การสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นความเร็วสูงโดยกระบวนการลิโชกราฟฟี ด้วยรังสีเอ็กซ์

นายมาโนทย์ มาปะโท

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2550

FABRICATION OF FAST RESPONSE HUMIDITY SENSOR BY USING X-RAY LITHOGRAPHY TECHNIQUE

Manot Mapato

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the

Degree of Master of Engineering in Electrical Engineering

Suranaree University of Technology

Academic Year 2007

การสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นความเร็วสูงโดยกระบวนการลิโชกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์

มหาวิทยาลัยเทค โน โลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(รศ. คร.กิตติอัตถกิจมงคล) ประธานกรรมการ

(อ. คร.นิมิต ชมนาวัง) กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

(คร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์) กรรมการ

(ผศ. คร.ธนัคชัย กุลวรวานิชพงษ์) กรรมการ

(อ. คร.บุญเรือง มะรังศรี) กรรมการ

(รศ. น.อ. คร.วรพจน์ ขำพิศ) คณบคีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

(ศ. คร.ไพโรจน์ สัตยธรรม) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มาโนทย์ มาปะโท : การสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นความเร็วสูงโดยกระบวนการลิโธกราฟฟี ด้วยรังสีเอ็กซ์ (FABRICATION OF FAST RESPONSE HUMIDITY SENSOR BY USING X-RAY LITHOGRAPHY TECHNIQUE) อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. คร.นิมิต ชมนาวัง, 123 หน้า

งานวิจัยวิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการออกแบบ และสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุ ้ที่มีคุณสมบัติในการตอบสนองต่อความชื้นเร็ว สร้างโดยใช้กระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์ และรังสีอัลตราไวโอเลต การออกแบบตัวตรวจรู้ ใช้การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ จำลอง ผลตอบสนองต่อความชื้นของตัวตรวจรู้ที่มีโครงสร้างต่างกันได้แก่ โครงสร้างแบบขั้วไฟฟ้า ้มีรูพรุน แบบสารไวความชื้นเป็นทรงกระบอก แบบทรงลูกบาศก์ และแบบอิเล็กโทรคซี่ยาว ้เมื่อกำนึงถึงความเป็นไปได้ในการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นพบว่าตัวตรวจรู้ความชื้นแบบอิเล็กโทรค ซี่ยาวมีความเหมาะสมมากที่สุด ความเร็วในการตอบสนองขึ้นกับขนาดความกว้างของซึ่ สารไวกวามชื้น เมื่อซึ่งองสารไวกวามชื้นมีกวามกว้างลดลง เวลาในการตอบสนองจะลดลง เช่นเดียวกัน ตัวตรวจรู้ความชื้นสร้างโดยการเคลือบสารไวแสง SU-8 ลงบนฐานนำไฟฟ้า และสร้าง ้ถวดถายของสารไวกวามชื้น โดยใช้การฉายรังสีอัลตราไวโอเลตผ่านหน้ากากโลหะ ที่มีช่องเปิด ้เป็นรูปซื่อิเล็กโทรด ซึ่งเตรียมขึ้นด้วยเทคนิคการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์ และเคลือบโลหะ ้ด้านบนเป็นซื่อิเล็กโทรคโดยใช้หน้ากากตัวเดียวกัน โดยหน้ากากโลหะหลังจากใช้สร้างตัวตรวจรู้ ้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การทดสอบคุณสมบัติของตัวตรวจรู้ความชื้น ใช้การปรับเทียบ ้ความชื้นด้วยความชื้นจากสารละลายเกลืออิ่มตัว ผลการทดสอบคุณสมบัติของตัวตรวจรู้ความชื้น ที่มีสารไวความชื้นเป็นซึ่งนาคความกว้างเท่ากับ 51 µm หนา 2 µm พบว่าตัวตรวจรู้มีค่าความจุ ใฟฟ้าที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% เท่ากับ 31 pF ความไวเท่ากับ 83 fF/%RH หรือ 2,677 ppm/%RH ้ ก่ากวามผิดพลาดในการวัดกวามชื้นสูงสุดเท่ากับ ±5% เวลาในการดูดซึมกวามชื้น 0.56 วินาที กาย ้ความชื้น 1 วินาที ซึ่งเป็นผลตอบสนองที่เร็วตามความคาดหมาย ตัวตรวจรู้ความชื้นโครงสร้างนี้ ้จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานที่ต้องการวัคความชื้นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวคเร็วได้

ลายมือชื่อนักศึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

สาขาวิชา <u>วิศวกรรมไฟฟ้า</u> ปีการศึกษา 2550

MANOT MAPATO : FABRICATION OF FAST RESPONSE HUMUDITY SENSOR BY USING X-RAY LITHOGRAPHY TECHNIQUE. THESIS ADVISOR : NIMIT CHOMNAWANG, Ph.D., 123 PP.

HUMIDITY SENSOR/X-RAY LITHOGRAPHY

This thesis presents design and fabrication of fast-response capacitive humidity sensor using X-ray and UV lithography techniques. Mathematic models based on Fick's law are used to determine the humidity response for different types of humidity sensor including long electrode, porous electrode, cylindrical and cube body. Considering possibility of structural realization, the long electrode type is the most possible form to be fabricated. Mathematic models predict that the time response would decrease if the comb width of sensitive material is reduced.

The long-electrode type sensor was fabricated by spin coating of SU-8 photoresist on a conductive substrate. The soft baked resist was patterned by exposure of UV radiation through a 250 μ m-thick metal mask with comb-like aperture which was prepared by x-ray lithography technique. Aluminum film was then coated by thermal evaporation onto the UV exposed SU-8 combs underneath the aperture to form an upper electrode. After removal of the metal mask, and development of un exposed SU-8, the capacitance of fabricated sensors were calibrated against various humidity standards using saturated salt solutions. The characterization were done to find its sensitivity and response time. The experimental results showed that a sensor with 51 µm-wide and 2 µm-thick electrode has capacitance of 31 pF at relative humidity of 30%, sensitivity of 83 fF/%RH or 2,677 ppm/%RH and

maximum error of $\pm 5\%$. Humidity adsorption and desorbtion time are 0.56 and 1 seconds, respectively. Good results were readily obtained from the experiment. This work provides technologies to realize a fully functioning fast response capacitive humidity sensor in the future.

School of <u>Electrical Engineering</u>

Academic Year 2007

Student's Signature _____

Advisor's Signature _____

Co-Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้คำเนินการเสร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บุคคล และกลุ่ม บุคคลต่าง ๆ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทั้งในด้านวิชาการ และการ คำเนินงานวิจัยรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวนความสะดวกในการทำงานวิจัย อาทิ

อาจารย์ คร.นิมิต ชมนาวัง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำปรึกษาแนะนำ และชี้แนะ แนวทางอันเป็นประ โยชน์ยิ่งต่องานวิทยานิพนธ์ รวมทั้งเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ ทำงานและการคำเนินงานวิจัยให้กับผู้วิจัยเสมอมา

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท คร.สราวุฒิ สุจิตจร รองศาสตราจารย์ คร.กิตติ อัตถกิจมงกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.อาทิตย์ ศรีแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ธนัคชัย กุลวรวานิชพงษ์ อาจารย์ คร.บุญเรือง มะรังศรี และอาจารย์ คร.เผด็จ เผ่าละออ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้ให้คำปรึกษาด้านวิชาการอย่างคียิ่ง ตลอคมา

คร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ นักวิจัยประจำศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสง ซินโครตรอนแห่งชาติ ที่กรุณาให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสง ซินโครตรอนแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการสนับสนุนเครื่องมือวิจัย สถานที่ทำวิจัย ตลอดจนทุนการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา และทุนสนับสนุนงานวิจัย

ท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ รวมถึงญาติพี่น้องของผู้วิจัยทุกท่าน ที่ได้ให้ความรักความอบอุ่น ความห่วงใย การอบรมเลี้ยงดู และให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา อย่างดียิ่งตลอดมา รวมทั้งเป็นกำลังใจให้ผู้วิจัยสามารถเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จนทำให้ ผู้วิจัยประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดมาและตลอดไป

มาโนทย์ มาปะโท

สารบัญ

	บทคัดย่อ (ภาษาไทย)ก					
	บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)ข					
	กิตติกรรมประกาศง					
	สารบัญ					
	สารบัญต	ารางซ				
	สารบัญรู	ปณ				
	บทที่					
	1 1	บทนำ				
	1	1.1 กล่าวนำ1				
	1	1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย				
	1	1.3 ข้อตกลงเบื้องต้น				
1.4 ขอบเขตงานวิจัย						
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ						
]	1.6 การจัครูปเล่มวิทยานิพนธ์				
 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 						
2.1 ตัวตรวจร้ความชื้นประเภทต่าง ๆ						
2.1.1 ตัวตรวจร้โดยใช้เซรามิกเป็นวัสดไวความชื้น						
		(ceramic-based humidity sensor)				
		2.1.2 ตัวตรวจรู้ความชื้นโคยใช้วัสคุพอลิเมอร์เป็นวัสคุไวความชื้น				
		(Polvmer-based humidity sensor)8				
(1 orymer based namery sensor)						
	2	2.3 ตัวตรวจร้ความชื้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบัน12				
	3 f	การพัฒนากระบวนการพื้นฐาน				
		3.1 การคำนวณพลังงานแสงซินโคตรอนที่ใช้ในกระบวนการลิโธกราฟฟี				
	-	ด้วยรังสีเอ็กซ์				

สารบัญ(ต่อ)

		3.1.1 สมการและขั้นตอนการคำนวณ	23
		3.2.1 สมการและขั้นตอนการคำนวณ	34
		3.2.2 การเตรียมส่วนฐานของหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์	35
		3.2.3 การฉายแสงอัลตราไวโอเลต	
		3.2.4 การชุบโลหะเงิน	39
	3.2	การสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์	
	3.3	การสร้างหน้ากากโลหะ	42
4	ทฤร	ษฎีการคำนวณสำหรับตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุ	47
	4.1	ความชื้น	47
	4.2	ทฤษฎีและการคำนวณ	48
		4.2.1 โครงสร้างแบบขั้วไฟฟ้ามีรูพรุน (Porous electrode)	49
		4.2.2 ตัวตรวจรู้ความชิ้นแบบทรงกระบอก	
		(Cylindrical humidity sensor)	51
		4.2.3 โครงสร้างแบบทรงลูกบาศก์ (Cube body)	52
		4.2.4 แบบซื่อิเล็กโทรดที่มีความยาวมากกว่าความกว้างมาก	54
5	กระ	ะบวนการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้น	59
	5.1	การออกแบบถวดลาย	60
	5.2	การสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์	62
	5.3	การสร้างหน้ากากโลหะ	65
	5.4	การสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุ	69
6	การ	รทดสอบคุณลักษณะสมบัติตัวตรวจรู้ความชื้น	76
	6.1	การวัดผลตอบสนองในสภาวะอยู่ตัว	76
	6.2	การวัดผลตอบสนองทางเวลา	86
7	ສຽາ	ปงานวิจัยและข้อเสนอแนะ	90
	7.1	บทสรุปงานวิจัย	90
	7.2	ข้อเสนอแนะ	92

สารบัญ(ต่อ)

รายการอ้างอิง	93
ภาคผนวก	
ภากผนวก ก. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	97
ภาคผนวก ข. การผสมน้ำยาชุบโลหะเงินปริมาตร 500 มิลลิลิตร	99
ภาคผนวก ค. กระบวนการสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์	101
ภาคผนวก ง. กระบวนการสร้างหน้ากากโลหะ	103
ภาคผนวก จ. กระบวนการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นโดยการระเหยโลหะ	
ผ่านหน้ากาก	105
ภาคผนวก ฉ. กระบวนการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้น โดยวิธีการ lift-off	107
ภาคผนวก ช. โปรแกรม XmaskSim	109
ภาคผนวก ซ. โปรแกรมจำลองผลการตอบสนองของตัวตรวจรู้ความชื้น	118
ประวัติผู้เขียน	123

หน้า

สารบัญตาราง

ตาร	างที่	หน้า
2.1	เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของหลักการวัดความชื้นแบบต่าง ๆ	7
2.2	แสดงผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้ความชื้นแบบฟิล์มบาง	11
2.3	เปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาและความไวของตัวตรวจรู้ความชื้น	16
5.1	ตัวอย่างข้อมูลการฉายรังสีเอ็กซ์เพื่อสร้างแม่พิมพ์สารไวแสงหนา 350 μm	
	ต้องการพลังงานสะสม 5,500 mJ/cm ³	64
6.1	ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) ของสารละลายเกลืออิ่มตัวที่อุณหภูมิต่าง ๆ	79
6.2	ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวตรวจรู้ความชื้นเมื่อแทนด้วยสมการรูปแบบต่างกัน	85

สารบัญรูป

รูปที่ หน้า
1.1 ตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุอย่างง่าย
1.2 ตัวตรวจรู้ความชื้นแบบซี่ตัวนำ
 ทั่วตรวจรู้ความชื้นแบบซี่ตัวนำและซี่ไดอิเล็กทริก
2.1 ผลตอบสนองทางเวลาขาขึ้น (ดูคซึมความชื้น)
ของตัวตรวจรู้ความชื้น10
2.2 ผลตอบสนองทางเวลาขาลง (คายความชื้น)
ของตัวตรวจรู้ความชื้น10
2.3 ความไวของตัวตรวจรู้ความชื้น12
2.4 เปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้ความชื้นแบบต่าง ๆ
2.5 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบซี่ยาว17
2.6 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความชิ้นความเร็วสูงที่เพิ่มความไว
โดยการเพิ่มพื้นที่อิเล็กโทรด18
3.1 แสดงการสร้างถวดถายถงบนสารไวแสงชนิดบวกและชนิดถบ
3.2 สเปกตรัมกำลังของแสงซินโครตรอนที่กระแสอิเล็กตรอน 40 mA
3.3 องค์ประกอบของระบบลำเลียงแสงซินโครตรอน BL-6 ที่ใช้สำหรับ
กระบวนการลิโธกราฟฟิด้วยรังสีเอ็กซ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ22
3.4 แม่เหล็กโค้งทั้ง 8 ตัวของวงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอน
3.5 ลักษณะของแสงซินโครตรอนที่แผ่ออกมาจากแม่เหล็กโค้ง bending magnet
3.6 กรวยแสงที่ตกกระทบชิ้นงาน27
3.7 ลักษณะของระบบลำเลี้ยงแสง BL-6 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ28
3.8 สัมประสิทธิ์การดูดกลื่นคลื่นแสงของอลูมิเนียม
 สเปกตรัมพลังงานหลังจากผ่านวัสคุกรองแสงต่าง ๆ
3.10 แสดงพลังงานส่วนต่าง ๆ ที่คำนวณโดยใช้โปรแกรม XmaskSim

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.11	การคำนวณการส่งกำลังของแสงซินโครตรอนผ่านวัสดกรองต่าง ๆ	32
3 12	แผบกาพโฟลวชาร์ตแสดงการคำบวญของโปรแกรม XmaskSim	33
3.12	ตัวตราจร้อาวบซึ่บที่บีอาวบอว้างซื่อิเอ็กโทรด 40 um	
5.15	ออกแบบโดยโปรแกรม Lavout Editor	34
3 14	หน้ากากกั้บแสงอัลตราไวโอเลตที่บีลาดลายจลกาคขบเวด 40 um	
5.11	ซึ่งพิมพ์ลงบบฟิล์มใสด้ายแสงเลเซอร์ดาาบละเอียด 3 600 จดต่อบ้ำ	35
3 1 5	ารเตรียบสาบสำหรับหน้ากากกับรับสีเอ็กซ์	
3.15	แย่นใสที่เคลื่อนโลหะไทเทเบียน และเงินซึ่งใช้เป็นธานรองรับลาดลาย	
5.10	พคน เกิดเกียบ เกิดของ เกิดของ และเงิน และ และเป็น และเงิง เป็นเกิดเกิด ของโลหะเงินอาาบหบา 40 และ ใบขั้นตอบต่อไป	37
2 17	ของ แกะเงนการมานา 40 μm เนงนทอนทองบ	
2.10	แมพมพถาว เสรา หน้าอาออั้นรังสีเอีอซ์	
2.10	ี และเมืองส์สวรไวแสงสี่งหนิงเวงเซียนเช้า	40
3.19	าแมพมพล เว เ มแลงพซุบเงนงนเตมแล ม	41
3.20	าหน้าที่ที่ที่ที่มีรังสเขาซิหลงการสางแมพมพสาร เว่แสง AZ4620 อยกแล้ว	41
3.21	หนากากกนรงสเอกซ อ้ ม อ้อสส ร	42
3.22	ขนตอนการสรางหนากากกนรงสเอกซแบบ โลหะ	44
3.23	หน้ากาก โลหะกันรังสีเอ็กซหนา 250 μm ทัสร้างเสร็จแล้ว	46
4.1	ตัวตรวจรู้ความชิ้นแบบฟิล์มบาง (Thin film humidity sensor)	49
4.2	ตัวตรวจรู้ความชิ้นแบบทรงกระบอก (Cylindrical humidity sensor)	51
4.3	ตัวตรวจรู้ความชื่นแบบทรงลูกบาศก์	52
4.4	ตัวตรวจรู้กวามชื่นแบบซียาว	54
4.5	ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่องจำกัดโดยใช้วิธี Crank-Nicloson	56
4.6	เปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาของโกรงสร้างขั้วไฟฟ้ารูพรุน	
	สารไวความชื้นเป็นทรงกระบอก และแบบทรงลูกบาศก์	57
4.7	เปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาของโครงสร้างสารไวความชื้นเป็น	
	ทรงกระบอกแบบทรงลูกบาศก์ และแบบอิเล็กโทรคซี่ยาว	58
4.8	ผลของความกว้างของซี่สารไวความชื้นต่อการตอบสนองทางเวลา	58

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5.1	ตัวตรวจรู้ความชื้นแบบซี่ตัวนำวางบนชั้นไดอิเล็กทริกไวความชื้น	59
5.2	ถวดถายตัวตรวจรู้ความชื้นที่ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Layout Editor	61
5.3	หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์บนแผ่นใสเคลือบโลหะ	62
5.4	หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์สร้างด้วยโลหะเงินหนา 40 μm	63
5.5	แม่พิมพ์สารไวแสงหนาสำหรับใช้สร้างหน้ากากโลหะกั้นรังสีเอ็กซ์	65
5.6	ภาพด้านบนของแม่พิมพ์สารไวแสงหนาสำหรับใช้สร้างหน้ากากโลหะ	
	กั้นรังสีเอ็กซ์	66
5.7	ภาพด้านข้างแม่พิมพ์สารไวแสงหนาสำหรับใช้สร้างหน้ากากโลหะกั้นรังสีเอ็กซ์	66
5.8	หน้ากากโลหะกั้นรังสีเอ็กซ์หนา 250 μm	67
5.9	ภาพด้านบนของหน้ากากโลหะกั้นรังสีเอ็กซ์หนา 250 µm	67
5.10	ภาพพขายซึ่ของหน้ากากโลหะกั้นรังสีเอ็กซ์หนา 250 µm	68
5.11	ภาพขยายด้ำนบนของหน้ากากโลหะหนา 250 µm	68
5.12	ตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างโดยใช้วิธีการ lift-off	70
5.13	การสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นโดยใช้วิธีการ lift-off	71
5.14	ภาพขยายตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างโดยใช้วิธีการ lift-off	72
5.15	ชิ้นงานที่ติดหน้ากากโลหะหลังการเคลือบโลหะเรียบร้อยแล้ว	72
5.16	การสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบระเหยเคลือบโลหะผ่านหน้ากาก	73
5.17	ตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างจากการเคลือบขั้วโลหะผ่านหน้ากากโลหะ	74
5.18	ตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างจากการเคลือบโลหะผ่านหน้ากาก	
	แบบที่สามารถเชื่อมต่อสายโคยการบัคกรี	74
6.1	โครงสร้างชุดทดสอบตัวตรวจรู้ความชื้นโดยใช้กวามชื้นมาตรฐาน	
	จากสารละลายเกลืออิ่มตัว	77
6.2	ชุดทดสอบตัวตรวจรู้ความชื้นโดยใช้ความชื้นมาตรฐาน	
	จากสารละลายเกลืออิ่มตัว	78
6.3	วงจรอะสเตเบิล มัลติไวเบรเตอร์ (Astable multivibrator circuit)	81

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
6.4	วงจรแปลงความถี่เป็นแรงคันไฟฟ้าใช้ตัวกรองออปแอมป์แบบสองขั้ว	
	เพื่อเพิ่มความเร็วในการตอบสนองของวงจร	
6.5	ค่าความจุไฟฟ้าของตัวตรวจรู้ความชื้นเทียบกับก่าไอเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน	83
6.6	ค่าความจุไฟฟ้าของตัวตรวจรู้ความชื้นเทียบกับก่าความชื้นจาก	
	สารละลายเกลืออิ่มตัวเมื่อแทนชุดข้อมูลด้วยสมการเส้นตรง	83
6.7	ค่าความจุไฟฟ้าของตัวตรวจรู้ความชื้นเทียบกับค่าไอเกลืออิ่มตัวเมื่อแทน	
	ชุดข้อมูลด้วยสมการเส้นโค้งกำลังสอง	84
6.8	ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเส้นตรงที่สร้างขึ้นเทียบกับ	
	ค่าความชื้นจริงเพื่อใช้หาความผิดพลาดของตัวตรวจรู้ความชื้น	
6.9	ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเส้นโค้งกำลังสองที่สร้างขึ้นเทียบกับ	
	ค่าความชื้นจริงเพื่อใช้หาความผิดพลาดของตัวตรวจรู้ความชื้น	85
6.10	ชุดทดสอบผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้ความชื้น	
6.11	ผลตอบสนองในการดูดซึมความชื้นเมื่อป้อนความชื้นแบบขั้นบันได	88
6.12	ผลตอบสนองในการคายความชื้นเมื่อป้อนอากาศแห้งแบบขั้นบันได	
6.13	ผลตอบสนองในการดูดซึมความชื้นของตัวตรวจรู้เมื่อเทียบกับ	
	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	89
6.14	ผลตอบสนองในการกายกวามชื้นของตัวตรวจรู้เมื่อเทียบกับ	
	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	89
7.1	กราฟเปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาและความไวของตัวตรวจรู้ความชื้น	
	กับตัวตรวจรู้ความชื้นที่มีผู้สร้างขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	91

บทนำ

1.1 กล่าวนำ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากทำให้กระบวนการ ทั้งใน ้อุตสาหกรรม หรือทางการเกษตร สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการได้ง่าย โดย ้สามารถใช้เครื่องมือวัคที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อควบคุมปัจจัยนั้น และช่วยลคปัญหาที่จะเกิคกับ กระบวนผลิต หรือการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อกระบวนการ ้อุตสาหกรรม คือ ความชื้นในอากาศ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไวต่อ การเปลี่ยนแปลงของความชื้น ซึ่งต้องมีการควบคุมความชื้นให้เหมาะสมตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิด ้ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ เช่นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและยา ซึ่งความชื้นมีผลโดยตรง ต่อคุณภาพและระยะเวลาในการเก็บรักษา หรืออุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์ นอกจาก กระบวนการทางอุตสาหกรรมแล้ว ในทางการแพทย์ยังมีการใช้ตัวตรวจรู้ความชื้นในการ ้วินิจฉัยโรคโดยใช้กวามชื้นจากลมหายใจของผู้ป่วย เทคโนโลยีการตรวจวัดกวามชื้นจึงได้ถูก พัฒนาขึ้นหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะกับประเภทของการใช้งาน รูปแบบของการวัคความชื้นที่นิยม ใช้กัน คือ แบบความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งเป็นการคิดอัตราส่วนมวลของไอน้ำในอากาศเทียบกับค่ามวล ้ไอน้ำในอากาศสูงสุด ที่จุดอิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกัน หลักการวัดความชื้นนั้นอาจใช้หลักการของ ้ตัวต้านทาน แบบตัวเก็บประจุ การเปลี่ยนแปลงทางกล หรือการเปลี่ยนแปลงความถี่ ซึ่งแบบ ้ตัวเก็บประจุ จะเป็นแบบที่นิยมใช้กันมากเนื่องจากให้ผลตอบสนองเป็นเชิงเส้น ใช้พลังงานต่ำ ้สร้างได้ง่าย และมีความไวสูง จุดประสงค์หลักของการพัฒนาตัวตรวจรู้ความชื้นโดยทั่วไปนั้น มีอยู่ ้สองข้อหลัก คือ เพื่อให้ตัวตรวจรู้ความชื้นมีความไวสูง หรือเพื่อให้ตัวตรวจรู้ความชื้นมี ผลตอบสนองทางเวลาเร็ว โคยแบบที่ให้ความไวสูงนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นแบบฟิล์มบาง (Thinfilm humidity sensor) สามารถแสดงโครงสร้างอย่างง่ายได้ดังรูปที่ 1.1 การเพิ่มความไวทำได้โดย การถุดความหนาของชั้นฟิล์ม ตามสมการที่ (1-1) เมื่อความหนาถุดลงจะทำให้ค่าความจุไฟฟ้าเมื่อ เทียบกับความชื้นที่เปลี่ยนไป ($\Delta C / \% R H$) มีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองทางเวลา ้ของตัวตรวจรู้ความชื้น เมื่อศึกษาแบบจำลองการแพร่ของไอน้ำเข้าสู่ชั้นไคอิเล็กทริกโคยใช้ กฎการแพร่ของฟิกค์ (Fick's law) แก้สมการอนุพันธ์ จำลองผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่า ้ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบสนองทางเวลา คือ ระยะทางในการแพร่ของความชื้นเข้าสู่ชั้นไดอิเล็กทริก จนถึงจุดอิ่มตัว ต้องมีระยะทางในการแพร่ที่สั้นที่สุด ซึ่งโครงสร้างในรูปที่ 1.1 เมื่อให้ความชื้นแพร่ เข้าทุกด้านเท่ากัน ระยะทางในการแพร่ของความชื้นจากขอบจนถึงจุดกึ่งกลางมีระยะททางมาก ทำให้โครงสร้างนี้ใช้เวลาในการตอบสนองนานมาก จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบโครงสร้างใหม่ ใช้ การลดระยะทางในการแพร่ โดยสร้างแผ่นอิเล็กโทรดด้านบนให้มีลักษณะเป็นซี่ ซึ่งระยะทางของ การแพร่ จะเหลือเพียงระยะจากความหนาของฟิล์มจนถึงครึ่งหนึ่งของความกว้างของซี่ โครงสร้าง แสดงได้ดังรูปที่ 1.2

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d}$$
(1-1)

เมื่อ C คือ ค่าความจุไฟฟ้าของตัวตรวจรู้ความชื้น E₀ คือ ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ของ สุญญากาศ E_r คือ ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ของใดอิเล็กทริกไวความชื้น ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตาม ความชื้น A คือ พื้นที่ของแผ่นเก็บประจุ และ d คือ ความหนาของชั้นใดอิเล็กทริกไวความชื้น หรือ ระยะห่างระหว่างแผ่นเก็บประจุ



รูปที่ 1.2 ตัวตรวจรู้ความชื้นแบบมีซี่ตัวนำ

์ โครงสร้างตามรูปที่ 1.2 นี้มีข้อเสีย คือ ระยะห่างระหว่างซี่และความหนาของฟิล์มยังมีผล ต่อความเร็วซึ่งถ้าความหนาของฟิล์มมากหรือระยะห่างระหว่างซึ่น้อยก็จะทำให้ผลตอบสนองช้าลง ้โครงสร้างตามรูปที่ 1.3 นี้จะเป็นโครงสร้างที่ช่วยแก้ปัญหาจุดนี้ และยังช่วยเพิ่มพื้นผิวสำหรับให้ ้ความชื้นแพร่เข้าสู่โครงสร้างได้มากขึ้นและผลตอบสนองทางเวลาจะขึ้นกับขนาดความกว้างของซึ่ เท่านั้น โครงสร้างตามรูป 1.3 นี้จากแบบจำลองทางทฤษฎี ถ้าความกว้างของซี่ลดลงสองเท่า ้ตัวตรวจรู้ความชื้นจะให้ผลการตอบสนองทางเวลาเร็วขึ้นถึงสี่เท่า งานวิจัยนี้จึงได้นำกระบวนการ ้ลิโชกราฟีด้วยรังสีเอ็กซ์มาใช้ในการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้น ซึ่งจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ในการสร้าง หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ในขณะนี้ สามารถสร้างให้มีความกว้างได้ประมาณ 40 μm โดยกระบวนการ สร้างจะใช้หน้ากากโลหะหนาซึ่งสร้างจากกระบวนการลิโธกราฟีด้วยรังสีเอ็กซ์ เพื่อใช้สร้าง ้ถวดถายของชั้นไดอิเล็กทริกไวกวามชื้นโดยการฉายรังสีเอ็กซ์หรือรังสีอัลตราไวโอเลต ผ่าน ช่องว่างถวดถายของหน้ากากโถหะ และสร้างซื่อิเล็กโทรคโดยการเคลือบโถหะโดยใช้หน้ากาก ้ตัวเดียวกัน โดยนำหน้ากากโลหะวางบนสารไวแสงที่เคลือบบนแผ่นฐานที่เป็นตัวนำ จากนั้น ้ฉายรังสีเอ็กซ์ หรืออัลตราไวโอเล็ต เพื่อให้เกิดลวดลายบนสารไวแสงและเคลือบโลหะทับลงไป ้เมื่อล้างฟิล์มสารไวแสงส่วนที่อยู่ใต้หน้ากาก และนำหน้ากากออกก็จะได้ลวดลายซึ่งอง ้ชั้นไดอิเล็กทริกบนฐานตัวนำ และมีซี่โลหะทับอยู่ด้านบน ความชื้นสามารถแพร่เข้าด้านข้างของ ้ชั้นใดอิเล็กทริกทั้งสองค้าน ทำให้ตัวตรวจรู้ความชื้นที่ได้มีการตอบสนองทางเวลาเร็วขึ้น ข้อคีของ การสร้างอิเล็กโทรดแบบเป็นชิ้นเดียวกันนี้ จะลดต้นทุนในการเชื่อมต่อขั้วของตัวเก็บประจุ เข้าด้วยกัน และง่ายในการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์วงจรรวม ทำให้สะดวกและช่วยลดต้นทุนในการผลิต



รูปที่ 1.3 ตัวตรวจรู้ความชื้นแบบมีซี่ตัวนำและซี่ไดอิเล็กทริก

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นความเร็วสูง โดยใช้การลิโธกราฟฟี ด้วยรังสีเอ็กซ์ สร้างขั้วอิเล็กโทรดวางทับชั้นของสารไวความชื้น ซึ่งจะใช้สารไวแสง SU-8 เป็น ชั้นไวความชื้น โดยจะได้ตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุ และทำการวัดผลเพื่อทดสอบ กุณลัษณะสมบัติของตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างขึ้นต่อไป

1.3 ข้อตกลงเบื้องต้น

เนื่องจากเทคโนโลยีในการสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ที่มีอยู่ยังมีข้อจำกัดในการสร้าง ลวดลายที่เล็กมาก ๆ ทำให้ยังไม่สามารถสร้างลวดลายที่เล็กกว่า 10 μmได้ ตัวตรวจรู้ความชื้น ที่สร้างขึ้น จึงมีขนาดกวามกว้างของซี่ไวกวามชื้นที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 μm

1.4 ขอบเขตงานวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นด้วยกระบวนการลิโธกราฟฟี โดย ใช้สารไวแสง SU-8 เป็นสารไวความชื้น เพื่อให้ตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างขึ้นมีผลการตอบสนอง ทางเวลาของตัวตรวจรู้ความชื้นน้อยกว่า 10 วินาที และมีก่ากวามกลาดเกลื่อนได้ในช่วง ±5% จาก มาตรฐานการปรับเทียบความชื้นด้วยสารละลายเกลืออิ่มตัว

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

งานวิจัยนี้เป็นการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นความเร็วสูงซึ่งสร้างโดยใช้วิธีการลิโธกราฟฟี ด้วยรังสีเอ็กซ์ ซึ่งจะได้ตัวตรวจรู้ความชื้นที่มีผลตอบสนองทางเวลาเร็ว

1.6 การจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์

ในงานวิจัยวิทยานิพนธ์นี้ประกอบด้วยเนื้อหา 7 บท ได้แก่ *บทที่ 1* เป็นบทนำกล่าวถึงความ เป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขต ข้อตกลงเบื้องต้น และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้ *บทที่ 2* กล่าวถึงปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และเทค โนโลยีตัวตรวจรู้ความชื้น เปรียบเทียบให้เห็นถึงพัฒนาการของตัวตรวจรู้ ความชื้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่นักวิจัยได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง *บทที่ 3* กล่าวถึงการพัฒนา กระบวนการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นตั้งแต่การคำนวนพลังงานจากแสงซินโครตรอน สำหรับใช้ ในกระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์ของระบบลำเลียงแสง BL-6 กระบวนการสร้างหน้ากาก กั้นรั้งสีเอ็กซ์ เพื่อใช้สร้างหน้ากากโลหะหนา บทที่ 4 เนื้อหากล่าวถึงการออกแบบสร้างตัวตรวจรู้ กวามชื้นตั้งแต่ทฤษฎีการแพร่ การสร้างแบบจำลองทางกณิตศาสตร์ จำลองผล เพื่อหาโกรงสร้าง ที่เหมาะสม ตลอดจนการออกแบบโกรงสร้างตัวตรวจรู้กวามชื้นที่จะสร้างใช้งานจริง เมื่อได้ โกรงสร้างที่เหมาะสม จึงเข้าสู่กระบวนการสร้างตัวตรวจรู้กวามชื้น บทที่ 5 กล่าวถึงกระบวนการ สร้างตัวตรวจรู้กวามชื้นตามโกรงสร้างที่ได้ออกแบบไว้ บทที่ 6 เป็นการวัดผล และทดสอบ กุณลักษณะสมบัติของตัวตรวจรู้กวามชื้น โดยปรับเทียบตัวตรวจรู้กวามชื้นตามมาตรฐานการ ปรับเทียบความชื้นด้วยสารละลายเกลืออิ่มตัว ทดสอบความกลาดเกลื่อนในการวัดความชื้นของ ตัวตรวจรู้กวามชื้นที่สร้างขึ้น และผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้กวามชื้น และในบทที่ 7เป็น บทสรุปงานวิจัยและข้อเสนอแนะ บทท 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ความชื้น (Humidity) เป็นปริมาณที่บ่งบอกถึงปริมาณของน้ำในสถานะแก๊ส ที่ปนอยู่ใน อากาศหรือ แก๊สชนิดอื่น โดยมีหน่วยวัคเป็นความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute humidity) หรือ ความชื้น สัมพัทธ์ (Relative humidity) ความชื้นสัมบูรณ์เป็นการวัดอัตราส่วนของมวลไอน้ำ เทียบกับมวล ้อากาศแห้งที่รวมตัวอยู่ในปริมาตรเดียวกัน แต่หน่วยการวัดความชื้นที่นิยมใช้มากกว่า คือ ความชื้น ้สัมพัทธ์ ซึ่งเป็นการวัดความชื้นโดยกิดอัตราส่วนมวลของไอน้ำในอากาศ เทียบกับก่ามวลไอน้ำใน อากาศอิ่มตัวสูงสุดที่อุณหภูมิเดียวกัน มีหน่วยเป็น %RH ความชื้นมีผลต่อชีวิตประจำวัน ในทาง ้อุตสาหกรรมต้องมีการควบคุมปริมาณความชื้นอย่างคี โคยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและยา ้ความชื้นมีผล โดยตรงต่อคุณภาพ และระยะเวลาในการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ้อิเล็กทรอนิกส์วงจรรวม และในอุตสาหกรรมอีกหลาย ๆ ประเภท นอกจากนี้ในทางการแพทย์ยัง ้สามารถใช้ความชื้นจากลมหายใจในการวินิจฉัยโรคบางชนิดได้ หรือในเครื่องช่วยหายใจยังมีความ ้งำเป็นในการควบคุมความชื้นให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย ดังนั้น เครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพ ้จึงเป็นที่ต้องการในงานเหล่านี้ ตัวตรวจรู้ความชื้นหลากหลายชนิคได้รับการพัฒนา เพื่อให้เหมาะ กับประเภทของการใช้งาน ซึ่งมีหลักการทำงานแตกต่างกันออกไป เช่น ใช้วัสดุไวความชื้น ใช้ ์ ใซโครมิเตอร์ (Psychomotor) แบบกระเปาะเปียก-แห้ง ใช้การวัดจุดน้ำค้าง ใช้การวัดอินฟาเรค (Brion, 1986) การพิจารณาเลือกใช้งานอาจเลือกจาก ขนาด น้ำหนัก ราคา ประสิทธิภาพ หรือ การบำรุงรักษา ซึ่งหลักการตรวจรู้ความชื้นแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปดังแสดงในตาราง ที่ 2.1

นอกจากนี้ตัวตรวจรู้ความชื้นยังสามารถจำแนกตามหลักการตรวจรู้ หรือวัสดุตรวจรู้ ใด้ หากแบ่งตามหลักการตรวจรู้สามารถแบ่งได้เป็น ใช้การเปลี่ยนแปลงความจุไฟฟ้า (ΔC) การเปลี่ยนแปลงค่าความด้านทาน (ΔR) การเปลี่ยนแปลงทางกล (ΔL) และการเปลี่ยนแปลง ความถี่ (Δf) หรือแบ่งตามวัสดุที่ใช้เช่น พอลิเมอร์ (PMMA, Polyimide) เซรามิกรูพรุน (TiO₂-V₂O₂, MgCr₂O₄-TiO₂, Al₂O₃) อิเล็กโทรไลต์ (LiCI) ซิลิกอนพรุน ซึ่งแต่ละแบบจะมีหลักการตรวจรู้ ต่างกัน โดยจะได้กล่าวในลำดับต่อไป

บทที่ 2

วิธีการวัดความชื้น	หลักการทำงาน	ข้อดี	ข้อเสีย
ใช้วัสดุไวความชื้น	อาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกล	-ไม่ต้องการพลังงาน	-ผลตอบสนองไม่เป็นเชิง
	(ขนาด ความยาว ปริมาตร	-ไวต่ออุณหภูมิน้อย	เส้น
	ความเค้น)	-ราคาถูก	-มีฮิสเทอรีซีส
		-ใช้งานง่าย	-ผลตอบสนองช้ำ
	อาศัยการเปลี่ยนแปลง	-ใช้งานง่าย	-มีฮิสเทอรีซิส
	คุณสมบัติทางไฟฟ้า	-ราคาถูก	-ไวต่อสิ่งสกปรก
	(ความต้ำนทาน ความถี่	-มีขนาดเล็ก	
	ค่าความจุไฟฟ้า)	-บำรุงรักษาง่าย	
ใช้วิธีกระเปาะเปียก-	ใช้การวัดอุณหภูมิ	ไม่ต้องทำการ	-ต้องเปลี่ยนใส้กรองและเติม
กระเปาะแห้ง	กระเปาะเปียก-แห้ง	ปรับเทียบ	น้ำกลั่นอยู่เสมอ
			-ต้องการอากาศใหลผ่าน
			ด้วยอัตราการไหลสูง
			(3 m/s)
ใช้วิธีวัดจุดน้ำค้าง	ใช้การวัดอุณหภูมิจุดน้ำค้าง	-มีความแม่นยำสูง	-มีขนาดใหญ่
	ด้วยการตรวจรู้การควบแน่น	-ย่านพลวัตกว้าง	-ราคาแพง
	โดยใช้ความเย็น	-ไม่ต้องทำการ	-ใช้พถังงานสูง
		ปรับเทียบ	-ต้องมีการทำกวามสะอาด
			สม่ำเสมอ
วัครังสีอินฟราเรค	เลือกการดูดกลืนสเปกตรัม	-ใช้ได้กับแก๊ส	-ราคาแพง
	อินฟราเรคของไอน้ำ	ที่กัดกร่อน	-อางเกิดการรบกวนจาก
		-ย่านพลวัตกว้าง	แก๊สชนิดอื่น

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบข้อคีข้อเสียของหลักการวัดความชื้นแบบต่าง ๆ

2.1 ประเภทของตัวตรวจรู้ความชื้น

การแบ่งตัวตรวจรู้ความชื้นตามชนิดของวัสคุไวความชื้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดหลัก คือ วัสคุเซรามิก และวัสคุพอลิเมอร์ ซึ่งแต่ละชนิคมีหลักการทำงานดังนี้

2.1.1 ตัวตรวจรู้โดยใช้เซรามิกเป็นวัสดุไวความชื้น (ceramic-based humidity sensor)

ตัวตรวจรู้ประเภทนี้สามารถจำแนกตามกลไกการตรวจรู้ ได้แก่ ไอออนิก อิเล็กทรอนิกส์ ความจุไฟฟ้า และของแข็ง-อิเล็กโทรไลต์ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีข้อคี คือ มีความแข็งแรง ทนทาน ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี มีเสถียรทางกายภาพ และอุณหภูมิ (Traversa, 1995) ข้อเสียของตัวตรวจรู้ความชื้นประเภทนี้ คือ ต้องมีการให้ความร้อนแก่ตัวตรวจรู้ความชื้นเพื่อให้ ตัวตรวจรู้ความชื้นคืนสภาพ นอกจากนี้ตัวตรวจรีความชื้นประเภทนี้ยังไวต่อสิ่งสกปรกด้วย

2.1.2 ตัวตรวจรู้กวามชื้นโดยใช้วัสดุพอลิเมอร์เป็นวัสดุไวกวามชื้น

(Polymer-based humidity sensor)

ตัวตรวจรู้ความชื้นประเภทนี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากกว่าวัสดุเซรามิก เนื่องจากวัสดุเซรามิกจะเน้นไปที่งานประเภทความร้อนสูง และสภาพแวคล้อมมีการกัคกร่อน ซึ่ง งานโดยทั่วไปจะใช้งานที่อุณหภูมิปกติ วัสดุพอลิเมอร์ที่นำมาใช้สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ พอลิอิเล็กโทรไลต์ และไดอิเล็กทริก ซึ่งการตรวจรู้ความชื้นจะใช้การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ทางไฟฟ้า ได้แก่ ความจุไฟฟ้า ความด้านทาน คลื่นเสียงพื้นผิว (Penza, et al., 1999) และ เพียโซรีซีสทีฟ โดยตัวตรวจรู้กวามชิ้นประเภทพอลิอิเล็กโทรไลต์ จะใช้ความนำไอออน ของวัสดุ ประเภทไอออนิก เมื่อความชิ้นเพิ่มขึ้นวัสดุจะมีความนำไอออนิกเพิ่มขึ้น กลไกการตรวจรู้อาศัย อัตราเร็วของอนุภาคประจุไอออนิก ซึ่งเคลื่อนที่เนื่องจากสนามไฟฟ้าภายนอก หรือความเข้มข้น ประจุพาหะ (Yamazoe, 1986) สมดุลของประจุเกิดจากการที่ไอออนเคลื่อนที่ตรงกันข้ามประจุนั้น คือ มีแรงไฟฟ้าสถิตดึงดูดกลุ่มขั้วที่อยู่กับที่ เมื่อน้ำดูดซึมผ่านวัสดุ อัตราเร็วของอนุภาคประจุที่ เกลื่อนที่เนื่องจากสนามไฟฟ้าภายนอกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นระหว่างกันในบริเวณ ใกล้ ๆ กันเป็นอิสระมากขึ้น ส่งผลให้ความด้านทานลดลง

ตัวตรวจรู้ความชื้นประเภทไดอิเล็กทริกใช้หลักการดูดซึมน้ำของโครงข่ายพอลิเมอร์ ซึ่งก่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ของน้ำและพอลิเมอร์มีค่าต่างกันมาก คือ น้ำจะมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริก สัมพัทธ์เท่ากับ 80 ส่วนพอลิเมอร์มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ประมาณ 5 ซึ่งเมื่อมีการดูดซึมน้ำเข้า สู่โครงสร้างของพอลิเมอร์ จะส่งผลให้ค่าไดอิเล็กทริกของพอลิเมอร์มีค่าเพิ่มขึ้น จากหลักการนี้ สามารถนำไปใช้สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุ เนื่องจากก่าความจุไฟฟ้าจะเปลี่ยนไป ตามค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของสารไวความชื้น ซึ่งสามารถวัดได้ง่าย วัสดุที่นิยมใช้เป็นชั้นไดอิเล็กทริก ไวความชื้น ได้แก่ พอลิอิไมด์ เนื่องจากเป็นวัสดุที่ทนทานต่อสารเคมีและการปนเปื้อน นอกจากนี้ Ralston (1994) ได้นำเสนอการใช้ PMMA เป็นวัสดุไวความชื้น ซึ่งมีผลเสีย คือ มีความไม่เป็น เชิงเส้น ที่ความชื้นสูง และมีฮีสเทอรีซีสมาก

2.2 ผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้ความชื้น

โครงสร้างของตัวตรวจรู้ความชื้นมีหลายแบบ โครงสร้างที่นิยมใช้กันแพร่หลายที่สุด คือ โครงสร้างแบบฟิล์มบาง (Thin-film humidity sensor) เนื่องจากให้ผลตอบสนองทางเวลาเร็ว มีความไวสูง มีเสถียรภาพ มีความเป็นเชิงเส้น วัสดุที่นิยมใช้ คือ พอลิอิไมด์ และอลูมิเนียม ออกไซค์ คุณสมบัติที่สำคัญของตัวตรวจรู้ความชื้น คือ ความเร็วในการตอบสนองต่อความชื้น ทดสอบโดยการป้อนค่าความชื้นแบบขั้นบันได โดยทั่วไปจะใช้การเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์จาก 20% จนถึง 80% และเทียบเวลาในการตอบสนองของตัวตรวจรู้ความชื้นเมื่อมีขนาดของการตอบสนอง เพิ่มขึ้นเป็น 10% และ 90% ดังรูปที่ 2.1 สามารถคิดผลตอบสนองทางเวลาแบ่งเป็น เวลาขึ้น (Rise time) และเวลาลง (Fall time) ตามสมการที่ (2-1) และ (2-2) สามารถแสดงหลักการ วัสดุ ความหนาของชั้นฟิล์ม และเวลาในการตอบสนองของตัวตรวจรู้ความชื้นแบบฟิล์มบาง ที่มี ผู้พัฒนาขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังตารางที่ 2.2

Rise time =
$$t_{M90} - t_{M10}$$
 (2-1)

Fall time =
$$t_{M90} - t_{M10}$$
 (2-2)



รูปที่ 2.1 ผลตอบสนองทางเวลาขาขึ้น(ดูคซึมความชื้น)ของตัวตรวจรู้ความชื้น



รูปที่ 2.2 ผลตอบสนองทางเวลาขาลง (คายความชื้น)ของตัวตรวจรู้ความชื้น

ป	ผู้ประพันธ์	หลักการ	วัสคุ	ความหนา	เวลา
				ฟิล์ม (µm)	ตอบสนอง (s)
1983	Hijikikawa, et al.	ความต้านทาน	พอลิเมอร์	10	100
1985	Tsuchitani, et al.	ความต้านทาน	ไอออนนิก-	10	120
			โคพอถิเมอร์		
1985	Jadhav, et al.	ความต้านทาน	AlOx	120 nm	20
1988	Shimizu, et al.	ความจุไฟฟ้า	พอถิอิไมด์	1	15
1992	Sadaoka, et al.	แสง	พอลิเมอร์	5	60
1993	Bolzhauser, et al.	ความจุไฟฟ้า	พอถิอิไมด์	10	30
1995	Roman, et al.	ความจุไฟฟ้า	PMMA	5-10	60-120
1996	Shibata, et al.	ความจุไฟฟ้า	พอถิอิไมด์	1.3	15
2000	Kang, et al.	ความจุไฟฟ้า	พอลิอิไมด์	2	1
2001	Qui, et al.	แรงคันไฟฟ้า	พอลิอิไมด์	3.8	20
2001	Laville, et al.	ความจุไฟฟ้า	พอลิอิไมด์	0.65	1
2002	Laville, et al.	ความจุไฟฟ้า	พอลิอิไมด์,	0.65	0.4
			BCB		
2003	Tetelin, et al.	ความจุไฟฟ้า	พอลิอิไมด์,	1.6	0.4
			BCB		
2004	Kalkan, et al.	กระแสไฟฟ้า	ซิลิคอน	0.04-0.2	<0.2
			นาโนเฟส		

ตารางที่ 2.2 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้กวามชื้นแบบฟิล์มบาง

2.3 ตัวตรวจรู้ความชื้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ตัวตรวจรู้ความชื้นที่ดีควรมีความไวสูง มีฮีสเทอรีซีสน้อย อายุการใช้งานยาวนาน ราคาถูก และมีผลตอบสนองทางเวลาเร็ว คุณสมบัติที่สำคัญของตัวตรวจรู้ความชื้น ได้แก่ ความไว และ ผลตอบสนองทางเวลาเ นักวิจัยได้พัฒนาตัวตรวจรู้ความชื้นในรูปแบบที่ต่างกัน ในที่นี้จะสรุปและ รวบรวมตัวตรวจรู้ความชื้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจุบัน มุ่งเน้นไปที่ความไวและผลตอบสนองทางเวลา ของตัวตรวจรู้ ซึ่งความไว คือ ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวตรวจรู้ความชื้นเทียบกับความชื้นที่ เปลี่ยนไป ต่อก่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ 30% ดังสมการที่ (2-3) รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.3



Seiyama (1983) สร้างตัวตรวจรู้ความชื้น โคยใช้วัสดุเซรามิก แบ่งออกเป็นแบบเซรามิก ้ชนิครพรน และแบบสารกึ่งตัวนำซึ่งใช้หลักการวัคค่าความต้านทานของที่เปลี่ยนไปของเซรามิก เมื่อได้รับความชื้น ตัวตรวจร์มีผลตอบสนองทางเวลา 15 วินาที มีความไว 36 ppm /%RH มีค่า ความต้านทานที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% เท่ากับ 25 MΩ Shimizu (1988) สร้างตัวตรวจรู้ความชื้น แบบดิจิตอล ใช้หลักการตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุ ตัวตรวจรู้ความชื้นมีความ ใว 2,922 ppm/%RH มีค่าความจุไฟฟ้าที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% เท่ากับ 285 pF มีผลตอบสนอง ทางเวลา 5 วินาที Denton (1990) สร้างตัวตรวจรู้ความชื้น โคยใช้พอลิอิไมค์ เป็นวัสคุไวความชื้น และสร้างวงจรที่สามารถแปลงความถี่ไฟฟ้าเป็นแรงคัน ซึ่งตัวตรวจรู้ความชื้นนี้มีผลตอบสนอง ทางเวลาเท่ากับ 600 วินาที มีความไว 13,470 ppm/%RH ค่าแรงคันไฟฟ้าที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% เท่ากับ 0.49 V Blotshauser (1991) สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุโคยใช้พอลิอิไมด์ ้เป็นวัสดุไวความชื้น มีโครงสร้างอิเล็กโทรคแบบซี่หวี วัคความงุไฟฟ้าของตัวตรวงรู้ที่ความชื้น สัมพัทธ์ 30% ได้ 1.5 pF และตัวตรวจรู้ความชื้นมีความไว 2,670 ppm/%RH แต่ผลตอบสนองทาง เวลาช้ามาก ต่อมาได้พัฒนาเป็นตัวตรวจร้ความชื้นแบบเทคโนโลยี CMOS เพื่อให้สามารถแปลง ้ ค่าความจุไฟฟ้าออกมาเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ทำให้ตัวตรวจรู้ความชื้นมีความไวเพิ่มขึ้นเป็น 5,333 ppm/%RH มีค่ากระแสไฟฟ้าที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% เท่ากับ 0.3 uA และเวลาในการ ตอบสนอง 30 วินาที

Sager (1995) สร้างตัวตรวจรู้ความชื้น โดยใช้การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกล (เปลี่ยนแปลงขนาด) ของพอลิอิไมด์เมื่อได้รับความชื้น ผลที่ได้พบว่าตัวตรวจรู้ความชื้นมีความไว 60 ppm/%RH ผลตอบสนองทางเวลาอยู่ที่ 90 วินาที Kang (2000) ได้ออกแบบโครงสร้างตัวตรวจรู้ ความชื้นแบบใหม่ ใช้หลักการของตัวเก็บประจุโครงสร้างของตัวตรวจรู้มีลักษณะเป็นแท่ง ใดอิเล็กทริกของพอลิอิไมด์ วางเรียงกันจำนวนมาก เพื่อเพิ่มความไวและมีตัวให้ความร้อน เพื่อให้ ตัวตรวจรู้ความชื้นกายความชื้นเร็ว ผลที่ได้ พบว่า ตัวตรวจรู้กวามชื้นนี้มีความไว 2,307 ppm/%RH มีความเร็วในการตอบสนอง 1 วินาทีมีค่าความจุไฟฟ้าที่ความชื้นนี้มีความไว 2,307 ppm/%RH มีความเร็วในการตอบสนอง 1 วินาทีมีค่าความจุไฟฟ้าที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% เท่ากับ 13 pF Laville (2001) สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุสำหรับใช้วัดความชื้นในอมหายใจ โดยใช้ พอลิอิไมด์เป็นวัสดุไวความชื้น ผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้กวามชื้นในอมหายใจ โดยใช้ พอลิอิไมด์เป็นวัสดุไวความชื้น ผลตอบสนองทางเวลาจองตัวตรวจรู้กวามชื้นในอมหายใจ โดยใช้ ด้วให้ความรื้อนพบว่าผลตอบสนองทางเวลาลดลงอยู่ที่ 0.2 วินาที เวลาในการกายความชื้น ใปฟ้าที่กวามร้อนพบว่าผลตอบสนองทางเวลาลดลงอยู่ที่ 0.2 วินาที เวลาในการกายความชื้น 11 วินาที ตัวตรวจรู้กวามชื้นมีกวามไว 3,166 ppm/%RH และมีก่าความจุ 11 วินาที ด้วตรวจรู้กวามชื้นมีกวามไว 3,160 ppm/%RH และมีก่าดวามจุแฟฟ้าที่กวามชื้นสัมพัทธ์ 30% เท่ากับ 12 pF Das (2003) พัฒนาตัวตรวจรู้กวามชื้น โดยใช้การวัดการเลื่อนเฟสของสัญญาณ คลื่นรูปชายน์ ซึ่งจะป้อนสัญญาณเข้าสู่ตัวตรวจรู้กวามชื้น ผลตอบสนองให้เป็นเชิงเส้นซึ่งผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวรู้ความชื้นเท่ากับ 10 วินาที โดยวัดสัญญาณออกมาในรูปแรงคันไฟฟ้า ซึ่งแรงคันไฟฟ้าที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% เท่ากับ 3 mV ตัวตรวจรู้ความชื้นมีความไว 333,333 ppm/%RH

Kann (2004) พัฒนาตัวตรวจรู้กวามชื้นโดยใช้ฟิล์มของซิลิกอนพรุนเป็นวัสดุไวกวามชื้น ้วัดผลตอบสนองเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโดยผลตอบสนองทางเวลาเท่ากับ 0.2 วินาทีตัวตรวจรู้ความชื้น มีความไว 360,000 ppm/%RH มีค่ากระแสที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% เท่ากับ 1 nA Zhang (2005) พัฒนาตัวตัวตรวจรู้ความชื้น โดยใช้ฟิล์มของ ZnO แบบเส้นนาโน (nanowires) และ ZnO แบบ แท่งนาโน (nanorod) ซึ่งวัคความค้านทานที่เปลี่ยนแปลงไปของวัสคุเมื่อได้รับความชื้น มี ความต้านทานที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% เท่ากับ 15 MΩ และมีความไว 20,700 ppm/%RH Packirisamy (2005) สร้างตัวตรวจรู้ความชื้น โดยวัดการเปลี่ยนแปลงก่ากวามต้านทานของฟิล์ม พอลิอิไมค์ ซึ่งวางบนขั้วไฟฟ้าสองขั้วผลตอบสนองทางเวลามีค่า 2 วินาที แต่มีข้อเสีย คือ ตัวตรวจรู้ ้ความชื้นมีผลตอบสนองต่อความชื้นสัมพัทธ์ 42% ขึ้นไป จึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องการวัดความชื้น ้ต่ำ และผลตอบสนองของตัวตรวจรู้ความชื้นยังไม่เป็นเชิงเส้น Steele (2006) พัฒนาตัวตรวจรู้ ้ความชื้นความเร็วสูงแบบตัวเก็บประจุ โคยใช้ฟิล์มบางของอลูมิเนียมออกไซค์เป็นวัสคุไวความชื้น ซึ่งให้ผลตอบสนองทางเวลาเพียง 42 มิลลิวินาทีโดยมีค่าความจุไฟฟ้าที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ี้เท่ากับ 55 pF และมีความไว 36,363 ppm/%RH แต่มีข้อเสีย คือ ผลตอบสนองที่ได้ไม่เป็นเชิง เส้น Liang (2006) สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบบรรจุตัวถังวงจรรวม ใช้เทคโนโลยี CMOS-MEMS ้มีตัวให้ความร้อน และวงจรแปลงค่าความจุไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณความถี่ ตัวตรวจรู้ความชื้นนี้ ให้ความไวเท่ากับ 321 ppm/%RH โดยที่มีค่าความถี่ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% เท่ากับ 51 MHz Ketthanom (2006) พัฒนาตัวตรวจรู้กวามชื้นแบบเทคโนโลยีวงจรรวมโคยใช้การสปัตเตอริง พอลิอิไมด์เคลือบทับขั้วอิเล็กโทรคบนฐานรองซิลิกอน พบว่าตัวตรวจรู้ความชื้นมีผลตอบสนองที่ ความชื้นสัมพัทธ์ 30% เท่ากับ 2.18 pF ตัวตรวจรู้ความชื้นมีความไว 3,810 ppm/%RH ตัวตรวจรู้มี เวลาในการดูคซึมความชื้น 1.3 วินาที มีเวลาในการกายความชื้น 247.1 วินาที

จากข้อมูลผลตอบสนองทางเวลา และความไวของตัวตรวจรู้ความชื้นที่ได้กล่าวมา สามารถ สรุปได้ดังตารางที่ 2.3 เมื่อนำข้อมูลในตารางที่ 2.3 วาดกราฟเปรียบเทียบความไว และ

ผลตอบสนองทางเวลา พัฒนาการของตัวตรวจรู้ความชื้นจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังรูปที่ 2.4 การออกแบบตัวตรวจรู้ความชื้น ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ซึ่งตัวตรวจรู้ความชื้นที่ดี ต้องสามารถใช้งานได้กว้างขวาง สร้างได้ง่าย ไม่ต้องมีการบำรุงรักษามาก ขนาดเล็ก มีความไวสูง ทนต่อสิ่งปนเปื้อน ใช้เวลาในการดูดซึม หรือคายความชื้นน้อย และเชื่อมต่อกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้ง่าย ตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย คิดเป็นจำนวนกว่า ร้อยละ 75 ของตัวตรวจรู้ความชื้นในท้องตลาด (Rittersma, 2002) เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่าย ผลตอบสนองทางเวลาเร็ว และเป็นเชิงเส้น ทำให้ง่ายในการนำไปใช้งาน และทนทานต่อ สิ่งปนเปื้อน หลักการทำงานของตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุ จะใช้วัสดุไวความชื้นเป็นชั้น ใดอิเล็กทริก ซึ่งค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (*ɛ*,) จะเปลี่ยนแปลงไปตามความชื้น ทำให้ค่าความจุไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงไปตามความชื้นด้วย ในงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบ ตัวเก็บประจุ ที่ให้ผลตอบสนองทางเวลาเร็วขึ้น มีขนาดเล็ก และสร้างด้วยเทคโนโลยีลิโธกราฟฟี ด้วยรังสีเอ็กซ์ เนื่องจากต้องการลวดลายซี่อิเล็กโทรดที่มีขนาดเล็ก และมีผนังโครงสร้างของชั้น ใดอิเล็กทริกไวความชื้นที่เรียบตรง

ในการออกแบบโครงสร้างตัวตรวจรู้จะใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาโครงสร้าง ที่ให้ผลตอบสนองทางเวลาเร็วที่สุด และสามารถสร้างได้ง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งโครงสร้างดังรูปที่ 2.5 เป็นโครงสร้างที่ให้ผลตอบสนองทางเวลาขึ้นกับค่าความกว้างของซื่อิเล็กโทรคเท่านั้นโคยเป็นไป ตามความสัมพันธ์ t = kW^2/D เมื่อ t เป็นเวลาในการตอบสนอง k เป็นค่าคงที่ขึ้นอยู่กับลักษณะ โครงสร้าง W คือ ความกว้างครึ่งหนึ่งของซื่อิเล็กโทรค และ D คือ ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของ ้ไอน้ำภายในวัสดุไวความชื้น เมื่อพิจารณาจากเครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ โครงสร้างนี้ ้เหมาะสมที่จะนำมาสร้างเป็นตัวตรวจรู้ความชื้นความเร็วสูง เนื่องจากกระบวนการลิโชกราฟฟี ้ด้วยรังสีเอ็กซ์ สามารถสร้างชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ได้ จึงสามารถใช้สร้างตัวตรวจรู้ความชื้น ที่มีผลตอบสนองทางเวลาเร็ว โดยลดความกว้างของซื่อิเล็กโทรคให้น้อยลง ถ้าต้องการเพิ่มความไว สามารถสร้างซื่อิเล็กโทรดแบบเดียวกันนี้ ขนานกันจำนวนมาก หรือทำการลดความหนาของ ้ชั้นฟิล์ม เพื่อเพิ่มความไวได้เช่นกัน ส่วนชั้นไคอิเล็กทริกจะใช้พอลิเมอร์ไวแสง SU-8 เป็นวัสคุ ้ไวความชื้น เนื่องจากเป็นวัสดุพอลิเมอร์ที่สามารถขึ้นรูปด้วยกระบวนการลิโธกราฟฟี นอกจากนี้ ้จากผลการทคลองเบื้องต้นพอลิเมอร์ไวแสง SU-8 มีค่าสัมประสิทธ์การแพร่ (D) สูงกว่าพอลิอิไมด์ ้จึงเหมาะที่จะนำพอถิเมอร์ชนิคนี้มาใช้ในโครงสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นความเร็วสูง ตัวอย่าง ้โครงสร้างอย่างง่ายของตัวตรวจรู้ความชื้นที่มีความไวสูงขึ้น ด้วยการเพิ่มพื้นที่ของอิเล็กโทรดแสดง ดังรูปที่ 2.6

ปี	ผู้ประพันธ์	หลักการ	ความไว	เวลาตอบสนอง
			ppm/%RH	(วินาที)
1983	Seiyama, et al.	ความต้านทาน	36	15
1988	Shimizu, et al.	ความจุไฟฟ้า	2,922	5
1990	Denton, et al.	ความจุไฟฟ้า/แรงคัน	13,470	600
1993	Blotshauser, et al.	ความจุไฟฟ้า/กระแส	5,330	30
1995	Sager, et al.	เปลี่ยนแปลงขนาด PI	60	90
1996	Lee, et al.	ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า	-	-
2000	Kang, et al.	ตัวเก็บประจุ	2,307	1
2001	Laville, et al.	ตัวเก็บประจุ	3,166	1
2002	Laville,et al.	ตัวเกีบประจุ	3,166	0.2
2003	Das, et al.	ตัวเก็บประจุ/การเลื่อนเฟส	333,333	10
2004	Kann, et al.	กระแสไฟฟ้า	360,000	0.2
2005	Zhang, et al.	ความด้ำนทาน	20,700	3
2005	Packirisamy, et al.	ความต้ำนทาน	-	2
2006	Steele.	ตัวเกีบประจุ	36,000	0.42
2006	Liang.	ความจุไฟฟ้า/ความถึ่	321	-
2006	Ketthanom.	ความจุไฟฟ้า	3,810	1.3

ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาและความไวของตัวตรวจรู้ความชื้น



รูปที่ 2.4 เปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาและความไวของตัวตรวจรู้ความชื้นแบบต่าง ๆ



รูปที่ 2.5 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบซี่ยาว



รูปที่ 2.6 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นความเร็วสูงที่เพิ่มความไวโคยการเพิ่มพื้นที่อิเล็กโทรด

บทที่ 3 การพัฒนากระบวนการพื้นฐาน

การสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นโดยใช้กระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์ มีกระบวนการ และขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายขั้นตอน ได้แก่ การฉายรังสีเอ็กซ์เพื่อสร้างชิ้นงาน เทคนิคใน การสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ โดยใช้เงินเป็นวัสดุดูดกลืนรังสี การสร้างหน้ากากโลหะ เพื่อใช้ สำหรับการสร้างลวดลายวัสดุไวความชื้น และขั้วอิเล็กโทรดด้วยรังสีเอ็กซ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การคำนวณพลังงานแสงซินโคตรอนที่ใช้ในกระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์

กระบวนการลิโธกราฟฟีเป็นกระบวนการในการสร้างโครงสร้างจุลภาค ซึ่งอาศัยการเกิด เงาของแสงเมื่อมีวัตถุใคมาบังแหล่งกำเนิคแสง โดยวัตถุที่ใช้มากั้นเรียกว่าหน้ากากกั้นแสง (mask) หน้ากากกั้นแสงนี้จะเป็นส่วนมีมีลวคลายจุลภาคอยู่ เมื่อฉายแสงผ่านหน้ากากกั้นแสง แสงที่ผ่าน หน้ากากจะถูกฉายลงบนสารไวแสงโฟโตรีซีส (photoresist) ที่ทำหน้าที่เป็นฉากรับภาพ แสงที่ ตกกระทบจะทำปฏิกิริยากับสารไวแสงทำให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นในเนื้อสารไวแสง เมื่อล้างด้วย ้น้ำยาล้างฟิล์มจึงจะได้ลวดลายตามต้องการ กระบวนการดังกล่าวได้ถูกพัฒนามาเพื่อใช้ผลิต ้โครงสร้างขนาดจุลภาค ซึ่งมีความสูงมากกว่าเมื่อเทียบกับความกว้าง (High-aspec ratio) ทำให้ ้สามารถสร้างชิ้นงานที่มีโครงสร้างเป็นสามมิติได้ โดยกระบวนการลิโธกราฟฟี จะใช้แหล่งกำเนิด พลังงานแสงชนิดต่าง ๆ สำหรับกระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต จะใช้พลังงาน แสงอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นในช่วง 365-405 nm สร้างลวดลายลงบนสารไวแสงโดยการ ้ฉายรังสีอัลตราไวโอเลตผ่านหน้ากากโปร่งใสที่มีลวคลายจุลภาคทึบแสง สารไวแสงที่ใช้เป็น ฉากรับภาพมีสองชนิด คือ สารไวแสงชนิดบวก (Possitive-photoresist) และสารไวแสงชนิดลบ (Negative-photoresist) ตัวอย่างสารไวแสงชนิดบวก ได้แก่ AZ ส่วนที่ถูกฉายด้วยรังสี ้อัลตราไวโอเลตจะหลุดหายไปหลังล้างด้วยน้ำยาล้างฟิล์ม ส่วนสารไวแสงชนิดลบ ได้แก่ SU-8 ซึ่งส่วนที่ถูกฉายด้วยรังสี อัลตราไวโอเล็ตจะแข็งตัวเป็นโครงสร้างถาวร ส่วนบริเวณที่ไม่ถูกฉาย ้จะสามารถล้างออกได้ด้วยน้ำยาล้างฟิล์มเช่นกัน โดยกระบวนการทั้งสองประเภทสามารถแสดงได้ ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 การสร้างลวคลายลงบนสารไวแสงชนิดบวกและชนิดลบ

นอกจากกระบวนการลิโธกราฟฟิด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตแล้ว ยังมีกระบวนการ ลิโธกราฟฟิด้วยรังสีเอ็กซ์ ซึ่งมีข้อดี คือ สามารถสร้างชิ้นงานที่มีโครงสร้างสูงกว่า และชิ้นงานยังมี ผนังของลวดลายโครงสร้างจุลภาคที่เรียบตรง เมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ได้จากการใช้รังสี อัลตราไวโอเลต แต่การสร้างชิ้นงานด้วยรังสีเอ็กซ์นั้นจะมีต้นทุนสูงกว่า หน้ากากที่ใช้ต้องเป็นวัสดุ ที่รังสีเอ็กซ์ไม่สามารถผ่านได้ ซึ่งจะใช้โลหะที่มีเลขอะตอมสูง เช่น ทอง หรือเงิน โดยมี แหล่งกำเนิดพลังงานแสงจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ซึ่งผลิตแสงที่มีพลังงานออกมา ในช่วงกว้างดังแสดงในรูปที่ 3.2 การนำพลังงานแสงซินโครตรอนมาใช้งาน จะกรองให้เหลือเฉพาะแสงในข่านที่สามารถ นำมาใช้ประโขชน์สำหรับกระบวนการลิโธกราฟฟีได้ซึ่งเป็นพลังงานแสงในช่วงของรังสีเอ็กซ์ พลังงานต่ำ (soft X-ray) ดังแสดงในรูปที่ 3.3 พลังงานจากรังสีเอ็กซ์ที่ชิ้นงานได้รับ จะต้องมีปริมาณ ที่พอเหมาะ จึงจะได้โครงสร้างจุลภาคที่ดี ถ้าพลังงานน้อยเกินไป จะทำให้โครงสร้างอ่อนตัว ไม่สามารถใช้งานได้ หรือมากเกินไปจะทำให้โครงสร้างแตกร้าว หลุดร่อนจากฐานรอง นอกจากนี้ หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์จำเป็นต้องมีความหนาเพียงพอ ที่จะกั้นรังสีเอ็กซ์มิให้ตกกระทบ สารไวแสง บริเวณที่ไม่ต้องการให้เกิดการแข็งตัว พลังงานส่วนนี้ไม่สามารถวัดได้ด้วยอุปกรณ์ ที่มีอยู่ จึงด้องใช้การคำนวณทางทฤษฎีเพื่อให้ทราบพลังงานที่สารไวแสงได้รับ เนื่องจากใน กระบวนการสร้างชิ้นงานที่ต่างกัน จะมีการใช้วัสดุส่วนฐานรองของหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ ต่างกัน วัสดุดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ต่างกัน และยังอาจมีการใส่ตัวกรองอื่น ๆ เข้าไปด้วย ทำให้สเปกตรัม พลังงานที่ออกมาเปลี่ยนแปลงไป และความหนาของชั้นตัวกรองข้งมีผลให้พลังงานลดทอนลงอีก สามารถแสดงตัวอย่างลำคับชั้นของตัวกรองจนถึงชิ้นงานของระบบลำเลียงแสงซินโครตรอน ที่ใช้งานจริงในกระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์ของระบบลำเลียงแสง BL-6 ณ ศูนย์ ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำแนิดแลงซินโครตรอนแห่งสาดิ ดังรูปที่ 3.3

การคำนวณพลังงานของแสงซินโครตรอน สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มี ผู้สร้างไว้แล้วเช่น XOP (X-ray Oriented Programs) แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดของ XOP ที่ไม่สามารถใช้ ชั้นวัสดุกรองแสงได้เกิน 5 ชั้นทำให้ไม่สามารถใช้กับกระบวนการถิโธกราฟฟิด้วยรังสีเอ็กซ์ของ ระบบลำเลียงแสง BL-6 ได้ หรือเมื่อต้องการชุดข้อมูลการจำลองผลจำนวนมากเพื่อนำมาวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ จำเป็นต้องเก็บข้อมูลจำนวนมาก ทำได้โดยการเปลี่ยนก่าในโปรแกรม XOP ซึ่ง ใช้เวลานานและไม่สะดวก ในส่วนนี้จึงได้ทำการพัฒนาโปรแกรมที่เขียนขึ้นเองชื่อว่าโปรแกรม XmaskSim โดยใช้ภาษา Scilab ที่เขียนได้ง่าย และสามารถคำนวณกณิตศาสตร์ขั้นสูงได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้สามารถแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของงานได้ สำหรับการคำนวณ บางขั้นตอนที่ยุ่งยากสามารถใช้โปรแกรม XOP ช่วยสร้างชุดข้อมูล เช่นการสร้างสเปกตรัมพลังงาน ที่ได้จากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ที่กระแสก่าต่าง ๆ เป็นต้น


Photon energy (eV) รูปที่ 3.2 สเปกตรัมกำลังของแสงซิน โครตรอนที่กระแสอิเล็กตรอน 40 mA



รูปที่ 3.3 องค์ประกอบของระบบลำเลียงแสงซินโครตรอน BL-6 ที่ใช้สำหรับกระบวนการ ลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ

3.1.1 สมการและขั้นตอนการคำนวณ

การคำนวณพลังงานของรังสีที่สาร ไวแสงได้รับ เริ่มจากการสร้างสเปกตรัมพลังงาน ของแสงซินโครตรอนด้วยโปรแกรม XOP เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่ออำนวย ความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจ สามารถนำมาใช้โดยไม่คิดมูลก่า เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการคำนวณ จึงใช้โปรแกรม XOP ในการสร้างสเปกตรัมของแสงที่แผ่ออกมาจากระบบดำเลียงส่วนหน้า หรือ (*I_{BL6}*) โดยใช้พารามิเตอร์ของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนที่ใช้งานอยู่จริง โดยมีพลังงานของ อิเล็กตรอนในวงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอน (E) เท่ากับ 1.2 GeV รัสมีความ โค้งแม่เหล็ก (Bending magnet radius of curvature : R_{BM}) เท่ากับ 2.78 เมตร จากรัศมีความโค้งแม่เหล็ก สามารถ กำนวณหาความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กได้จากสมการที่ (3-1) ซึ่งจะได้ความความหนาแน่นฟลักซ์ แม่เหล็กเท่ากับ 1.44 เทสลา มุมเปิดของกรวยแสงในแนวดิ่ง (vertical opening angle from source) สามารถคำนวณได้ตามสมการที่ (3-2) โดยจะได้มุมเปิด เท่ากับ 0.425 mrad พลังงานคุณลักษณะ (characteristic energy : E) จะมีความสัมพันธ์กับค่าพลังงานของอิเล็กตรอนในวงแหวนกักเก็บ อิเล็กตรอน และรัศมีความโค้งของแม่เหล็กตามสมการที่ (3-3) โดยมีพลังงาน เท่ากับ 1.378 keV กำลังงานของแสงซินโครตรอน 99% จะอยู่ในช่วงพลังงาน 0.01E_c ถึง 7E_c ในกรณีของเกรื่อง กำเนิดแสงซินโครตรอน มีค่าพลังงานคุณลักษณะ 1.378 keV ดังนั้น 99% ของกำลังแสง ซินโครตรอนจึงอยู่ในช่วง 13.78 eV ถึง 9.646 keV

ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก =
$$\frac{3.3357 \times E(GeV)}{R_{BM}(m)}$$
 (3-1)

มุมเปิดของกรวยแสงในแนวคิ่ง =
$$\frac{0.51(\text{mrad})}{E(\text{Gev})}$$
 (3-2)

พถังงานคุณลักษณะ =
$$\frac{2,218 \times E^3 (\text{GeV})}{R_{BM} (m)}$$
 (3-3)

ความยาวคลื่นคุณลักษณะ =
$$rac{5.59 imes R_{BM}(m)}{E^3(GeV)}$$
 (3-4)

อิเล็กตรอนที่โคจรในวงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอนในแต่ละรอบ จะมีการสูญเสีย พลังงานเนื่องจากการเลี้ยวเบนซึ่งถูกบังคับโดยแม่เหล็กโค้งทั้ง 8 ตัว ดังรูปที่ 3.4 โดยอิเล็กตรอน จะปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนี้เป็นพลังงานที่อิเล็กตรอนสูญเสีย ไปในแต่ละรอบการโคจร ซึ่งในแต่ละรอบจะถูกเลี้ยวเบน 8 ครั้ง เท่ากับจำนวนแม่เหล็กโค้ง สามารถกำนวณได้ตามสมการที่ (3-5) ในแต่ละรอบอิเล็กตรอนจะสูญเสียพลังงานทั้งสิ้น เท่ากับ 66 W/mA เมื่อ I(mA) คือ ก่ากระแสของวงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอน

Total energy loss per revolution =
$$\frac{\left[88.5\right] \times \left[E^{4}(\text{GeV})\right] \times \left[I(\text{mA})\right]}{\left[R_{BM}(\text{m})\right]}$$
(3-5)

กำลังที่อิเล็กตรอนสูญเสียในแต่ละรอบการโคจร เป็นผลรวมของกำลังที่สูญเสียเมื่อ ผ่านแต่ละแม่เหล็กโค้ง มีกำลัง 66 W/mA ดังนั้นในแม่เหล็กโค้งแต่ละตัวจะมีกำลังสูญเสีย 8.25 W/mA แม่เหล็กแต่ละตัวมีรัศมีความโค้ง เท่ากับ 2.78 เมตร มีความยาวของแม่เหล็ก (BM path length) เท่ากับ 2.1834 เมตร หรือคิดเป็นมุมเปิด เท่ากับ 0.7854 rad ดังรูปที่ 3.5กำลัง 8.25 W/mA จะปล่อยออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตลอดทั้งความยาวของแม่เหล็กโค้ง ซึ่งมีความยาว 2.1834 เมตร แต่ในระบบลำเลียงแสง BL-6 ดังรูปที่ 3.6 จะมีหน้ากาก 1 และ 2 เป็นตัวกำหนดมุมเปิดของ แสงซินโครตรอนที่จะนำไปใช้งาน โดยมีมุมเปิดสุดท้าย 5.063 mrad ซึ่งยอมให้พลังงานที่ผ่าน ออกมาเพียง 52.5 mW/mA หรือคิดเป็นสัดส่วนพลังงานที่ระบบลำเลียงแสงซินโครตรอนให้ผ่าน

ระบบลำเลียงแสงประกอบด้วยชิ้นงานและวัสดุกรองแสงทั้งสิ้น 6 ชั้น ได้แก่ แผ่น ผลึกเบอริลเลียม แผ่นพอลิอิไมด์ แผ่นอลูมิเนียม แผ่นฐานรองหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ ลวดลายโลหะ กั้นรังสีเอ็กซ์ และฟิล์มหนาของสารไวแสงโดยลักษณะของระบบลำเลียงแสง BL-6 แสดงได้ดังรูป ที่ 3.7 หน้ากาก 1 และ 2 จะเป็นตัวกำหนดมุมเปิดของกรวยแสง ระยะทางจากจุดกำเนิดแสงถึง หน้ากากตัวที่หนึ่ง (mask1) เท่ากับ 1.952 เมตร มุมเปิดในแนวนอนเท่ากับ 17.42 mrad มุมเปิด ในแนวดิ่งเท่ากับ 0.425 mrad หน้ากากตัวที่สอง (mask2) มีระยะจากจุดกำเนิดแสง เท่ากับ 4.937 เมตร มุมเปิดในแนวนอน เท่ากับ 5.063 mrad มุมเปิดในแนวดิ่ง เท่ากับ 0.425 mrad หน้ากาก ตัวที่สองจึงเป็นตัวกำหนดมุมเปิดในแนวนอน คือ 5.063 mrad จากนั้นแสงจะเข้าสู่หน้าต่าง ผลึกเบอริลเลียม ซึ่งห่างจากจุดกำเนิดแสง 7.59 เมตร มีมุมเปิดในแนวนอน เท่ากับ 5.063 mrad มุมเปิดในแนวดิ่ง เท่ากับ 0.425 mrad แสงจึงสามารถลอดผ่านหน้าต่างนี้โดยที่ไม่มีการจำกัดมุมเปิด และแสงที่ผ่านไปจะเข้าสู่ชั้นตัวกรองแสง ได้แก่ แผ่นฟิล์มพอลิอิไมด์หนา 100 µm อลูมิเนียมหนา 16 μm มีระยะทางจากจุดกำเนิดแสงจนถึงชิ้นงาน เท่ากับ 17.93เมตร พื้นที่ตกกระทบของแสง มีขนาด 6.917 ตารางเซนติเมตร หรือ สูง 0.762 เซนติเมตร กว้าง 9.078 เซนติเมตร ตัวอย่าง การคำนวณพลังงานแสงที่ตกกระทบชิ้นงานในกรณีที่ไม่มีตัวกรอง และหน้ากากกำหนดมุมเปิด ของแสง (Mask1, Mask2) เป็นดังรูปที่ 3.5

จากรูปที่ 3.6 การคำนวณพลังงานที่ตกกระทบบนชิ้นงาน หาได้จากพลังงานของ แหล่งกำเนิดแสง (I_{ar}) หารด้วยพื้นที่ตกกระทบของแสง โดยสมมติว่าไม่มีชั้นตัวกรองและหน้าต่าง พื้นที่ที่ตกกระทบของแสงจะเป็นดังรูปที่ 3.5 โดยความหนาแน่นพลังงาน (power density) เป็นไป ตามสมการที่ (3-7) เมื่อ I_{BL} คือ พลังงานตกกระทบที่ระนาบของชิ้นงาน โดยไม่มีชั้นตัวกรองหรือ หน้าต่างใด ๆ ซึ่งก็คือ พลังงานที่ออกมาจากจุดกำเนิดแสงทั้งหมด และ A, คือ พื้นที่ที่แสง ตกกระทบแต่ในระบบถ้าเลี้ยงแสงที่ใช้งานจริงแสงจะถูกจำกัดมุม โดย mask1 และ mask2 ดังรูป ี้ที่ 3.7 โดยมีมุมเปิด 5.063 mrad 0.425 mrad ในแนวระนาบและแนวดิ่งตามลำคับ โดยพื้นที่ที่แสง ตกกระทบระนาบชิ้นงาน เท่ากับ 6.917 ตารางเซนติเมตร หรือ สูง 0.762 เซนติเมตรกว้าง 9.078 เซนติเมตร แสงที่ออกมาจึงมีลักษณะยาว จึงต้องใช้การเลื่อนชิ้นงานตัคแสงเพื่อให้ได้พื้นที่ ในการฉายแสงเพิ่มขึ้น ถ้าระบบการเลื่อนชิ้นงานมีความเร็วมากพอ จะสามารถคำนวณพลังงาน ตกกระทบของแสงโดยใช้ระยะการเลื่อนชิ้นงาน 10 เซนติเมตร บวกกับความสูงของแสง 0.762 เซนติเมตร และคูณกับความกว้างของแสง 9.078 เซนติเมตร จะได้พื้นที่ที่แสงตกกระทบ เท่ากับ 97.7 ตารางเซนติเมตร ซึ่งสามารถคำนวณความหนาแน่นพลังงานได้โดย นำพลังงาน ที่ถูกจำกัดด้วย mask2 หารด้วยพื้นที่ 97.7 ตารางเซนติเมตร แต่ในการใช้งานปัจจุบันจะมี ้ข้อผิดพลาดในการคำนวณพลังงานเนื่องจาก ระบบการเลื่อนชิ้นงานยังช้ามาก การคำนวณควรใช้ ้อัตราเร็วในการเลื่อนชิ้นงาน (cm/s) คูณกับระยะเวลาที่จุดใด ๆ บนชิ้นงานตัดผ่านแสงที่มีความสูง 0.762 เซนติเมตร ซึ่งจะช่วยให้การกำนวณพลังงานถูกต้องมากขึ้น

ความหนาแน่นพลังงาน (power density) =
$$\frac{I_{BL}}{A_S}$$
 (W/cm²) (3-7)



รูปที่ 3.5 ลักษณะของแสงซินโครตรอนที่แผ่ออกมาจากแม่เหล็กโค้ง bending magnet

ผลการคำนวณสเปกตรัมของแสงซินโครตรอนจากแหล่งกำเนิด BM ถูกเก็บในรูป ข้อมูลจุดกำลังงาน (power) โดยมีพลังงานของอิเล็กตรอนในช่วง 100-50,000 eV ช่วงพลังงานห่าง กัน 1 eV สเปกตรัมของกำลังแสงที่ได้จากโปรแกรม XOP เป็นสเปกตรัมที่แผ่ออกมาขณะค่ากระแส อิเล็กตรอนในวงกักเก็บค่าหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากการผลิตแสงซินโครตรอน จะมีค่ากระแส อิเล็กตรอนไม่คงที่ โดยจะมีค่าลดลงจากประมาณ 130 mA ถึงประมาณ 30 mA ในแต่ละรอบ ดังนั้น ข้อมูลสเปกตรัมของแสงที่ผลิตได้จะมีหลายชุด รูปที่ 3.2 แสดงสเปกตรัมของแสงซินโครตรอน ขณะกระแสอิเล็กตรอนเท่ากับ 40 mA ซึ่งข้อมูลที่เก็บจะเป็นสเปกตรัมที่สามารถนำค่ากระแส ในหน่วยของ mA ไปคูณเพื่อให้ได้ค่าสเปกตรัมที่ก่ากระแสใด ๆ ได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน ในการคำนวณของโปรแกรม XmaskSim ได้

เมื่อได้สเปกตรัมแสงซินโครตรอนจากแหล่งกำเนิดแล้ว จึงใช้โปรแกรม XmaskSim กำนวณการส่งผ่านคลื่นแสง (Transmission) และดูดกลืนคลื่นแสง (Absorption) ของวัสดุโดยใช้ สมการที่ (3-8) และ (3-9) ตามลำดับ ขั้นแรกจะเป็นการกำนวณกำลังของคลื่นแสงเมื่อผ่านตัวกรอง ชั้นต่าง ๆ จนครบทุกชั้น โดยจะใช้สมการที่ (3-8) จนได้ก่าสเปกตรัมสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่ สารไวแสงต่อไป

$$I(z,\hbar\omega) = I_0 e^{-\mu(\hbar\omega)z}$$
(3-8)

เมื่อ I₀ คือ กำลังของคลื่นแสงก่อนเข้าสู่วัสดุ สร้างโดยใช้โปรแกรม XOP เก็บไว้เป็น สเปกตรัมตามค่าพารามิเตอร์ของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนในรูปของตาราง ค่าสเปกตรัม กำลังงานของแสงซินโครตรอน มีความสัมพันธ์กับค่าของกระแสในวงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอน แบบเชิงเส้น ข้อมูลที่เก็บในรูปตารางจึงสามารถตัดค่าสัมประสิทธิ์กระแสออก เพื่อให้สามารถสร้าง สเปกตรัมแสงซินโครตรอนที่ก่ากระแสใด ๆ ได้สะดวกขึ้น



รูปที่ 3.6 กรวยแสงที่ตกกระทบชิ้นงาน



รูปที่ 3.7 ลักษณะของระบบลำเลียงแสง BL-6 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสง ซินโครตรอนแห่งชาติ

ค่าสเปกตรัมกำลังงานจะเป็นเป็นฟังก์ชันของแสงซินโครตรอนที่พลังงาน ต่าง ๆ หรือ $\hbar\omega$ และก่าความหนาของวัสดุกั้นคลื่นแสง z โดยที่ $\mu(\hbar\omega)$ คือ สัมประสิทธิ์การดูดกลืน รังสีของวัสดุแต่ละชนิด มีความหนาเป็น z และมีหน่วยเป็น cm โดยตัวอย่างสัมประสิทธิ์การ ดูดกลืนรังสีของอลูมิเนียมแสดงได้ดังรูปที่ 3.8 เมื่อคำนวณตามสมการที่ (3-8) จะได้สเปกตรัม พลังงานที่ผ่านออกมาจากวัสดุ และใช้เป็น I_0 ของการคำนวณสเปกตรัมที่ผ่านตัวกรองชั้นต่อไป ทำการกำนวณจนได้สเปกตรัมที่ผ่านตัวกรองชั้นสุดท้าย ซึ่งจะใช้เป็นสเปกตรัมที่นำไปคำนวณการ ดูดกลืนพลังงานของสารไวแสง โดยใช้สมการที่ (3-9) ในการคำนวณพลังงานที่ถูกดูดกลืนโดย สารไวแสง ซึ่งเป็นพลังงานที่ต้องการทราบ ตัวอย่างระบบลำเลียงแสงซินโครตรอน แสดงได้ดังรูป ที่ 3.9 เมื่อ $I_{0e}^{-\mu(\hbar\omega)z}$ คือ สเปกตรัมพลังของแสงซินโครตรอนที่ผ่านเข้าสู่เนื้อสารไวแสง ที่ กวามหนา z $\mu(\hbar\omega)$ คือ สัมประสิทธิ์การดูดกลืนคลื่นแสงของสารไวแสง Absorb(z, $\hbar\omega$) คือ สเปกตรัมการดูดกลืนพลังงานเพื่อให้ได้พลังงานในหน่วย W/cm โดยใช้สมการที่ (3-10)

$$Absorb(z,\hbar\omega) = \mu(\hbar\omega)I_0 e^{-\mu(\hbar\omega)z}$$
(3-9)

$$D(z) = \int_{E_1}^{E_2} I_0 e^{-\mu(\hbar\omega)z} \mu(\hbar\omega) d\hbar\omega$$
(3-10)

สมการที่ (3-10) ช่วยให้ทราบค่าพลังงานที่สารไวแสงที่ความหนาต่าง ๆ ได้รับ โดย μ(ħω) คือ สัมประสิทธิ์การดูดกลืนคลื่นแสงของสารไวแสง E₁, E₂ คือ ช่วงพลังงานของ สเปกตรัม ซึ่งในที่นี้ใช้ค่า 100-50,000 eV และ D(z) คือ พลังงานที่สารไวแสงที่ความหนา z ดูดกลืน มีหน่วยเป็น W/cm สามารถสรุปการทำงานของโปรแกรมได้ดังรูปที่ 3.12 เมื่อนำโปรแกรมนี้ ทดสอบใช้งานเพื่อจำลองผลการฉายรังสี โดยใช้พารามิเตอร์จากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ทดสอบที่ค่ากระแส 60 mA ใช้ตัวกรองต่าง ๆ ตามที่ใช้ในระบบลำเลียงแสง BL-6 มีลำดับ คือ ผลึกเบอริลเลียม 100 µm พอลิอิไมด์ 100 µm อลูมิเนียม 16 µm และเงิน 30 µm สามารถแสดง สเปกตรัมพลังงานเมื่อผ่านตัวกรองชั้นต่าง ๆ ได้ดังรูปที่ 3.10 ซึ่งแสดงให้เห็นสเปกตรัมพลังงาน ที่เปลี่ยนไปเมื่อผ่านวัสดุชั้นต่าง ๆ สเปกตรัมพลังงานจะมีค่าลดลงเรื่อย ๆ จากวิธีการคำนวณ ข้างต้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์ของระบบลำเลียงแสง BL-6 ของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน แห่งชาติได้



รูปที่ 3.8 สัมประสิทธิ์การดูดกลืนคลื่นแสงของอลูมิเนียม

การฉายรังสีลงบนชั้นฟิล์มไวแสง กำลังงานที่สารไวแสงที่ระดับความหนาต่างกัน ใด้รับ จะมีค่าต่างกัน โดยลดลงตามความหนาของเนื้อสารไวแสง แบบเอ็กซ์โปเนนเซียล รูปที่ 3.11 แสดงนิยามของกำลังงานที่ตำแหน่งต่าง ๆ ในเนื้อสารไวแสง ซึ่งแต่ละค่ามีความสำคัญในการสร้าง ชิ้นงาน กำลังแสงที่ผ่านหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ออกมา จะแบ่งเป็นส่วนมืด (dark zone) ซึ่งเป็นส่วน ที่มีวัสดุกั้นรังสีเอ็กซ์ และส่วนสว่าง (blight zone) ซึ่งเป็นส่วนที่รังสีเอ็กซ์สามารถผ่านได้ สำหรับ ส่วนมืด กำลังงานสะสมในเนื้อสารไวแสงส่วนบนสุด (top dark) ต้องไม่มากจนทำให้สารไวแสง แข็งตัว โดยวัสดุกั้นรังสีต้องมีความหนาพอที่จะให้กำลังงานส่วนนี้ไม่เกินล่าที่กำหนด และใน ส่วนสว่าง กำลังงานที่สารไวแสงส่วนอ่างสุด (bottom blight) ได้รับต้องมีค่าพอเหมาะที่จะทำให้ สารไวแสงแข็งตัว จึงจะทำให้ได้โครงสร้างที่ดี ถ้ามากเกินไปอาจทำให้โครงสร้างโก่งตัวจนหลุด จากฐาน หรือถ้าน้อยเกินไปจะทำให้สารไวแสงไม่แข็งตัวและหลุดไป นอกจากนี้ยังมีค่าความคมชัด (%contrast) คือ ค่ากำลังงานในเนื้อสารไวแสงไม่แข็งตัวและหลุดไป นอกจากนี้ยังมีค่าความคมชัด (might : bottom dark) ค่าเปอร์เซนต์ความคมชัดนี้ต้องใกล้ 100% จึงจะได้ลวดลายที่คมสวยงาม การกำนวณเหล่านี้จะใช้โปรแกรม XmaskSim ในการกำนวณ ส่วนค่าพลังงานที่เหมาะสม จะได้ จากผลการทดลอง



รูปที่ 3.9 สเปกตรัมพลังงานหลังจากผ่านวัสดุกรองแสงต่าง ๆ



รูปที่ 3.10 แสดงพลังงานส่วนต่าง ๆ ที่คำนวณ โดยใช้โปรแกรม XmaskSim



รูปที่ 3.11 การคำนวณการส่งกำลังของแสงซินโครตรอนผ่านวัสดุกรองต่าง ๆ



รูปที่ 3.12 แผนภาพโฟลวชาร์ตแสดงการคำนวณของโปรแกรม XmaskSim

3.2 การสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ่

ในกระบวนการลิโธกราฟฟิด้วยรังสีเอ็กซ์ สิ่งที่มีความสำคัญต่อกระบวนการ คือ หน้ากาก กั้นรังสีเอ็กซ์ ซึ่งใช้กั้นรังสีเอ็กซ์ให้เกิดเป็นเงาของลวดลายต้นแบบบนสารไวแสง วัสดุที่ใช้ กั้นรังสีเอ็กซ์ ได้แก่ วัสดุที่มีเลขอะตอมสูงเช่น ทอง หรือเงิน โดยจะสร้างบนฐานที่เป็นวัสดุ โปร่งรังสีเอ็กซ์ ซึ่งเปรียบได้กับกระจก หรือแผ่นใสในกระบวนการลิโธกราฟฟิด้วยรังสี อัลตราไวโอเลต โดยในกระบวนการสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์นั้น จะใช้กระบวนการลิโธกราฟฟิ ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต ในการสร้างลวดลายแม่พิมพ์สารไวแสงเพื่อชุบโลหะทองหรือเงิน โดย กระบวนการทั้งหมดมีดังนี้

3.2.1 การออกแบบลวดลาย

ในขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบลวดลายโครงสร้างที่จะใช้เป็นหน้ากากกั้นรังสี อัลตราไวโอเลต เพื่อใช้สร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ ลวดลายนี้วาดด้วยโปรแกรม Layout Editor ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างลวดลายที่มีขนาดเล็กระดับไมโครเมตรได้ ตัวอย่างลวดลายที่วาด ด้วยโปรแกรม Layout Editor แสดงในรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13 ตัวตรวจรู้ความชื้นที่มีความกว้างซื่อิเล็กโทรค 40 μm ออกแบบโคยโปรแกรม Layout Editor

เมื่อวาดลวดลายตัวตรวจรู้ความชื้นแล้วขั้นตอนต่อไปจึงพิมพ์ลวดลายตามที่ออกแบบ ลงบนฟิล์มใส ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ความละเอียด 3,600 จุดต่อนิ้ว ซึ่งสามารถสร้างลวดลาย ทึบแสงที่มีขนาดเล็ก 40 µm รูปที่ 3.14 แสดงหน้ากากกั้นรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งเป็นลวดลาย ทึบแสงบนแผ่นใส ลวดลายทึบแสงนี้จะนำไปใช้ในกระบวนการสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ โดยใช้ รังสีอัลตราไวโอเลต ฉายผ่านหน้ากากลงบนสารไวแสง ในที่นี้จะใช้สารไวแสงชนิดบวก AZ4620 เนื่องจากสามารถล้างออกได้ง่ายและไม่หลุดร่อนในกระบวนการชุบโลหะเงิน



รูปที่ 3.14 หน้ากากกั้นแสงอัลตราไวโอเลตที่มีลวดลายจุลภาคขนาด 40 µm ซึ่งพิมพ์ลงบน ฟิล์มใสด้วยแสงเลเซอร์ความละเอียด 3,600 จุดต่อนิ้ว

3.2.2 การเตรียมส่วนฐานของหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์

หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์มีโครงสร้างที่สำคัญสองส่วน คือ ส่วนของฐานรอง และส่วน วัสดุดูคกลื่นรังสีเอ็กซ์ ส่วนฐานต้องใช้วัสดุที่โปร่งรังสีเอ็กซ์และนำไฟฟ้าได้ โดยทั่วไปจะใช้ กราไฟต์เนื่องจากเป็นวัสดุที่รังสีเอ็กซ์ผ่านได้ดี และนำไฟฟ้าได้ แต่กราไฟต์ยังมีราคาแพง และ หาซื้อได้ยาก จึงเลือกใช้แผ่นใสชนิดถ่ายเอกสาร เนื่องจากเป็นวัสดุที่รังสีเอ็กซ์ผ่านได้ดี มีราคาถูก และทนความร้อนได้สูง แต่แผ่นใสมิโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง และไม่นำไฟฟ้า สามารถแก้ปัญหาได้ โดยนำแผ่นใสติดกับวงแหวนเพื่อยึดแผ่นใสให้ตึงและเรียบ สามารถหยิบจับใช้งานได้ง่าย จากนั้น นำแผ่นใสเข้าสู่กระบวนการเคลือบโลหะโดยการระเหยในสุญญากาศ ซึ่งจะใช้โลหะไทเทเนียม และเงิน เนื่องจากโลหะไทเทเนียมสามารถยึดติดกับแผ่นใสและโลหะอื่น ๆ ได้ดี หน้ากากกั้น ้รังสีเอ็กซ์ที่สร้าง จะใช้เงินเป็นวัสคกั้นรังสีเอ็กซ์ ซึ่งในขั้นตอนการชบด้วยไฟฟ้า ถ้าชบเงินลงบน ้โลหะอื่น ๆ สารละลายเงินจะกัดกร่อนจนทำให้โครงสร้างแม่พิมพ์สารไวแสงหลดร่อนจาก ฐานโลหะ ไม่สามารถชุบเงินต่อไปได้ การระเหยเคลือบโลหะเงินทับลงไปก่อน จะช่วยแก้ปัญหานี้ แผนภาพการเตรียมส่วนฐานของหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์เป็นดังรูปที่ 3.15 ขั้นตอนแรก นำแผ่นใสติด กับวงแหวนโลหะเพื่อให้แผ่นใสมีความแข็งแรง ใช้สารไวแสง SU-8 2050 เป็นกาวยึค เนื่องจาก ้สามารถทนต่อสารเคมีและความร้อนในกระบวนการได้ หลังจากทากาวที่วงแหวน และนำแผ่นใส ติดเข้าไปจึงทำการอบที่อณหภมิ 65 องศาเซลเซียส 30 นาทีและอบที่ 95 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง หลังจากชิ้นงานเย็นลงนำมาฉายรังสีอัลตราไวโอเลตด้วยเกรื่อง UV-PCB เป็นเวลา 30 นาที และ ้นำไปอบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 30 นาที และอบที่ 95 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง นำแผ่นใส ที่ติดกับวงแหวนมาถ้างทำกวามสะอาดโดยเช็ดด้วย IPA (Isopropyl alcohol) ฉีดด้วยอะซิโตน และ ้ ถืดด้วย IPA อีกครั้ง นำไปทำความสะอาดด้วยกลื่นเสียง อัลตราโซนิกในน้ำดีไอ (DI water) ้ประมาณ 10 นาที เป่าให้แห้งด้วยแก๊สในโตรเจน และอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 30 นาที จากนั้นนำไปเคลือบโลหะ ไทเทเนียมและเงินโดยการระเหยในสุญญากาศ ซึ่งจะได้ ้ความหนาประมาณ 200 และ 600 อังสตรอม ตามลำคับ จากนั้นนำไปเคลือบสารไวแสงชนิคบวก AZ4620 โดยการหมุนเคลือบด้วยเครื่องหมุนเคลือบ Laurell รุ่น WS-400B-6NPP/LIT ด้วยความเร็ว 500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 วินาที ซึ่งจะได้ความหนาของสารไวแสงประมาณ 35 μm นำไปอบที่ ้อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อให้สารไวแสงแข็งตัว เมื่อชิ้นงานเย็นลงจึงนำ ไปฉายรังสีอัลตราไวโอเลตในขั้นตอนต่อไป



รูปที่ 3.15 การเตรียมฐานสำหรับหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์



รูปที่ 3.16 แผ่นใสที่เคลือบโลหะ ไทเทเนียม และเงินซึ่งใช้เป็นฐานรองรับลวคลายของโลหะเงิน ความหนา 40 µm ในขั้นตอนต่อไป

3.2.3 การฉายแสงอัลตราไวโอเลต

เมื่อได้แผ่นใสที่เคลือบสารไวแสงแล้ว ขั้นดอนต่อไป คือ การสร้างลวดลายลงบน แผ่นใสเกลือบโลหะ เพื่อล้างสารไวแสงให้เกิดลวดลาย และชุบโลหะเงินลงบนแผ่นใสเพื่อใช้ สำหรับเป็นหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ต่อไป โดยขั้นตอนต่าง ๆ เริ่มต้นด้วยการนำหน้ากากหมึกทึบแสง วางทับบนแผ่นใสที่เกลือบสารไวแสงชนิดบวก AZ4620 โดยหันด้านที่มีหมึกเข้าหาสารไวแสง เพื่อให้ลวดลายที่ได้มีความคมชัด จากการทดสอบจะได้ลวดลายที่คมชัด เมื่อฉายแสง อัลตราไวโอเลตด้วยพลังงานประมาณ 3,700 mJ/cm² ขั้นตอนต่อไปเป็นการล้างฟิล์มไวแสง โดยใช้ น้ำยาล้างฟิล์มผสมอัตรา 1 ส่วนต่อน้ำ 2 ส่วน ใช้เวลาล้างสารไวแสงประมาณ 20-30 นาที จาก ขั้นตอนนี้เนื่องจากใช้สารไวแสงชนิดบวกดังนั้นบริเวณที่มีหมึกทึบแสงกั้นอยู่ จะมีสารไวแสงเป็น แม่พิมพ์อยู่ ส่วนบริเวณที่ถูกฉายแสง เนื้อของสารไวแสงออกจนพื้นผิวโลหะสะอาด จึงล้างด้วยน้ำดีไอ และเป่าให้แห้ง อบที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 20 นาทีเพื่อให้สารไวแสงยึดเกาะกับฐานได้ดี ยิ่งขึ้น ถ้าไม่อบอาจทำให้สารไวแสงหลุดในขณะที่ชุบโลหะได้ หลังจากชิ้นงานเย็นลงจึงทำการชุบ โลหะเงินให้มีลวดลายตามแบบแม่พิมพ์ต่อไป ขั้นตอนการฉายแสงและการชุบโลหะสามารถแสดง ได้ดังรูปที่ 3.18 และตัวอย่างแม่พิมพ์คลังล้างสารไวแสงแสงแสงใต้ดังรูปที่ 3.17



รูปที่ 3.17 แม่พิมพ์สารไวแสงชนิดบวก

3.2.4 การชุบโลหะเงิน

้ขั้นตอนต่อไปเป็นการชุบโลหะลงในแม่พิมพ์ของสารไวแสง ซึ่งโลหะที่ใช้ต้องเป็น ้โลหะ ที่มีเลขอะตอมสูงจึงจะกั้นรังสีเอ็กซ์ได้ ในที่นี้ใช้โลหะเงิน เนื่องจากมีต้นทุนต่ำกว่าการใช้ ทองคำมาก และสามารถกั้นรังสีเอ็กซ์ได้คีเช่นเดียวกันเพียงแต่ต้องใช้ความหนามากกว่า ขั้นตอน ต่อไปนี้เป็นการเตรียมสารละลายเงินปริมาตร 500 มิลลิลิตร เริ่มจากเตรียมน้ำดีไอ ปริมาตร 300 ้มิลลิลิตร ลงในภาชนะที่ทำการกวนตลอดเวลา เติมโพแทสเซียมไซยาไนด์ น้ำหนัก 83.3 กรัม ์ที่ละน้อย และทำการกวนทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที จนกว่าโพแทสเซียมไซยาไนค์ ละลายจนหมค ้งากนั้น เติมโพแทสเซียมการ์บอเนต 7.5 กรัม ลงในสารละลายและกวนจนสารละลายเป็นเนื้อ เดียวกัน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที จากนั้นเติมซิลเวอร์ไซยาในค์ 80% น้ำหนัก 22.5 กรัม ลงไป ้ทีละน้อย กวนจนสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน และกวนสารทิ้งไว้อีก 15 นาที เติมน้ำดีไอเพิ่มลงใน สารละลายจนมีปริมาตร 500 มิลลิลิตร เติมผงคาร์บอน (Granular carbon) น้ำหนัก 1 กรัมลงไป แล้วกวนสารละลายต่อไปเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นจึงหยุดการกวนสาร นำสารละลายที่ได้ลง ้งากเครื่องกวนสาร ปีคฝาให้สนิท ปล่อยให้สารเคมีทำปฏิกิริยากันอย่างน้อย 12 ชั่วโมง จากนั้น นำสารละลายมากรองด้วยกระดาษกรอง 3-5 ครั้ง เพื่อกรองเอาผงการ์บอนและฝุ่นผงในสารละลาย ออก ขั้นตอนต่อไปทำความสะอาคสารละลายค้วยการกรองด้วยไฟฟ้า โคยนำสารละลายมาชุบด้วย ้ไฟฟ้า ใช้โลหะตะแกรง ไทเทเนียมชุบพลาทินัม (Platinized titanium) เป็นขั้วบวก (Anode) และใช้ Stainless steel เป็นขั้วลบ (Cathode) ป้อนแรงคันคงที่ 1.5 โวลท์ เป็นเวลา 15 นาที ขั้นตอนสุดท้าย เติมสาร Silver Glo make up ปริมาตร 3 มิลลิลิตร และสาร Silver Glo 3K TY ปริมาตร 0.65 มิลลิลิตร เพื่อทำให้ผิวของโลหะเงินหลังการชุบด้วยไฟฟ้าเรียบเนียน

หลังจากได้สารละลายที่จะใช้สำหรับการชุบเงินแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการชุบเงิน ด้วยไฟฟ้า ใช้โลหะไทเทเนียมชุบพลาทินัม เป็นขั้วบวก (Anode) และให้ชิ้นงานเป็นขั้วลบ (Cathode) ต่อขั้วไฟฟ้าโดยจะต่อสายไฟเข้ากับแผ่นใสบริเวณที่เคลือบโลหะ โดยชิ้นงานตัวอย่างนี้ มีพื้นที่ประมาณ 1 ตารางเซนติเมตร ใช้กระแสประมาณ 28 mA ใช้เวลาชุบประมาณ30 นาที โลหะเงินจึงล้นแม่พิมพ์พอดี และมีความเรียบ โดยได้ความหนาประมาณ 35 µm สามารถใช้เป็น หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์สำหรับสร้างแม่พิมพ์สารไวแสง SU-8 ได้หนาประมาณ 400 µm หลังจาก ชุบโลหะเงินจนเต็มแล้วถ้าใช้สารไวแสงชนิดบวก AZ4620 จะมีข้อดี คือ สามารถล้างออกได้โดย ใช้อะซิโตน ซึ่งหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์หลังการชุบเงิน และล้างสารไวแสงออก สามารถแสดงได้ ดังรูปที่ 3.19 และ 3.20



แผ่นใสเคลือบโลหะ Ti/Ag และAZ4620



ฉายแสงผ่านหน้ากากลวดลายทึบแสง



ล้างสารไวแสงให้เกิดลวดลาย



ชุบเงินจนเต็มและล้างสารไวแสง ออกด้วยอะซิโตน

รูปที่ 3.18 กระบวนการสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์



รูปที่ 3.19 แม่พิมพ์สารไวแสงที่ชุบเงินจนเต็มแล้ว



รูปที่ 3.20 หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์หลังการล้างแม่พิมพ์สารไวแสง AZ4620 ออกแล้ว



รูปที่ 3.21 หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์

3.3 การสร้างหน้ากากโลหะ

เมื่อได้หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ซึ่งใช้เงินเป็นวัสดุกั้นรังสีเอ็กซ์แล้ว ขั้นดอนต่อไป เป็นการนำ หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ไปใช้สร้างแม่พิมพ์พอลิเมอร์หนา เพื่อใช้ในการสร้างหน้ากากแบบแผ่นโลหะ โดยการชุบด้วยไฟฟ้า ซึ่งเหตุที่จำเป็นต้องสร้างหน้ากากโลหะนี้ เนื่องจากโครงสร้างที่ออกแบบไว้ ด้องมีโลหะทับด้านบนของชั้นไดอิเล็กทริก เพื่อเป็นแผ่นตัวนำสำหรับสร้างด้วตรวจรู้กวามชื้นแบบ ตัวเก็บประจุ โดยขั้นตอนแรกด้องเตรียมส่วนฐานของสารไวแสงหนาก่อน โดยเริ่มจากการตัดแผ่น กราไฟต์ให้มีขนาดประมาณ 1x1 นิ้วทำความสะอาดโดยกลิ่นอัลตราโซนิกในน้ำดีไอ ประมาณ 2-3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 10 นาที ทำความสะอาดด้วยกลิ่นอัลตราโซนิกอีกครั้งในเมทานอล เป็น เวลา 15 นาที และทำความสะอาดโดยกลิ่นอัลตราโซนิกในน้ำดีไออีกครั้ง ประมาณ 10 นาที เป่าด้วย แก๊สไนโตรเจน และอบที่อุณหภูมิ 150 องสาเซลเซียส 30 นาที เนื่องจากแผ่น กราไฟต์มีความบาง มาก จึงอาจแตกหักหรือโด้งงอได้ในขั้นตอนการหมุนเกลือบ หรืออบสารไวแสง อาจเพิ่มความ แข้งแรงโดยนำกระจกสไลด์หมุนเกลือบสารไวแสง AZ1512 ด้วยกวามเร็ว 1,500 รอบต่อนาที และ นำแผ่นกราไฟต์ติดทับลงไป อบให้แห้งด้วยอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 30 นาที ขั้นตอนต่อไปเป็น การเกลือบสารไวแสงชนิดหนา นำแผ่นกราไฟต์หมุนเกลือบสารไวแสง SU-8 2150 ด้วย ความเร็ว 1,750 รอบต่อนาที และอบด้วยอุณหภูมิ 65 องสาเซลเซียส 30 นาที และต่อด้วย 95 องสาเซลเซียส 4 ชั่วโมงขั้นตอนนี้จะได้กวามหนาของสารไวแสงประมาณ 350 µm จากนั้น นำไป ฉายรังสีเอ็กซ์ผ่านหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 3.2 สารไวแสง SU-8 ที่ใช้ เป็น สารไวแสงชนิดลบ ดังนั้นส่วนที่ถูกฉายด้วยแสงจะแข็งตัว การฉายรังสีเอ็กซ์ในขั้นตอนนี้ สามารถ ใช้การคำนวณพลังงานที่สารไวแสงได้รับ โดยใช้โปรแกรม XmaskSim ที่ได้สร้างขึ้นใน หัวข้อ 3.1 จากการทดลองพบว่าพลังงานที่สารไวแสงส่วนล่างสุดได้รับ ที่ทำให้โครงสร้างแข็งตัว และยึดกับฐานได้ดี (สำหรับฐานกราไฟต์) คือ ที่ประมาณ 5,500-6,000 mJ/cm³ หลังฉายแสงแล้วจึง อบที่อุณหภูมิ 95 องสาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ขั้นตอนนี้เป็นการสร้างพันธะภายให้กับ พอลิเมอร์ สามารถสังเกตเห็นลวดลายที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน หลังจากสารไวแสงเย็นตัวลงแล้ว จึงล้าง สารไวแสงโดยใช้น้ำยา SU-8 ดีเวลอปเปอร์ สารไวแสงส่วนที่ไม่ถูกฉายด้วยรังสีเอ็กซ์จะถูกล้าง ออกไป เหลือเป็นแม่พิมพ์พอลิเมอร์บนฐานกราไฟต์ ซึ่งจะทำการชุบโลหะนิกเกิลงบนกราไฟต์นี้ โดยใช้อัตรากระแสประมาณ 20 mA/cm² การชุบโลหะนิกเกิล จะชุบจนล้นแม่พิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่า โลหะได้ถูกเติมจนเต็มแม่พิมพ์ทุกส่วน หลังจากนั้นจึงขัดโลหะนิกเกิลให้เรียบและขัดส่วนฐาน กราไฟต์ทิ้งไป จะได้หน้ากากโลหะซึ่งยังเหลือสารไวแสงติดอยู่ในช่องว่าง สามารถกำจัดกิ้งได้โดย การใช้พลาสมาของ O₂ ผสมกับแก๊ส CF4 โดยใช้กำลัง 200 W เป็นเวลาประมาณ 50 ชั่วโมง จะได้ หน้ากากโลหะซึ่งมีลวดลายเป็นช่องว่าง ขั้นตอนการสร้างหน้ากากโลหะนี้แสดงได้ดังรูป ที่ 3.22 และ 3.23

หลังจากที่ได้หน้ากากโลหะนิกเกิลแล้ว ขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นส่วนของการสร้างตัว ตรวจรู้ความชื้น โดยใช้หน้ากากโลหะ ซึ่งสามารถใช้เป็นหน้ากากสำหรับกระบวนการลิโธกราฟฟี ด้วยรังสีเอ็กซ์ หรือรังสีอัลตราไวโอเลตได้ ซึ่งลวดลายของหน้ากากโลหะจะเป็นลวดลายของตัว ตรวจรู้ที่ต้องการออกแบบสร้าง การออกแบบตัวตรวจรู้ เพื่อให้ได้โครงสร้างที่ตอบสนอง ต่อความชื้นเร็ว จำเป็นต้องมีการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อจำลองผลหาโครงสร้าง ที่เหมาะสมที่จะสร้างเป็นตัวตรวจรู้ความชื้นความเร็วสูง โดยใช้หลักการแพร่ของสารในวัสดุ ที่เรียกว่า Fick's law โดยรายละเอียดจะได้กล่าวในบทต่อไป



รูปที่ 3.22 ขั้นตอนการสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์แบบโลหะ



รูปที่ 3.22 ขั้นตอนการสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์แบบโลหะ (ต่อ)



รูปที่ 3.23 หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์โลหะหนา 250 µm ที่สร้างเสร็จแล้ว

บทที่ 4

ทฤษฎีการคำนวณสำหรับตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุ

ตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างในงานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นที่ให้ ผลตอบสนองทางเวลาเร็ว โดยจะใช้กระบวนการลิโชกราฟฟิด้วยรังสีเอ็กซ์ ในการสร้างเพื่อให้ ตัวตรวจรู้กวามชื้นมีขนาดเล็กสามารถบรรจุลงบนตัวถังวงจรรวมได้ นอกจากนี้ตัวตรวจรู้ความชื้น ยังต้องมีความไวสูงเพื่อให้ง่ายในการวัดผล และช่วยลดต้นทุนในการสร้างวงจรที่ซับซ้อน จึงต้องมี การสร้างแบบจึงลองทางคณิตศาสตร์ของตัวตรวจรู้กวามชื้น ที่มีโครงสร้างต่างกัน เพื่อให้สามารถ ทำนายกุณลักษณะของตัวตรวจรู้กวามชื้นที่จะสร้างขึ้น และหาโครงสร้างที่เหมาะจะสร้างเป็น ตัวตรวจรู้ความชื้นความเร็วสูง ด้วยการเปรียบเทียบผลการจำลองผลตอบสนองด้วยโปรแกรม กอมพิวเตอร์ แล้วจึงพิจรณากวามเหมาะสมของโครงสร้าง และสรุปโครงสร้างที่จะนำไปสร้างเป็น ตัวตรวจรู้กวามชื้นค่อไป

4.1 ความชื้น

ความชื้น (humidity) หมายถึง ปริมาณน้ำที่ปรากฎอยู่ในสถานะของแก๊สในอากาศ หรือใน แก๊สชนิดอื่น รูปแบบการ วัดความชื้นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity) ความชื้นสัมบูรณ์ (absolute humidity) และอุณหภูมิจุดน้ำค้าง (dew point temperature) โดยความชื้นสัมพัทธ์ เป็นหน่วยการ วัดที่นิยมใช้กันมากที่สุด ความหมายของความชื้นสัมพัทธ์ คือ อัตราส่วนของความดันใอน้ำขณะนั้น ต่อความดันไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิเฉพาะ โดยทั่วไปแสดง ในรูปของเปอร์เซ็นต์ดังสมการที่ (4-1)

$$RH(\%) = \frac{P_w}{P_s} \times 100 \tag{4-1}$$

โดยที่ *RH*(%) คือ ความชื้นสัมพัทธ์ (%) *P*_w คือ ความดันไอน้ำบางส่วน (mbar) *P*_s คือ ความดันไอน้ำอิ่มตัว (mbar) ความชื้นสัมบูรณ์ (absolute humidity) คือ อัตราส่วนมวลของไอน้ำต่อปริมาตรของอากาศ หรือแก๊ส อาจเปรียบได้ว่าเป็นความหนาแน่น หรือความเข้มข้นของไอน้ำในอากาศ (Suzuki, 2004) แสดงความสัมพันธ์ได้ดังสมการที่ (4-2)

$$d_w = \frac{M_w}{V_w + V_g} = \frac{M_w}{V}$$
(4-2)

โดยที่R d_w คือ ความชื้นสัมบูรณ์ (kg/m^3)

M_w คือ มวลของไอน้ำ (kg)

V_w คือ ปริมาตรของไอน้ำ (m³)

 V_g คือ ปริมาตรของอากาศแห้ง (m^3)

V คือ ปริมาตรของอากาศแห้งและ ไอน้ำรวมกัน (m³)

อุณหภูมิจุดน้ำด้าง (dew point temperature) คือ อุณหภูมิซึ่งความคันไอน้ำจริงในอากาศ หรือแก๊ส มีค่าเท่ากับความคันไอน้ำอิ่มตัว ณ อุณหภูมินี้ ซึ่งความชื้นสัมพัทธ์จะมีค่าเป็น 100% และ ไอน้ำเริ่มเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ อากาศ หรือ แก๊สจะไม่สามารถเก็บกักปริมาณไอน้ำ ได้มากไปกว่านี้ ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิต่ำลงกว่าจุดนี้ ความคันไอน้ำอิ่มตัวก็จะมีค่าลดลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ความคันไอน้ำจริงยังคงเท่าเดิม ส่งผลให้ความคันไอน้ำอิ่มตัวก็จะมีค่าลดลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ความคันไอน้ำจริงยังคงเท่าเดิม ส่งผลให้ความคันไอน้ำจริงในอากาศมีค่าเกินกว่าค่า ความคันไอน้ำอิ่มตัว และเกิดการควบแน่นของไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำมากขึ้นตามลำคับ เหมือนกับ ปรากฏการที่มีหยดน้ำเกาะอยู่รอบ ๆ แก้ว ที่มีน้ำแข็งใส่อยู่ สามารถอธิบายได้ว่าอุณหภูมิของน้ำ ในแก้วมีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิจุดน้ำก้างของอากาศในขณะนั้น จึงทำให้เกิดการควบแน่นและกลายเป็น หยดน้ำที่ข้างแก้วและอุณหภูมิจุดน้ำค้างจะแปรเปลี่ยนตามค่าความคันในขณะนั้นด้วย

4.2 ทฤษฎีและการคำนวณ

การสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นจำเป็นต้องศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาสร้างแบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ โดยที่ค่าความจุในสถานะอยู่ตัวสามารถคำนวณได้ตามความสัมพันธ์ $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A / d$ โดยที่ ε_0 คือ สภาพยอมสัมพัทธ์ของสุญญากาศ ε_r คือ ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของสาร d คือ ระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำ และ A คือ พื้นที่แผ่นตัวนำ แต่ผลตอบสนองทางเวลานั้นต้องใช้ สมการการแพร่ของสารซึ่งเรียกว่า Fick's law (Carnk ;1975) โดยจะอยู่ในรูปของสมการอนุพันธ์ สามารถหาผลเฉลย โดยใช้วิธีผลเฉลยสมการอนุพันธ์แบบอนุกรม และนำผลเฉลยที่ได้ไปจำลองผล โดยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษา Scilab ซึ่งจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงการตอบสนอง ทางเวลาของตัวตรวจรู้ความชื้นทั้งสี่แบบ ซึ่งสมการของแต่ละแบบมีดังนี้

4.2.1 โครงสร้างแบบขั้วไฟฟ้ามีรูพรุน (Porous electrode)

โครงสร้างแบบขั้วไฟฟ้ามีรูพรุนเป็นโครงสร้างของตัวตรวจรู้ความชื้นชนิดเก็บประจุ มีถักษณะแผ่นโถหะขนานกัน โดยมีสารไดอิเล็กทริกไวความชื้นอยู่ระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสอง แผ่นโถหะตัวนำด้านบน จะมีถักษณะเป็นรูพรุน ความชื้นสามารถแพร่เข้าสู่ชั้นไดอิเล็กทริกได้ โดยตรง ซึ่งโครงสร้างนี้จะตัดมาจากโครงสร้างขนาดใหญ่ พื้นที่ในการแพร่ของความชื้นจากทาง ด้านข้างจึงมีน้อยมากเมื่อเทียบกับด้านบน จึงสามารถตัดผลของการแพร่ความชื้นจากทางด้านข้าง ได้ โครงสร้างนี้ มีความกว้าง a ยาว b และสูง L ดังรูปที่ 4.2 ซึ่งใช้สมการการแพร่ของสารแบบ หนึ่งมิติ ดังสมการที่ (4-3) เมื่อ M คือ ความเข้มข้นของความชื้นในสารไดอิเล็กทริกพอลิเมอร์ D คือ สัมประสิทธิ์การแพร่ของน้ำ ภายในพอลิเมอร์ กำหนดขอบเขตให้ M_s คือ ความเข้มข้นของความชื้น ที่ผิว กำหนดความเข้มข้นความชื้นภายในเนื้อสารเริ่มต้น M(x,0) เท่ากับ 0 และความชื้นที่ผิวที่เวลา ใด ๆ M(L,t) เท่ากับ M_s จะได้ผลเฉลยแบบอนุกรมของสมการอนุพันธ์ดังสมการที่ (4-4)



รูปที่ 4.1 ตัวตรวจรู้ความชื้นแบบฟิล์มบาง(Thin film humidity sensor)

$$M(x,t) = M_{S} + \frac{2}{p} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n} M_{S} \left(\cos(np) - 1 \right) \sin\left(\frac{np(x-L)}{2} L \right) e^{\left(\frac{-n^{2}p^{2}}{4} L^{2} D t \right)} \right]$$
(4-4)

้ค่าไดอิเล็กทริก*ะ*, จะเปลี่ยนแปรผันตรงกับกับค่าความชื้นที่ดูดซับไว้โดยสารไวความชื้น ซึ่งมี ความสัมพันธ์ดังสมการที่ (4-5)

$$\mathcal{E}_{r}\left(x,t\right) = uM\left(x,t\right) + v \tag{4-5}$$

โดยที่ v และ u เป็นก่ากงที่ขึ้นกับสารไวกวามชื้นโดยก่ากวามจุไฟฟ้าของทรงลูกบาศก์ (C) หาได้ จากการอินทิเกรตตามทิศทางการแพร่ L โดยใช้สมการที่ (4-4) และ (4-5) ดังนี้

$$C(t) = \int_{0}^{L} \varepsilon_{0} \varepsilon_{r}(x,t) \frac{bdx}{d} = \frac{\varepsilon_{0}b}{d} \left[(uM_{s} + v)L - \frac{8uM_{s}L}{\pi^{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\left(\frac{-(2n-1)^{2}\pi^{2}Dt}{4L^{2}}\right)}}{(2n-1)^{2}} \right]$$
(4-6)

โดยที่ _{E0} คือสภาพยอมสัมพัทธ์ของสุญญากาศ_E, คือค่าคงที่ใดอิเล็กทริกของสาร d คือระยะห่าง ระหว่างแผ่นตัวนำ และ b คือความกว้างของตัวเก็บประจุ เมื่อนำค่าความจุไฟฟ้า ณ เวลา t ใด ๆ เทียบกับค่าความจุไฟฟ้าที่สถานะอยู่ตัวจะได้

$$C_{norm} = \frac{C(t) - C_0}{C_{\infty} - C_0}$$
(4.7)

แทนค่าลงในสมการที่ (4-6) จะได้ค่าความจุไฟฟ้าที่เป็นฟังก์ชันของเวลา (C_{norm}) โดยทำให้เป็น หนึ่งหน่วยดังสมการที่ (4-8)

$$C_{norm}(t) = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - e^{\left[\frac{-(2n-1)^2 \pi^2 Dt}{4L^2}\right]}}{(2n-1)^2}}{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}}$$
(4.8)

4.2.2 โครงสร้างแบบทรงกระบอก (Cylindrical body)

การพัฒนาตัวตรวจรู้ให้มีความเร็วสูงขึ้น จำเป็นต้องมีการเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับ การแพร่ของความชื้น และในขณะเดียวกันด้องลดระยะทางในการแพร่ของความชื้น เพื่อให้ สารไวความชื้นเกิดการอิ่มตัวด้วยความชื้นเร็วที่สุด โครงสร้างที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้แก่ โครงสร้างแบบทรงกระบอก ดังรูปที่ 4.2 ซึ่งด้านบนและล่างจะเป็นแผ่นโลหะตัวนำ โดยความชื้น จะแพร่เข้าสู่โครงสร้างทางด้านข้างโดยรอบ โดยมีสมการอนุพันธ์ของการแพร่ของสารเข้าสู่ ปริมาตรทรงกระบอกดังสมการที่ (4-9)



รูปที่ 4.2 ตัวตรวจรู้ความชื้นแบบทรงกระบอก (Cylindrical humidity sensor)

$$\frac{\partial M(r,t)}{\partial t} = \frac{D}{r} \frac{\partial}{\partial t} \left(r \frac{\partial M(r,t)}{\partial r} \right)$$
(4-9)

กำหนดเงื่อนไขเริ่มต้น M(r,0) = 0 และเงื่อนไขขอบเขต $M(a,t) = M_s$ จะได้ ผลเฉลยของสมการดังสมการที่ (4-10) เมื่อ J_0 คือ ฟังก์ชันเบสเซลชนิดที่หนึ่งอันดับศูนย์ (Bessel function of the first kind of zero) J_1 คือ ฟังก์ชันเบสเซลชนิดที่หนึ่งอันดับหนึ่ง (Bessel function of the first kind of the first order) และ α_n คือ รากของ $J_0(a\alpha_n) = 0$

ค่าความจุไฟฟ้าของปริมาตรทรงกระบอก จะคำนวณ โดยการอิททิเกรตจาก จุดศูนย์กลางไปยังผิวของทรงกระบอก ตามสมการที่ (4-11) และจากสมการที่ (4-11) จัดสมการ ให้อยู่ในรูปอัตราส่วนต่อค่าความจุไฟฟ้าในสถานะอยู่ตัวตามสมการที่ (4-7) จะได้ก่าความจุไฟฟ้า ซึ่งเป็นฟังก์ชันของเวลา (*C_{norm.ev}*) ดังสมการที่ (4-12)

$$M(r,t) = M_{S} \left(1 - \frac{2}{a}\right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\left(-D\alpha_{n}^{2}t\right)} J_{0}\left(r\alpha_{n}\right)}{\alpha_{n} J_{1}\left(a\alpha_{n}\right)}$$
(4-10)

$$C_{cyl}(t) = \int_{0}^{a} \varepsilon_{0} \varepsilon_{r}(r,t) \frac{2\pi r dr}{d}$$
$$= \frac{2\pi \varepsilon_{0} a^{2}}{d} \left[0.5 (uM_{s} + v) - 2uM_{s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\left(-Dk_{n}^{2}t/a^{2}\right)}}{k_{n}^{2}} \right]$$
(4-11)

$$C_{Norm,cyl}(t) = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - e^{\left(-Dk_n^2 t/a^2\right)}}{k_n^2}}{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{k_n^2}}$$
(4-12)

เมื่อ

k, คือ รากของสมการเบสเซลชนิคที่หนึ่งอันคับศูนย์

a คือ รัศมีของทรงกระบอก

4.2.3 โครงสร้างแบบทรงลูกบาศก์ (Cube body)

โครงสร้างตัวตรวจรู้แบบทรงลูกบาศก์ เป็นโครงสร้างทรงลูกบาศก์ที่มีความกว้าง 2a และยาว 2b ความชื้นสามารถแพร่เข้าสู่โครงสร้างทั้งสี่ด้าน จึงต้องใช้การวิเคราะห์การแพร่ของ ความชื้นเข้าสู่โครงสร้างแบบสองมิติ ดังรูปที่ 4.3 จากโครงสร้างแบบทรงลูกบาศก์ ความชื้น สามารถแพร่เข้าสู่โครงสร้างได้ทั้งสี่ทิศทาง กำหนดให้ความเข้มข้นความ ชื้นทั้งสี่ด้านมีค่าเท่ากัน ดังนั้นจะได้สมการการแพร่ในสองมิติดังสมการที่ (4.13)

$$\frac{\partial M(x, y, t)}{\partial t} = D\left(\frac{\partial^2 M(x, y, t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 M(x, y, t)}{\partial y^2}\right)$$
(4-13)



รูปที่ 4.3 ตัวตรวจรู้ความชื้นแบบทรงลูกบาศก์

กำหนดเงื่อนไขเริ่มต้น โดยให้กวามชื้นที่จุดใด ๆ ภายในทรงลูกบาศก์เป็นศูนย์ และกวามเข้มข้น ของกวามชื้นที่ผิวมีก่าเป็น M_s จะได้ผลเฉลยดังสมการที่ (4-14)

กำหนดให้
$$M(x, y, 0) = 0$$

 $M(x, y, t) = M_s$

$$M(x, y, t) = M_{s} - M_{s} \frac{16}{\pi^{2}} \left[\sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{m+n} e^{(-\alpha_{m,n}, t)}}{(2n+1)(2m+1)} \cos\left(\frac{(2m+1)\pi x}{2a}\right) \cos\left(\frac{(2n+1)\pi y}{2b}\right) \right]$$
(4-14)

$$u \vec{1} = \frac{D\pi^2}{4} \left[\frac{(2m+1)^2}{a^2} + \frac{(2n+1)^2}{b^2} \right]$$

นำสมการที่ (4-14) แทนค่าลงในแบบจำลองของค่าความจุไฟฟ้า ตามสมการที่ (4-15) สามารถ หาผลเฉลยของสมการได้ตามสมการที่ (4-16) จากนั้นจัดรูปสมการที่ (4-16) ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน ต่อค่าความจุไฟฟ้าในสถานะอยู่ตัว จะได้ผลเฉลยค่าความจุไฟฟ้าของทรงลูกบาศก์ที่เป็นฟังก์ชัน ของเวลา (*C_{no}*,) ดังสมการที่ (4-17)

$$C = \frac{4\varepsilon_0 k_2 ab}{d} + \frac{\varepsilon_0 k_1}{d} \int_{-b-a}^{b} \int_{-a}^{a} M(x, y, t) dx dy$$
(4-15)

$$C = \frac{4\varepsilon_0 k_2 ab}{d} + \frac{\varepsilon_0 k_1}{d} M_S$$

- $M_S \frac{16}{\pi^2} \sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} \frac{(-1)^{m+n} e^{(-\alpha_{m,n},t)}}{(2n+1)(2m+1)} \int_{-b-a}^{b} \int_{-a}^{a} \cos\left(\frac{(2m+1)\pi x}{2a}\right) \cos\left(\frac{(2n+1)\pi y}{2b}\right) dxdy$
(4-16)

$$C_{nor} = \frac{\sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} \frac{(-1)^{m+n}}{(2n+1)(2m+1)} \int_{-b}^{b} \int_{-a}^{a} \cos\left(\frac{(2m+1)\pi x}{2a}\right) \cos\left(\frac{(2n+1)\pi y}{2b}\right) dxdy}{-\sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} \frac{(-1)^{m+n} e^{(-\alpha_{m,n},t)}}{(2n+1)(2m+1)} \int_{-b}^{b} \int_{-a}^{a} \cos\left(\frac{(2m+1)\pi x}{2a}\right) \cos\left(\frac{(2n+1)\pi y}{2b}\right) dxdy}{\cos\left(\frac{(2n+1)\pi y}{2b}\right) dxdy}$$
(4-17)
$$\frac{\sum_{0}^{\infty} \sum_{0}^{\infty} \frac{(-1)^{m+n}}{(2n+1)(2m+1)} \int_{-b-a}^{b} \cos\left(\frac{(2m+1)\pi x}{2a}\right) \cos\left(\frac{(2n+1)\pi y}{2b}\right) dxdy}{\cos\left(\frac{(2n+1)\pi y}{2b}\right) dxdy}$$

4.2.4 แบบซื่อิเล็กโทรดที่มีความยาวมากกว่าความกว้างมาก

การวิเคราะห์การแพร่ของตัวตรวจรู้ความชื้นแบบซี่ยาว โดยที่มีความยาวมากกว่า ความกว้างมาก ๆ ดังรูปที่ 4.4 กำหนดให้ความชื้นที่แพร่เข้าสู่ด้านหน้า และด้านหลังน้อยมาก เมื่อ เทียบกับด้านข้างจนสามารถละทิ้งได้ ซึ่งจะใช้การวิเคราะห์การแพร่ในหนึ่งมิติ โดยที่ความชื้น สามารถแพร่เข้าสู่โครงสร้างจากทั้งสองด้าน ระยะทางของการแพร่มีก่าเท่ากับขนาดของความ กว้าง b ซึ่งจะได้สมการผลการตอบสนองทางเวลาของก่าความจุไฟฟ้าที่เป็นฟังก์ชันของเวลา (*C_{norm.long}*) ดังสมการที่ (4-18)



รูปที่ 4.4 ตัวตรวจรู้ความชื้นแบบซี่ยาว

$$C_{norm,long}\left(t\right) = 1 - \frac{4}{\pi} \sum_{j=0}^{N} \frac{1}{(2j+1)} \sin \frac{(2j+1)\pi x}{h} e^{\frac{-(2j+1)^2 \pi^2 D t}{h^2}}$$
(4-18)

นอกจากนี้ การหาผลตอบสนองต่อความชื้นของตัวตรวจรู้ความชื้น ซึ่งใช้ หลักการแพร่ของ Fick's law สามารถหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์ย่อยได้ โดยใช้วิธีการประมาณ ค่าด้วยระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่องจำกัด (Finite difference) โดยใช้วิธีการของ Crank-Nicloson โดยมี การถู่เข้าแบบกำลังสอง และมีความแม่นยำกว่าแบบอื่น ๆ เนื่องจากใช้การประมาณค่าที่จุดกึ่งกลาง ระหว่างจุดข้อมูล มีรายละเอียดการคำนวนโดยเริ่มต้นจากสมการการแพร่ใน 1 มิติ ดังสมการที่ (4-19) ทำการประมาณก่าอนุพันธ์ของก่าความเข้มข้นความชื้นเทียบกับเวลาได้ดังสมการที่ (4-20)

$$\frac{\partial M}{\partial t} = D \frac{\partial^2 M}{\partial x^2} \tag{4-19}$$

$$\frac{\partial M}{\partial t} \cong \frac{M_i^{l+1} - M_i^l}{\Delta t} \tag{4-20}$$

$$\frac{\partial^2 M}{\partial x^2} \cong \frac{1}{2} \left[\frac{M_i^{l+1} - 2M_i^l + M_{i-1}^l}{(\Delta x)^2} + \frac{M_{i+1}^{l+1} - 2M_i^{l+1} + M_{i-1}^{l+1}}{(\Delta x)^2} \right]$$
(4-21)

แทนค่าสมการที่ (4-20) และ (4-21) ลงในสมการที่ (4-19) จะได้ดังสมการที่ (4-22) สำหรับจุดใด ๆ ส่วนสมการที่ (4-23) และ (4-24) ใช้สำหรับจุดแรก และจุดสุดท้ายของกำตอบ ตามลำดับ

$$-\lambda M_{i-1}^{l+1} + 2(1+\lambda)M_i^{l+1} - \lambda M_{i+1}^{l+1} = \lambda M_{i-1}^l + 2(1-\lambda)M_i^l + \lambda M_{i+1}^l$$
(4-22)

$$2(1+\lambda)M_1^{l+1} - \lambda M_2^{l+1} = \lambda f_0(t^l) + 2(1-\lambda)M_1^l + \lambda f_0(t^{l+1})$$
(4-23)

$$-\lambda M_{i-1}^{l+1} + 2(1+\lambda)M_m^{l+1} = \lambda f_{m+1}(t^l) + 2(1-\lambda)M_m^l + \lambda M_{m-1}^l + \lambda f_{m+1}(t^{l+1})$$
(4-24)

$$\lambda = k\Delta t / \left(\Delta x\right)^2 \tag{4-25}$$



รูปที่ 4.5 ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่องจำกัด โดยใช้วิธี Crank-Nicloson

เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาของแต่ละโครงสร้างจะกำหนดค่า ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันโดยให้ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของไอน้ำในสารไดอิเล็กทริก (D) เท่ากับ 2x10⁻¹²m²/s ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของพอลิอิไมด์ และให้ความหนาของฟิล์มเป็น 2 µm และขนาดของทรงลูกบาศก์ กว้างและยาว 10 µm เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเป็น 10 µm และ แบบตัวเก็บประจุซี่ยาวให้มีความยาว L และซี่กว้าง 10 µm โดยจะเปรียบเทียบโครงสร้างสามแบบ แรกก่อน ซึ่งได้ผลดังรูปที่ 4.6

จากรูปที่ 4.6 จะเห็นว่าแบบความชื้นแพร่เข้าสู่ด้านบน จะมีผลตอบสนองทางเวลา เร็วที่สุด เนื่องจากฟิล์มมีความบาง จึงมีระยะทางในการแพร่สั้นกว่าแบบอื่น ทำให้ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ในความเป็นจริงไม่สามารถสร้างตัวเก็บประจุที่แผ่นตัวนำมีรูพรุนที่ความชื้นสามารถแพร่เข้าได้ เสมือนว่าไม่มีแผ่นโลหะกั้น ดังนั้นโครงสร้างนี้จึงไม่สามารถสร้างได้ เมื่อพิจารณาโครงสร้างแบบ ทรงกระบอก และแบบลูกบาศก์จะพบว่าให้ผลตอบสนองใกล้เคียงกันโดยแบบทรงกระบอกจะ ให้ผลตอบสนองเร็วกว่าเล็กน้อย เนื่องจากความชื้นสามารถแพร่เข้าได้โดยรอบ ซึ่งแบบทรง ลูกบาศก์ความชื้นสามารถแพร่เข้าสู่โครงสร้างได้โดยรอบเช่นกัน แต่จะมีบริเวณมุมที่ทำให้ ระยะทางในการแพร่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ช้ากว่าเล็กน้อย ต่อไปนำโครงสร้างแบบแท่งตัวนำยาว เปรียบเทียบกับแบบลูกบาศก์และแบบทรงกระบอกจะได้ดังรูปที่ 4.7

จากรูปที่ 4.7 โครงสร้างแบบทรงกระบอกจะให้ผลการตอบสนองทางเวลาที่เร็วที่สุด ส่วนโครงสร้างแบบทรงลูกบาศก์จะช้ากว่าเล็กน้อย และโครงสร้างแบบซี่ตัวนำยาวจะช้ากว่า ทั้งสองแบบ เพราะไม่คิดผลการแพร่จากด้านหน้าและด้านหลัง แต่ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่สามารถ สร้างได้ง่ายกว่า เนื่องจากไม่ต้องเชื่อมต่อซื่อิเล็กโทรดในภายหลัง และสามารถออกแบบสร้างทั้ง ลายของชั้นไดอิเล็กทริก และซี่ตัวนำได้ในคราวเดียวโดยใช้หน้ากากตัวเดียวกัน นอกจากนี้ถ้า ออกแบบให้ซี่ตัวนำมีความยาวมาก ๆ ก็จะสามารถเพิ่มความไวของตัวตรวจรู้ความชื้นได้โดยไม่มี ผลต่อความเร็ว โดยผลการตอบสนองทางเวลานั้นจะเป็นฟังก์ชันของขนาดของซี่ตัวนำยกกำลังสอง ถ้าใช้กระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์ สร้างขนาดความกว้างของซี่ตัวนำให้ได้เล็กลง จะสามารถสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นที่มีผลการตอบสนองที่เร็วมากขึ้นซึ่งสามารถแสดงได้ ดังรูปที่ 4.8



รูปที่ 4.6 เปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาของโครงสร้างขั้วไฟฟ้ารูพรุน สารไวความชื้น แบบทรงกระบอก และแบบสารไวความชื้นแบบทรงลูกบาศก์

เมื่อได้โครงสร้างที่เหมาะสมในการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้าง ตัวตรวจรู้ความชื้นด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ประกอบด้วยกระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสี อัลตราไวโอเลต กระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์ รวมไปถึงกระบวนการสร้างตัวตรวจรู้ ความชื้น รายละเอียดจะได้กล่าวต่อไปในบทที่ 5 เรื่อง กระบวนการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้น


รูปที่ 4.7 เปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาของโครงสร้างสารไวความชื้นเป็น ทรงกระบอก แบบทรงลูกบาศก์ และแบบอิเล็กโทรคซี่ยาว



รูปที่ 4.8 ผลของความกว้างของซี่สารไวความชื้นต่อการตอบสนองทางเวลา

บทที่ 5 กระบวนการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้น

ตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุที่ได้ออกแบบ และสร้างในงานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์ หลักเพื่อให้ได้ตัวตรวจรู้ความชื้นที่มีผลตอบสนองทางเวลาเร็ว โดยโครงสร้างที่ออกแบบเป็น โครงสร้างแบบซื่อิเล็กโทรด วางทับบนซึ่งองไดอิเล็กทริกดังรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 ตัวตรวจรู้ความชื้นแบบซื่อิเล็กโทรคตัวนำ วางบนชั้นไคอิเล็กทริกไวความชื้น

ความไวของตัวตรวจรู้ความชื้น สามารถเพิ่มได้โดยการการถดความหนาของชั้นฟิล์ม หรือ เพิ่มจำนวนซึ่ของตัวตรวจรู้ความชื้น จากการสร้างแบบจำถองทางกณิตศาสตร์ เพื่อหาผลตอบสนอง ทางเวลาของตัวตรวจรู้ความชื้น เวลาในการตอบสนองต่อความชื้นโครงสร้างแบบอิเล็กโทรดซี่ยาว จะแปรผันตรงกับขนาดความกว้างของซี่ยกกำลังสอง ถ้าสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นให้มีขนาดซี่ แกบถง จะได้ตัวตรวจรู้ความชื้นที่ให้ผลตอบสนองเร็วขึ้น กระบวนการสร้างตัวตรวจรู้จะใช้วิธีการ ลิโธกราฟฟิด้วยรังสีเอ็กซ์ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 3 ขั้นตอนการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้น ประกอบด้วยการออกแบบถวดลาย การสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ การสร้างหน้ากากโลหะ การฉายรังสีอัลตราไวโอเลต และเกลือบโลหะทับไดอิเล็กทริกไวความชื้น ซึ่งแต่ละขั้นตอนมี รายละเอียดดังนี้

5.1 การออกแบบลวดลาย

การออกแบบลวดลาขของตัวตรวจรู้ความชิ้นแบบตัวเก็บประจุ จากโครงสร้างของ ดัวตรวจรู้ความชิ้นสำหรับโครงสร้างแบบอิเล็กโทรดซี่ยาวที่ได้ออกแบบไว้ ปัจจัยที่มีผลต่อ ความเร็ว คือ ความกว้างของซี่ไดอิเล็กทริก และตัวตรวจรู้ความชิ้นยังต้องมีความไว ซึ่งสามารถเพิ่ม ค่าความจุไฟฟ้าได้โดยการขนานซี่ตัวนำ และตั่าทุกซี่ต้องเชื่อมต่อถึงกันเพื่อให้สามารถนำไปใช้งาน ได้สะควกขึ้น การออกแบบโครงสร้างใช้โปรแกรม Layout Editor ซึ่งใช้สำหรับการออกแบบ ลวดลายจุลภาค โครงสร้างเป็นดังรูปที่ 5.2 โดยออกแบบให้ซี่มีความกว้าง 40 และ 60 μm เชื่อมต่อ กันด้วยแถบกลางกว้างเท่ากับความกว้างของซี่ โดยแบ่งเป็นสามชุด ทุกชุดเชื่อมต่อถึงกัน และมี จุดต่อสาย (Bonding pad) จำนวนสองจุดสามารถใช้ได้ทั้งสองจุดเพื่อป้องกันกรณีที่เกิดความ เสียหายกับจุดใดจุดหนึ่ง พื้นที่ทั้งหมดที่ทำให้เกิดความจุไฟฟ้าเท่ากับ 1.672 ตารางมิลลิเมตร สำหรับขั้วอิเล็กโทรดอีกขั้วหนึ่ง เป็นแผ่นกราวน์ที่เคลือบตลอดฐานรอง เมื่อใช้ค่าสภาพขอม สุญญากาส (*e*₀) เท่ากับ 8.85 pF/m หากชั้นฟิล์มสารไวความชิ้นหนา 2 μm และค่าไดอิเล็กทริกของ สารไวความชื้น (*e*_r) เท่ากับ 4 จะได้ก่าความจุไฟฟ้าของตัวตรวจรู้ความชิ้นที่ออกแบบตาม ความสัมพันธ์ *C* = *e*₀*e*,*A*/*d* เท่ากับ 29.6 pF หลังจากออกแบบฉวดลายตัวตรวจรู้ความชิ้นแล้ว จึงพิมพ์ลวดลายบนฟิล์มใส ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ความละเอียด 3,600 จุดต่อนิ้ว ลวดลายทึบแสงนี้ จะนำไปใช้สำหรับการสร้างหน้ากากกั้นรงสีเอ็กซ์ โดยใช้รังสีอักตราไวโอเลตต่อไป



รูปที่ 5.2 ลวดลายตัวตรวจรู้ความชื้นที่ออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Layout Editor

5.2 การสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ่

ลวดลายทึบแสงบนฟิล์มใสที่ได้ออกแบบไว้ เมื่อสร้างจริงจะมีขนาด 35 μm และ 51 μm สำหรับลวดลาย 40 μm และ 60 μm ตามลำดับซึ่งเกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องจากลวดลาย มีขนาดเล็กเข้าใกล้ขีดจำกัดความสามารถของเครื่องพิมพ์ ขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างหน้ากาก กั้นรังสีเอ็กซ์ โดยใช้โลหะเงินเป็นวัสดุกั้นรังสี รายละเอียดการสร้างได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3 หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ที่สร้างขึ้นจากลวดลายที่ออกแบบเป็นดังแสดงในรูปที่ 5.3-5.4 โดยเงินมีความ หนา 35 μm เป็นวัสดุกั้นรังสีเอ็กซ์ แม่พิมพ์ SU-8 ที่ได้จากกระบวนการลิโธกราฟฟี จะถูกใช้เป็น แม่พิมพ์ในการสร้างหน้ากากโลหะความหนา 250-300 μm ต่อไป



รูปที่ 5.3 หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์บนแผ่นใสเคลือบโลหะ



รูปที่ 5.4 หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์สร้างด้วยโลหะเงินหนา 40 μm

เมื่อได้หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ขั้นตอนต่อไป คือ การนำหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ที่ได้ ไปใช้ สร้างแม่พิมพ์สารไวแสงชนิดหนา โดยใช้สารไวแสงหนา 350 µm ปริมาณพลังงานของการฉาย รังสีเอ็กซ์คำนวณได้จากโปรแกรม XmaskSim ซึ่งมีรายละเอียดในบทที่ 3 จำนวนชั้นตัวกรองที่มีใน ระบบลำเลียงแสง BL-6 ได้แก่ ผลึกเบอริลเลียม 100 µm แผ่นพอลิอิไมด์หนา 100 µm แผ่น อลูมิเนียมหนา 16 µm และแผ่นใสฐานรองหน้ากากหนา 100 µm รายละเอียดการฉายรังสีเอ็กซ์ เป็นดังตารางที่ 5.1 ซึ่งประกอบไปด้วย ค่ากระแสในวงแหวนกักเก็บอิเล็กตรอน I(mA) พลังงาน ที่ได้รับที่บริเวณสารไวแสงส่วนบนด้านมืด (Top dark) และด้านสว่าง (Top bright) พลังงานที่ได้รับ ที่บริเวณสารไวแสงส่วนอ่างด้านสว่าง (Bottom bright) พลังงานส่วนล่างด้านมืด (Bottom dark) ค่าอัตราส่วนพลังงานส่วนบนต่อส่วนล่าง (Top to bottom ratio) และค่าเปอร์เซนต์ความคมชัด ส่วนล่าง (% Contrast) โดยรายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3

Current (mA)	Top bright (mJ/cm ³)	Accumulate top bright (mJ/cm ³)	Bottom bright (mJ/cm ³)	Accumulate bottom bright (mJ/cm ³)	Top dark (mJ/cm ³)	Accumulate top dark (mJ/cm ³)	Accumulate bottom dark (mJ/cm ³)	Contrast (%)
88.19	1,726.36	1,726.36	287.39	287.39	0.61	0.61	0.48	99.67
88.09	1,724.40	3,450.76	287.06	574.45	0.61	1.21	0.96	99.67
88.04	1,723.42	5,174.19	286.90	861.35	0.61	1.82	1.45	99.67
87.96	1,721.86	6,896.05	286.64	1,147.99	0.61	2.43	1.93	99.67
87.93	1,721.27	8,617.32	286.54	1,434.54	0.61	3.03	2.41	99.67
87.83	1,719.31	10,336.63	286.22	1,720.75	0.61	3.64	2.89	99.67
87.73	1,717.36	12,053.99	285.89	2,006.64	0.60	4.24	3.37	99.67
87.68	1,716.38	13,770.36	285.73	2,292.37	0.60	4.84	3.85	99.67
87.59	1,714.62	15,484.98	285.43	2,577.80	0.60	5.45	4.33	99.67
87.56	1,714.03	17,199.01	285.34	2,863.14	0.60	6.05	4.8	99.67
87.47	1,712.27	18,911.27	285.04	3,148.18	0.60	6.65	5.28	99.67
87.33	1,709.53	20,620.80	284.59	3,432.77	0.60	7.25	5.76	99.67
87.22	1,707.37	22,328.17	284.23	3,717.00	0.60	7.85	6.24	99.67
87.17	1,706.39	24034.56	284.07	4,001.07	0.60	8.45	6.71	99.67
87.07	1,704.44	25,739.00	283.74	4,284.81	0.60	9.05	7.19	99.67
86.98	1,702.67	27441.67	283.45	4,568.25	0.60	9.65	7.66	99.67
86.95	1,702.09	29,143.76	283.35	4,851.60	0.60	10.25	8.14	99.67
86.85	1,700.13	30,843.89	283.02	5,134.62	0.60	10.85	8.62	99.67
86.75	1698.17	32542.06	282.70	5417.32	0.60	11.45	9.09	99.67
86.70	1697.19	34239.25	282.53	5699.85	0.60	12.04	9.56	99.67

ตารางที่ 5.1 ตัวอย่างข้อมูลการฉายรังสีเอ็กซ์เพื่อสร้างแม่พิมพ์สารไวแสงหนา 350 µm

ต้องการพลังงานสะสม 5,500 mJ/cm³

5.3 การสร้างหน้ากากโลหะ

การสร้างแม่พิมพ์สารไวแสงชนิดหนา สำหรับหน้ากากโลหะกั้นรังสีเอ็กซ์ มีรายละเอียดดัง ใด้กล่าวไปแล้วในบทที่ 3 รูปของแม่พิมพ์สารไวแสงแสดงได้ดังรูปที่ 5.5-5.7 หลังจากได้แม่พิมพ์ สารไวแสงชนิดหนาแล้วจึงเติมโลหะนิกเกิลลงในแม่พิมพ์ โดยการชุบด้วยไฟฟ้าจนล้นแม่พิมพ์ และส่วนที่เกินขึ้นมาจะถูกขัดทิ้งด้วยวิธีทางกล จากนั้นจึงขัดแผ่นกราไฟต์ทิ้ง จะได้หน้ากากโลหะ นิกเกิลแบบหนาดังรูปที่ 5.8-5.11 มีขนาดพื้นที่ 1 ตารางมิลลิเมตร



SU-8 ที่จะถูกสกัดทิ้งให้เป็นช่องว่างหลังใช้เป็นแม่พิมพ์ในการสร้างหน้ากากโลหะ

ช่องว่างสำหรับการเติมโลหะนิกเกิลโดยการชุบด้วยไฟฟ้าเพื่อสร้างเป็นแผ่นหน้ากากโลหะ

รูปที่ 5.5 แม่พิมพ์สารไวแสงหนาสำหรับใช้สร้างหน้ากากโลหะกั้นรังสีเอ็กซ์



รูปที่ 5.6 ภาพด้านบนของแม่พิมพ์สารไวแสงหนาสำหรับใช้สร้างหน้ากากโลหะกั้นรังสีเอ็กซ์



รูปที่ 5.7 ภาพด้านข้างแม่พิมพ์สารไวแสงหนาสำหรับใช้สร้างหน้ากากโลหะกั้นรังสีเอ็กซ์



ู้ ส่วนของลวคลายซึ่งเป็นช่องว่าง

รูปที่ 5.8 หน้ากากโลหะกั้นรังสีเอ็กซ์หนา 250 µm



รูปที่ 5.9 ภาพด้านบนของหน้ากาก โลหะกั้นรังสีเอ็กซ์หนา 250 µm



รูปที่ 5.10 ภาพขยายซึ่ของหน้ากากโลหะกั้นรังสีเอ็กซ์หนา 250 μm



รูปที่ 5.11 ภาพขยายด้ำนบนของหน้ากากโลหะหนา 250 μm

5.4 การสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุ

เนื่องจากความเร็วของตัวตรวจรู้ความชื้น ขึ้นกับความกว้างของซี่ ดังนั้นเมื่อสร้างหน้ากาก โลหะเสร็จแล้ว จึงนำไปใช้สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นให้มีลักษณะเป็นตัวเก็บประจุต่อไป ในขั้นตอน การสร้างมีทั้งการสร้างขั้วโลหะทับค้านบนโดยใช้วิธีการ lift-off รายละเอียดดังรูปที่ 5.13 ในวิธีการ นี้จะทำการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตผ่านหน้ากากโลหะ แล้วนำหน้ากากโลหะออก จากนั้นเคลือบ โลหะลงบนสารไวแสงทั้งหมด และทำการกำจัดโลหะที่อยู่บนสารไวแสงส่วนที่ไม่ถูกฉายแสง ด้วย การจุ่มในน้ำยาล้างฟิล์มไวแสง และใช้คลื่นเสียงอัลตราโซนิกช่วยให้โลหะส่วนนี้หอุดร่อนออก ตัวอย่างตัวตรวจรู้ความชื้นที่ได้จากกระบวนการ lift-off แสดงดังรูปที่ 5.13-5.14 วิธีการ lift-off นี้มี ข้อเสีย คือ ต้องใช้กลื่นอัลตราโซนิกในการกำจัดโลหะส่วนที่ไม่ด้องการออก ซึ่งในขั้นตอนนี้จะ ทำให้ชั้นของสารไวแสงที่ใช้เป็นไดอิเล็กทริกเกิดการหลุดร่อนทำให้ได้ค่าความจุไฟฟ้าที่ไม่ แน่นอน นอกจากนี้ ตัวตรวจรู้ความชื้นนี้จำเป็นด้องมีการต่อสายเพื่อประกอบเข้ากับตัวถังวงจรรวม ซึ่งในการต่อสายต้องการแผ่นโลหะที่หนาแต่วิธี lift–off ไม่สามารถกำจัดโลหะส่วนเกินที่หนา ได้ จึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้สร้างดัวตรวจรู้ความชื้น

้วิธีการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นที่จะสามารถนำไปใช้งานได้ ต้องสามารถเคลือบขั้วโลหะ ต่อสายให้มีความหนามากๆได้ ทำให้โครงสร้างที่แข็งแรงไม่หลุดหรือร่อน ซึ่งการสร้างให้ได้ ้ลักษณะดังกล่าว ทำได้โดยใช้การระเหยเคลือบโลหะผ่านช่องว่างของหน้ากากโลหะ เนื่องจาก ้สามารถสร้างให้แผ่นตัวนำด้านบนมีความหนามาก ๆ ได้ เพราะ โลหะจะเคลือบเฉพาะบริเวณ ้ที่ต้องการ ทำให้ไม่จำเป็นต้องกำจัดโลหะในภายหลังอีก การสร้างโดยวิธีการนี้เริ่มจากการเคลือบ สารไวแสงบางถงบนฐานกระจก หรือซิลิกอนที่เคลือบโลหะ เพื่อเป็นแผ่นกราวค์ เนื่องจากต้องการ ้ชั้นฟิล์มบาง เพื่อให้ตัวตรวจรู้กวามชื้นมีกวามไวสูง จึงใช้ SU-8 2002 เป็นชั้นไวกวามชื้นโดยหมุน เคลือบด้วยความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที วางบนแผ่นทำความร้อนที่อุณหภูมิคงที่ประมาณ 95 ้องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที จะได้ความหนาประมาณ 2 µm และได้ความจุไฟฟ้าตามลวดลายที่ ออกแบบประมาณ 30 pF หลังจากนั้น นำหน้ากากโลหะมาวางทับบนสารไวแสง และฉายด้วยรังสี ้อัลตราไวโอเลต ด้วยความหนาแน่นพลังงาน 2,000 mJ/cm² ซึ่งปริมาณพลังงานนี้จะทำให้ ้สารไวแสงแข็งตัว และยึดเกาะแผ่นฐานได้ดี หลังจากฉายแสงแล้วไม่ต้องนำหน้ากากออก แต่นำไป ้อบที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส 10 นาที และเคลือบโลหะอลูมิเนียมโคยการระเหยผ่านหน้ากาก ้โลหะ ลงบนลวคลายที่ถูกฉายรังสีอัลตราไวโอเลตจนสารไวแสงแข็งตัวแล้ว ให้ได้ความหนา ประมาณ 0.6 μm และอบซ้ำด้วยอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสอีก 30 นาที เพื่อให้ โลหะยึดเกาะ ้ถวดถายซี่อิเล็กโทรดได้ดียิ่งขึ้น รูปที่ 5.15 แสดงการติดหน้ากากโลหะถงบนชิ้นงาน เมื่อชิ้นงานเย็น ้ลงจึงนำหน้ากากโลหะออก และล้างฟิล์มส่วนที่ไม่ถูกฉายแสงออก จะได้ลวดลายของ ซี่สารไวความชื้นซึ่งวางทับด้วยซี่โลหะตัวนำ ในขั้นตอนนี้อาจมีสารไวแสงตกค้างที่ผิวของแผ่น ฐาน สามารถทำความสะอาดได้โดยการสกัดด้วยพลาสมาของออกซิเจน 200 W 20 นาที ขั้นตอน การสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นโดยวิธีการระเหยเคลือบโลหะผ่านหน้ากากแสดงได้ดังรูปที่ 5.16 โครงสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างขึ้น มีสองแบบ คือ แบบต่อสายโดยใช้เครื่องต่อสาย (wire bonder) และแบบที่สามารถบัดกรีต่อสายได้เอง เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อ สำหรับการ วัดทดสอบคุณสมบัติ ในการทดลองนี้จะใช้ตัวตรวจรู้ความชื้นที่ต่อสายโดยการบัดกรี โครงสร้าง ทั้งสองแสดงได้ดังรูปที่ 5.17-5.18



รูปที่ 5.12 ตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างโดยใช้วิธีการ lift-off



รูปที่ 5.13 การสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นโดยใช้วิธีการ lift-off



รูปที่ 5.14 ภาพขยายตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างโดยใช้วิธีการ lift-off



รูปที่ 5.15 ชิ้นงานที่ติดหน้ากากโลหะหลังการเคลือบโลหะเรียบร้อยแล้ว



รูปที่ 5.16 การสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบระเหยเกลือบขั้วโลหะ ผ่านหน้ากากโลหะ



รูปที่ 5.17 ตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างจากการเกลือบขั้วโลหะผ่านหน้ากากโลหะ



รูปที่ 5.18 ตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างจากการเคลือบโลหะผ่านหน้ากาก แบบที่สามารถเชื่อมต่อสายโดยการบัคกรี จากโครงสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างขึ้น ในขั้นตอนต่อไปต้องทำการปรับเทียบ ก่าความจุไฟฟ้าของตัวตรวจรู้ความชื้น กับก่าความชื้นมาตรฐานของสารละลายเกลืออิ่มตัว ก่าต่าง ๆ เพื่อหาก่าความไว และก่าความผิดพลาดในการวัดความชื้นของตัวตรวจรู้ความชื้น ที่สร้างขึ้น แล้วจึงทดสอบผลตอบสนองทางเวลาต่อความชื้นของตัวตรวจรู้ โดยการป้อนความชื้น และอากาศแห้งแบบขั้นบันได เพื่อหาก่าผลตอบสนองเวลา ขาขึ้น และขาลง โดยรายละเอียดจะได้ กล่าวในบทต่อไป

บทที่ 6 การทดสอบตัวตรวจรู้ความชื้น

การทคสอบตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยการวัดผลตอบสนองในสภาวะ อยู่ตัว (Static response) และผลตอบสนองทางพลวัต (Dynamic response) การวัดผลตอบสนอง ในสภาวะอยู่ตัวใช้เพื่อปรับเทียบตัวตรวจรู้ความชื้น กับความชื้นมาตรฐาน ซึ่งได้จากสารละลาย เกลืออิ่มตัว อันเป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารแต่ละชนิด ส่วนการวัดผลตอบสนองทางพลวัต หรือ ผลตอบสนองทางเวลา เพื่อทคสอบความเร็วในการตอบสนองของตัวตรวจรู้ต่อความชื้น ซึ่งป้อน ให้กับตัวตวรจรู้ความชื้นแบบขั้นบันได โดยรายละเอียดมีดังนี้

6.1 การวัดผลตอบสนองในสภาวะอยู่ตัว

การวัดผลตอบสนองในสภาวะอยู่ตัวของตัวตรวจรู้กวามชื้นมีจุดประสงค์เพื่อวัดผลการ ตอบสนองต่อกวามชื้นของตัวตรวจรู้ โดยปรับเทียบกับก่ากวามชื้นมาตรฐานซึ่งได้จากสารละลาย เกลืออิ่มตัว เกลือแต่ละชนิดจะให้ก่ากวามชื้นที่ต่างกันไป และก่าของอุณหภูมิยังมีผลต่อก่ากวามชื้น ของไอเกลืออิ่มตัวเหล่านี้ ดังนั้นจึงทำการปรับเทียบก่ากวามชื้นที่ก่าอุณหภูมิเดียวกัน โดยเลือกที่ก่า อุณภูมิห้องกือ 25 องศาเซลเซียส รายละเอียดก่ากวามชื้นสัมพัทธ์มาตรฐานจากสารละลายเกลือ อิ่มตัวเป็นดังตารางที่ 6.1

วิธีการปรับเทียบตัวตรวจรู้ด้วยความชื้นมาตรฐานจากสารละลายเกลืออิ่มตัว เริ่มจากการนำ เกลือใส่ลงในภาชนะที่เป็นแก้วเช่น บีกเกอร์ เติมน้ำบริสุทธิ์ลงในภาชนะจนเกลือเปียก คนให้เกลือ ละลายในน้ำ เติมเกลือแล้วคนจนกระทั่งเกลือไม่สามารถละลายได้อีก จากนั้นนำบีกเกอร์ไปอุ่น เพื่อให้เกลือละลายพร้อมทั้งเติมเกลือจนกระทั่งไม่สามารถละลายได้อีก ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง จนสารละลายเกลือตกผลึก เทสารละลายเกลือที่ได้ลงในภาชนะปิดดังรูปที่ 6.1-6.2 แล้วนำ ตัวตรวจรู้ความชื้นบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท พร้อมกับตัวตรวจรู้ความชื้นอ้างอิง แล้วทิ้งไว้ ประมาณ 6-12 ชั่วโมง ความชื้นภายในภาชนะจะมีค่าเท่ากับความชื้นของสารละลายเกลือนั้น ซึ่งจะ แตกต่างกันขึ้นกับอุณหภูมิห้อง ซึ่งตรวจสอบได้จากตัวตรวจรู้อุณหภูมิ ขั้นตอนสุดท้ายจึงทำการวัด ก่าความจุไฟฟ้าและต่อตัวตรวจรู้ความชื้นเข้ากับวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แล้วทำการวัด ความถี่และแรงคันไฟฟ้าจากวงจร ทำซ้ำวิธีการเดิมเพียงแต่เปลี่ยนชนิดของเกลือที่ให้ก่าความชื้น แตกต่างกันออกไป ณ อุณหภูมิกงที่



รูปที่ 6.1 โครงสร้างชุดทดสอบตัวตรวจรู้กวามชื้นโดยใช้กวามชื้น มาตรฐานจากสารละลายเกลืออิ่ม

การวัดผลตอบสนองต่อความชื้นของตัวตรวจรู้อาจกระทำในรูปของการวัดค่าความจุไฟฟ้า หรือวัดในรูปความถิ่ของสัญญาณเอาท์พุตที่สัมพันธ์กับความจุไฟฟ้า หรืออาจแปลงความถิ่ที่เกิดขึ้น ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้ การเปลี่ยนค่า ความจุไฟฟ้าเป็นความถิ่ไฟฟ้าทำได้โดยการใช้วงจร อะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ (Astable multivibrator circuit) ซึ่งค่าความถิ่ของสัญญาณเอาท์พุตจะแปรตามค่าของความจุไฟฟ้าของ ตัวตรวจรู้ความชื้นดังรูปที่ 6.3 แล้วทำการจดบันทึกค่าความจุไฟฟ้าจากหน้าปักม์ของเครื่องวัด ความจุไฟฟ้า LCR มิเตอร์ HP รุ่น 4284A Precision LCR meter ส่วนการแปลงความถี่ไปเป็น แรงดันไฟฟ้าสามารถทำได้โดยใช้วงจรในรูปที่ 6.4 ซึ่งเป็นวงจรที่ใช้เปลี่ยนค่าความถี่ที่ได้จาก วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์เป็นค่าแรงดันไฟฟ้า



รูปที่ 6.2 ชุดทดสอบตัวตรวจรู้กวามชื้นโดยใช้กวามชื้นมาตรฐาน จากสารละลายเกลืออิ่มตัว

อุณหภูมิ	Lithium	Potassium	Magnesium	Potassium	Magnesium	
(°C)	Chloride	acetate	Chloride	carbonate	nitrate	
	(LiCl)	(CH ₃ COOK)	(MgCl ₂)	(K_2CO_3)	$(Mg(NO_3)_2)$	
0	11.23 ±0.54		33.66 ±0.33	43.13 ±0.66	60.35 ±0.55	
5	11.26 ± 0.47		33.60 ± 0.28	43.13 ±0.50	58.86 ± 0.43	
10	$11.29\pm\!\!0.41$		33.47 ± 0.24	$43.14\pm\!\!0.39$	57.36 ±0.33	
15	$11.30\pm\!\!0.35$	$23.28\pm\!\!0.53$	33.30 ±0.21	43.15 ±0.33	55.87 ±0.27	
20	11.31 ± 0.31	$23.40\pm\!\!0.32$	33.07 ±0.18	43.16 ±0.33	54.38 ±0.23	
25	11.30 ± 0.27	23.11 ±0.25	32.78 ±0.16	43.16 ±0.39	52.89 ±0.22	
30	11.28 ± 0.24	22.51 ±0.32	32.44 ± 0.14	43.17 ±0.50	51.40 ±0.24	
35	11.25 ±0.22	21.61 ±0.53	32.05 ±0.13		49.91 ±0.29	
40	11.21 ± 0.21		31.60 ±0.13		48.42 ± 0.37	
45	11.16 ± 0.21		31.10 ±0.13		46.93 ± 0.47	
50	11.10 ± 0.22		30.54 ± 0.13		45.44 ± 0.60	
55	11.03 ±0.23		29.93 ±0.16			
60	10.95 ± 0.26		$29.26\pm\!\!0.18$			
65	$10.86\pm\!\!0.29$		28.54 ± 0.21			
70	10.75 ± 0.33		27.77 ±0.25			
75	$10.64\pm\!0.38$		26.94 ± 0.29			
80	10.51 ± 0.44		26.05 ± 0.34			
85	$10.80\pm\!\!0.51$		25.11 ±0.39			
90	10.23 ±0.59		24.12 ± 0.46			
95	10.07 ± 0.67		23.07 ±0.52			
1						

ตารางที่ 6.1 ก่ากวามชื้นสัมพัทธ์ (%RH) ของสารละลายเกลืออิ่มตัวที่อุณหภูมิต่าง ๆ

				-	
อุณหภูมิ	Sodium	Potassium	Potassium	Potassium	
(°C)	chloride	Chloride (KCl)	Nitrate	Sulfate (K_2SO_4)	
	(NaCl)		$(K_2(NO_3)_2)$		
0	75.51 ±0.34	88.61 ±0.53	96.33 ±2.90	98.77 ±1.10	
5	75.65 ± 0.27	87.67 ± 0.45	96.27 ±2.10	98.48 ± 0.91	
10	75.67 ± 0.22	86.77 ±0.39	95.96 ± 1.40	98.18 ± 0.76	
15	75.61 ±0.18	85.92 ± 0.33	95.41 ±0.96	97.89 ± 0.63	
20	75.47 ± 0.14	85.11 ±0.29	94.62 ±0.66	97.59 ±0.53	
25	75.29 ± 0.12	84.34 ± 0.26	93.58 ±0.55	$97.30\pm\!\!0.45$	
30	75.09 ± 0.11	$83.62\pm\!\!0.25$	92.31 ±0.60	$97.00\pm\!0.40$	
35	74.87 ± 0.12	82.95 ± 0.25	90.79 ± 0.83	96.71 ±0.38	
40	74.68 ±0.13	82.32 ± 0.25	89.03 ±1.20	96.41 ±0.38	
45	$74.52\pm\!\!0.16$	81.74 ± 0.28	87.03 ± 1.80	96.12 ± 0.40	
50	74.43 ± 0.19	$81.20\pm\!\!0.31$	84.78 ±2.50	95.82 ± 0.45	
55	74.41 ±0.24	80.70 ± 0.35			
60	$74.50\pm\!0.30$	80.25 ± 0.41			
65	74.71 ±0.37	79.85 ± 0.48			
70	75.06 ± 0.45	79.49 ± 0.57			
75	75.58 ± 0.55	79.17 ±0.66			
80	76.29 ± 0.65	$78.90\pm\!\!0.77$			
85		$78.68\pm\!\!0.89$			
90		78.50 ± 1.00			

ตารางที่ 6.1 ก่ากวามชื้นสัมพัทธ์ (%RH) ของสารละลายเกลืออิ่มตัวที่อุณหภูมิต่าง ๆ (ต่อ)



รูปที่ 6.3 วงจรอะสเตเบิล มัลติไวเบรเตอร์ (Astable multivibrator circuit)

โครงสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นที่ออกแบบไว้มีค่าความจุไฟฟ้าประมาณ 30 pF หลังจากการ สร้างจริง วัคค่าความจุไฟฟ้าได้ในช่วง 29.5-36.5 pF สำหรับความชื้นในช่วง 10-95% สำหรับ ผลตอบสนองในสภาวะอยู่ตัว เป็นดังรูปที่ 6.5 เมื่อแทนชุดข้อมูลด้วยสมการเส้นตรง โดยวิธีผลรวม ค่าผิดพลาดกำลังสองเป็นดังรูปที่ 6.6 สามารถหาความไวจากความชันของสมการเส้นตรงได้ เท่ากับ 83 fF/%RH หรือเมื่อเทียบกับค่าความจุไฟฟ้าที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% จะได้ความไวเท่ากับ 2,677 ppm/%RH สมการ (6-1) เป็นสมการเส้นตรงที่ดีที่สุด ซึ่งใช้แทนชุดข้อมูลความจุไฟฟ้าจาก การวัดโดยมีค่าผลรวมความคลาดเคลื่อนกำลังสองเท่ากับ 0.9932

เมื่อแทนชุดข้อมูลด้วยสมการเส้นโค้งกำลังสอง โดยวิธีการผลรวมค่าผิดพลาดกำลังสอง จะได้ดังรูปที่ 6.7 และหาความไวจากความชันเฉลี่ยของสมการเส้นโค้งได้เท่ากับ 83.6 fF/%RH หรือเมื่อเทียบกับค่าความจุไฟฟ้าที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% จะได้ความไวเฉลี่ยเท่ากับ 2,833 ppm/%RH สมการที่ (6-2) เป็นสมการเส้นโค้งที่ดีที่สุด ซึ่งใช้แทนชุดข้อมูลความจุไฟฟ้าจาก การวัด โดยมีก่าผลรวมความกลาดเกลื่อนกำลังสองเท่ากับ 0.9929



รูปที่ 6.4 วงจรแปลงความถี่เป็นแรงคันไฟฟ้าใช้ตัวกรองออปแอมป์แบบสองขั้ว เพื่อเพิ่มความเร็วในการตอบสนองของวงจร

ในการใช้งานตัวตรวจรู้ความชื้น ค่าผลตอบสนองของเอาท์พุตจะอยู่ในรูปของความชื้น สัมพัทธ์ แทนที่จะเป็นค่าความจุไฟฟ้า ดังนั้นจึงวาดกราฟผลตอบสนองใหม่โดยการสลับแกนของ กราฟดังรูปที่ 6.8 และ 6.9 สำหรับกรณีการแทนชุดข้อมูลด้วยสมการเส้นตรงและเส้นโด้งตามลำดับ การทำงานของเครื่องวัดความชื้นจะเริ่มจากการวัดก่าความจุไฟฟ้าจากตัวตรวจรู้แล้วแทนค่าลงใน สมการแทนชุดข้อมูลดังสมการ (6-3) หรือ (6-4) แล้วจึงนำค่าที่ได้ไปแสดงผล

$$C (\%RH) = 0.08325 x (\%RH) + 28.46$$
 (6-1)

$$C (\%RH) = 0.000221 \text{ x} (\%RH)^{2} + 0.06148 \text{ x} (\%RH) + 28.8$$
(6-2)



รูปที่ 6.5 ค่าความจุไฟฟ้าของตัวตรวจรู้ความชื้นเทียบกับค่าไอเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน



รูปที่ 6.6 ค่าความจุไฟฟ้าของตัวตรวจรู้ความชื้นเทียบกับค่าไอเกลืออิ่มตัวเมื่อ แทนชุดข้อมูลด้วยสมการเส้นตรง



รูปที่ 6.8 ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเส้นตรงที่สร้างขึ้นเทียบกับค่าความชื้นจริง เพื่อใช้หาความผิดพลาดของตัวตรวจรู้ความชื้น



รูปที่ 6.9 ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุคสมการเส้นโค้งกำลังสองที่สร้างขึ้นเทียบกับค่า ความชื้นจริงเพื่อใช้หาความผิดพลาดของตัวตรวจรู้ความชื้น

$$%RH = f(c) = 10.8c - 301.9$$
 (6-3)

$$%$$
RH = f(c) = -0.6837c² + 57.96 - 1112 (6-4)

ตารางที่ 6.2 ก่าความคลาดเคลื่อนของตัวตรวจรู้ความชื้นเมื่อแทนด้วยสมการรูปแบบต่างกัน

	คาวมชื้น	93.58	75.29	52.89	43.16	32.78	11.307
	(%RH)						
ความคลาด	สมการ	+4.5581	-4.5392	-0.0371	-0.0369	-3.5908	+1.4257
เคลื่อนของ	เส้นตรง						
ความชื้น	สมการ	1.3705	-3.5283	2.2274	2.2804	-2.1563	-0.0513
(%RH)	กำลังสอง						

ความคลาดเคลื่อนจากการใช้สมการ (6-3) หรือ (6-4) ในการแสดงผลการวัดเมื่อเทียบกับ กวามชื้นมาตรฐานจากสารละลายเกลืออิ่มตัวแสดงไว้ในตารางที่ 6.2 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างขึ้นมีความแม่น (accuracy) ในช่วงความชื้นสัมพัทธ์ ±5% เมื่อได้ ผลตอบสนองของตัวตรวจรู้ความชื้นในสถานะอยู่ตัว และทำการปรับเทียบกับความชื้นจาก สารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐานแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวัดผลตอบสนองทางเวลา โดยการ ป้อนความชื้นแบบขั้นบันไดให้กับตัวตรวจรู้ความชื้น ซึ่งจะวัดเวลาเมื่อตัวตรวจรู้มีขนาดของการ ตอบสนองที่ 10% จนถึง 90% จะได้ ผลการตอบสนองเป็นแรงดันไฟฟ้าเทียบกับเวลา โดยใช้วงจร ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

6.2 การวัดผลตอบสนองทางเวลา

้เมื่อทำการวัด และปรับเทียบตัวตรวจรู้ความชื้นในสภาวะอยู่ตัวแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการ ้วัดผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้ความชื้น โดยการป้อนความชื้นแบบขั้นบันได และเก็บ ้ข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม LabVIEW มีแผนภาพการทำงานดังรูปที่ 6.10 การทำงาน ้ของชุดทดสอบเริ่มจากการสร้างไอน้ำอิ่มตัว โดยการบรรจุน้ำในภาชนะปิดและอุ่นให้ร้อน ้ประมาณ 40 องศาเซลเซียส โคยมีวาล์ว 1 เป็นตัวกำหนุดการใหลของไอน้ำเข้าสู่ถังบรรจุตัวตรวจรู้ และวาล์ว 2 ซึ่งมีสถานะตรงกันข้ามกับวาล์ว 1 เสมอ เป็นตัวกำหนดการ ไล่ความชื้นออกจาก ้ถังบรรจุตัวตรวจรู้ ในสถานะเริ่มต้นจะป้อนอากาศแห้งให้กับถังบรรจุตัวตรวจรู้ความชื้น โดยเปิด ้วาล์ว 2 และ ปีควาล์ว 1 เพื่อไล่ความชื้นจนกระทั่งเหลือความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 20% จึงปีควาล์ว ้ทั้งสอง แล้วเริ่มบันทึกค่าแรงคันไฟฟ้าที่ได้จากวงจร ซึ่งจะมีค่าคงที่ จากนั้นป้อนความชื้นโดยเปิค ้วาล์ว 1 และปิควาล์ว 2 ทำให้อากาศแห้งเข้าไปผสมกับไอน้ำอิ่มตัว ซึ่งได้ปรับอัตราการไหลให้ได้ ้ความชื้นสัมพัทธ์ 80% ไว้แล้ว ความชื้นจะไหลเข้าสู่ถังบรรจุตัวตรวจรู้ความชื้น แล้วผ่านออกไป ทางวาล์วระบายทำให้ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าคงที่เท่ากับ 80% ในขั้นตอนนี้ต้องบันทึกค่า แรงดันไฟฟ้าด้วยกอมพิวเตอร์ตลอด ขั้นตอนต่อไปเป็นการทดสอบการกายกวามชื้น โดยเป็น ้ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน ในขั้นตอนนี้ จะหยุดป้อนอากาศชื้นและป้อนอากาศแห้งเข้าไปแทนโดย ้ปีควาล์ว 1 และเปิควาล์ว 2 ทำให้อากาศแห้งใหลเข้าสู่ถังบรรจุตัวตรวจรู้ ทำให้ตัวตรวจรู้ความชื้น คายความชื้นออกมา จากการการทคลองได้ผลตอบสนองในการดูดความชื้นดังรูปที่ 6.12 ซึ่งมี แรงคันไฟฟ้าสูงสุดที่ 0.225 โวลต์ ผลตอบสนองที่ 10% เท่ากับ 0.0225 โวลต์ ที่เวลา 0.14 วินาที และผลตอบสนองที่ 90% เท่ากับ 0.2025 โวลต์ ที่เวลา 0.7 วินาที คิคเป็นความเร็วการตอบสนอง 560 ms ส่วนในรูปที่ 6.13 แสดงการคายกวามชื้นของตัวตรวจรู้ โดยใช้เวลาในการคายกวามชื้น ้เท่ากับ 1 วินาที จากผลการทดลองพบว่า การตอบสนองของตัวตรวจรู้ความชื้นทั้งการดูดความชื้น และคายความชื้น อยู่ในเกณฑ์ที่เร็วมาก

เมื่อนำผลตอบสนองที่ได้ ทั้งเวลาในการดูดความชื้น และคายความชื้น วาดกราฟเพื่อ เปรียบเทียบผลจากแบบจำลองทาคณิตสาสตร์ที่ได้สร้างขึ้นในบทที่ 3 ขนาดของซี่ตัวตรจรู้ความชื้น ที่ออกไว้มีขนาดเท่ากับ 60 µm แต่ขนาดที่สร้างได้จริงวัดได้เท่ากับ 51 µm และใช้ค่าสัมประสิทธิ์ การแพร่ของความชื้นเข้าสู่สารไวแสง SU-8 เท่ากับ 400 µm² พบว่าแบบจำลองทางคณิตสาสตร์ สามารถอธิบายผลตอบสนองทางพลวัตได้ก่อนข้างดีดังรูปที่ 6.14 และ6.15



รูปที่ 6.10 ชุดทดสอบผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้ความชื้น



รูปที่ 6.11 ผลตอบสนองในการคูคซึมความชื้นเมื่อป้อนความชื้นแบบขั้นบันไค



รูปที่ 6.12 ผลตอบสนองในการคายความชื้นเมื่อป้อนอากาศแห้งแบบขั้นบันได



รูปที่ 6.13 ผลตอบสนองในการดูคความชื้นของตัวตรวจรู้เทียบกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์



รูปที่ 6.14 ผลตอบสนองในการคายความชื้นของตัวตรวจรู้เทียบกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

บทที่ 7 สรุปงานวิจัยและข้อเสนอแนะ

7.1 บทสรุปงานวิจัย

้งานวิจัยวิทยานิพนธ์นี้ นำเสนอการออกแบบ และสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุ ้ที่มีคุณสมบัติในการตอบสนองต่อกวามชื้นเร็ว เนื่องจากให้ผลตอบสนองเป็นเชิงเส้น สร้างได้ง่าย และมีความไวสูง ในการออกแบบโครงสร้างของตัวตรวจรู้ สามารถใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อจำลองผลการตอบสนองต่อความชื้นของตัวตรวจรู้ ที่มีโครงสร้างต่างกัน ได้แก่ โครงสร้างแบบ ้ขั้วไฟฟ้ามีรูพรุน แบบสารไวความชื้นเป็นทรงกระบอก แบบทรงลูกบาศก์ และแบบอิเล็กโทรค ซี่ยาว โครงสร้างที่มีความเหมาะสมสำหรับสร้างเป็นตัวตรวจรู้ความชื้นความเร็วสูงคือ โครงสร้าง แบบสารไวความชื้นเป็นซี่ยาว และปิคทับด้วยอิเล็กโทรคโลหะที่มีลักษณะคล้ายก้างปลาเชื่อมต่อ ้กันกับจุดเชื่อมต่อไปยังวงจรภายนอก ความไวของตัวตรวจรู้ความชื้นโครงสร้างนี้ สามารถควบคุม ้ได้ด้วยการแปรค่าความหนาของชั้นวัสดุไวความชื้น ชั้นวัสดุไวความชื้นที่บางจะช่วยให้ตัวตรวจรู้ ้ความชื้นมีความไวสูง ส่วนความเร็วในการตอบสนองจะขึ้นกับขนาดความกว้างของซื่อิเล็กโทรด กล่าวคือ มีค่าแปรผันตรงกับขนาดความกว้างของซี่สารไวความชื้นยกกำลังสอง เมื่อซี่ของ ้สารไวกวามชื้นมีขนาดกวามกว้างลดลง เวลาในการตอบสนองจะลดลงเช่นเดียวกัน ในขั้นตอนการ สร้างตัวตรวจรู้ สามารถสร้างถวดถายของสารไวความชื้น และอิเล็กโทรคโลหะ โดยการฉายรังสี ้อัลตราไวโอเลตผ่านหน้ากากโลหะ ซึ่งมีลวคลายเป็นช่องว่างตามรูปร่างของอิเล็กโทรค เพื่อให้ เกิดถวดถายของสารไวความชื้นที่เป็นไดอิเล็กทริก แล้วจึงระเหยไอโลหะให้ปิดทับบนสาร ใวความชื้นที่แขึงตัวจากการฉายแสง ทำให้เกิดโครงสร้างอิเล็กโทรคไวความชื้นที่มีรูปร่าง เหมือนกับช่องว่างในหน้ากากโลหะ หน้ากากโลหะที่ใช้สร้างอิเล็กโทรคไวความชื้นมีความหนา 250 μm สร้างโดยกระบวนการลิโชกราฟฟีด้วยรังสีเอ็กซ์เนื่องจากมีโครงสร้างที่สูงเมื่อเทียบกับ ้ความกว้างของลวดลาย หน้ากากโลหะมีอัตราส่วนความสูงต่อความกว้างประมาณ 5 เท่า หน้ากาก ้โลหะที่ใช้สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแล้ว สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก การทดสอบคุณสมบัติของ ้ตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างขึ้น แบ่งเป็นการทคสอบผลตอบสนองต่อความชื้นในสถานะอยู่ตัว ้เพื่อศึกษาค่าความไว และค่าความผิดพลาดจากการวัดความชื้น โดยการปรับเทียบตัวตรวจรู้กับ ้ความชื้น โดยใช้ความชื้นค่ามาตรฐานจากสารละลายเกลืออิ่มตัว จากการทดสอบคุณลักษณะของ ้ตัวตรวงรู้ความชื้นที่มีขนาดกวามกว้างของซี่สารไวกวามชื้น 51 μm พบว่าตัวตรวงรู้กวามชื้น

มีความไวเท่ากับ 83 fF/%RH หรือเท่ากับ 2677 ppm/%RH เมื่อเทียบกับค่าความชื้นสัมพัทธ์ 30% ซึ่งมีค่าเท่ากับ 31 pF ค่าความผิดพลาดในการวัดความชื้นสูงสุดเท่ากับ +4.55% และ -3.5283% เมื่อแทนชุดข้อมูลด้วยสมการเส้นตรงและสมการกำลังสองตามลำดับ และสามารถสรุปได้ว่า ตัวตรวจรู้ความชื้นมีความแม่น ±5%RH ผลตอบสนองทางเวลาในการดูดความชื้นเท่ากับ 0.56 วินาที และเวลาในการคายความชื้น 1 วินาที ซึ่งเป็นผลตอบสนองที่เร็ว เมื่อนำค่าความไว และ ผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้ความชื้นในงานวิจัยนี้ เทียบกับตัวตรวจรู้ที่มีผู้สร้างไว้จากอดีต จนถึงปัจจุบันดังรูปที่ 7.1 กราฟในรูปมีแกนนอนแสดงก่าส่วนกลับของความไว ของตัวตรวจรู้ ซึ่ง หากมีค่าเข้าใกล้สูนย์จะบ่งชี้ว่าตัวตรวจรู้นั้น ๆ มีความไวสูง ส่วนในแกนตั้งแสดงเวลาการ ตอบสนองต่อความชื้นอินพุตแบบขั้นบันไดซึ่งหากมีค่าใกล้สูนย์ จะบ่งชี้ว่าตัวตรจรู้นั้น ๆ มี ความเร็วสูง โดยในอนาคตถ้าสามารถสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นที่มีความกว้างของซี่ไวความชื้นลดลง จะช่วยให้ตัวตรวจรู้กวามชื้นที่สร้างขึ้นให้ผลตอบสนองเร็วขึ้นได้



รูปที่ 7.1 กราฟเปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาและความไวของตัวตรวจรู้ความชื้นกับ ตัวตรวจรู้ความชื้นที่มีผู้สร้างขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

7.2 ข้อเสนอแนะ

ในการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นความเร็ว และความไวสูง ควรลดความหนาของชั้นวัสดุ ไวความชื้นลง และทำให้ซี่อิเล็กโทรดมีความกว้างน้อยที่สุด เมื่อความหนาของชั้นวัสดุไวความชื้น ลดลง ความต้านทานทางไฟฟ้าของโครงสร้างจะลดต่ำลงด้วย ซึ่งอาจทำให้สามารถตรวจรู้ความชื้น โดยการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน ตามการแปรผันความชื้นอินพุตได้ หากสามารถ ทำเช่นนี้ได้ จะทำให้ตัวตรวจรู้มีการทำงานแบบเครื่องมือวัดอันดับศูนย์ ซึ่งจะมีการตอบสนอง ทางเวลาที่เร็วกว่าการตรวจรู้แบบตัวก็บประจุ

เมื่อชั้นไวความชื้นมีความหนาลดลงมาก ๆ จะส่งผลให้ก่าความต้านทานของชั้น ้ไวความชื้นมีค่าลดต่ำลงมากด้วย ทำให้ตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุเสมือนว่ามีค่าความ ้ต้านทานที่แปรเปลี่ยนไปตามความชื้นต่อขนานอยู่ ทำให้วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ ไม่ ้สามารถใช้สร้างความถึ่งากตัวตรวจรู้แบบตัวเก็บประจุได้ จึงเป็นข้อจำกัดหนึ่งในการสร้างตัวตรวจ รู้ความชื้นให้มีความไวสูง ในการพัฒนางานวิจัยในขั้นต่อไป จึงจำเป็นต้องมีวงจรที่สามารถใช้ ตรวจจับก่ากวามจุไฟฟ้า และก่ากวามต้านทานที่แปรเปลี่ยนไปพร้อมกัน วงจรที่แนะนำ คือ วงจรซึ่ง ใช้หลักการวัดการเลื่อนเฟส และการเปลี่ยนแปลงของแอมปลิจูดของสัญญาณไซน์ ซึ่งเป็นผลมา ้จากค่าความจุไฟฟ้า และค่าความต้านทานที่เปลี่ยนไป ตามลำคับ จากนั้นนำสัญญาณที่ได้เปรียบ เทียบกับสัญญาณอินพุต โดยใช้วงจรงยายผลต่าง จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่า วงจรนี้ช่วยให้ ผลตอบสนองของตัวตรวจรู้มีก่ากวามไวสูงขึ้น เมื่อนำผลตอบสนองที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ แบบจำลองที่สร้างขึ้นโดยวิธีการ Crank-Nicloson พบว่าสามารถทำนายผลตอบสนองทางเวลาได้ดี และเมื่อนำแบบจำลองเคียวกันนี้ ทำนายผลตอบสนองของตัวตรวจรู้ความชื้นเมื่อมีค่าความกว้าง ของซี่ลดลง เหลือ 25 µm 10 µm 5 µm และ 3 µm จะได้เวลาในการตอบสนองของตัวตรวจรู้ ้ความชื้นเป็น 450 ms 75 ms 17.6 ms และ 6.312 ms ตามลำคับ ตัวตรวจรู้ความชื้น โครงสร้างนี้ จึงเหมาะที่จะมีการพัฒนาให้ตอบสนองเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีของกระบวนการลิโชกราฟฟีด้วย รังสีเอ็กซ์ต่อไป

รายการอ้างอิง

- Boisen, A., Thaysen, J., Jensenius, H., and Hansen, O. (2000). Environmental sensors based on micromachined cantilevers with integrated read-out. **Ultramicroscopy**. 82 (1-4) : 11-16.
- Boltshauser, T., Leme, C.A., and Baltes, H. (1993). High sensitivity CMOS humidity sensors with on-chip absolute capacitance measurement system. Sensors and Actuators B: Chemical. 15 (1-3): 75-80. 171
- Caliendo, C., Verona, E., D'Amico, A., Furlani, A., Iucci, G., and Russo, M.V. (1993). Surface acoustic wave humidity sensor. Sensors and Actuators B: Chamical. 16 (1-3): 288-292.
- Caliendo, C., Verona, E., D'Amico, A., Furlani, A., Iucci, G., and Russo, M.V. (1994). A new surface acoustic wave humidity sensor based on a polyethynylfluorenol membrane. Sensors and Actuators B: Chemical. 18 (1-3):82-84.
- Chomnawang, N., Cheirsirikul, S., Pengchan, W., Niemchareon, S., and Ketthanom, Ch. (2005).
 Application of RF Sputtered Polyimide Film in Capacitive Humidity Sensing.
 Proceedings of the 19th European conference on solidstate transducers
 (Eurosensors XIX). 2(W) : (pp. WPb71). Spain, Barcelona.
- Crank, J. (1975). The Mathematics of Diffusion. London: Oxford University Press, Ely House.
- Das, J., Hossain, S.M., Chakraborty, S., and Saha, H. (2001). Role of parasitics in humidity sensing by porous silicon. Sensors and Actuators A: Physical. 94 (12):4452.
- Erson, R. C., Muller, R. S., and Tobias, C. W. (1990). Investigations of porous silicon for vapor sensing. Sensors and Actuators A: Physical. 23(1-3): 835-839.
- Fürjes, P., Kovács, A., DücsX, C.s., Ádám, M., Müller, B., and Mescheder, U. (2003). Porous silicon-based humidity sensor with interdigitated electrodes and internal heaters. Sensors and Actuators B: Chemical. 95 (1-3): 140-144.
- Gerlach, G., and Sager, K. (1994). A piezoresistive humidity sensor. Sensors and Actuators A: Physical. 43 (1-3): 181-184.
- Grange, H., Bieth, C., Boucher, H., and Delapiere, G. (1987). A capacitive humidity sensor with every fast response time and very low hysteresis. Sensors and Actuators. 12 (3): 291-296.
- Harrey, P.M., Ramsey, B.J., Evans, P.S.A., and Harrison, D.J. (2002). Capacitive-type humidity sensors fabricated using the offset lithographic printing process. Sensors and Actuators
 B: Chemical. 87 (2) : 226-232.
- Hijikagawa, M., Miyoshi, S., Sugihara, T. and Jinda, A. (1983). A thin-film resistance humidity sensor. Sensors and Actuators. 4 : 307-315.
- Jahori, H. (2003). Development of MEMS Sensors for Measurements of Pressure, Relative Humidity, and Temperture. Master Thesis, Faculty of Mechanical Engineering Worcester Polytechnic Institute, Worcester, United State of America.
- Kalkan, A. K., Handong, Li., O'Brien, C. J., and Fonash, S. J. (2004). A rapid response, highsensitivity nanophase humidity sensor for respiratory monitoring. IEEE Electron Device Letters. 25 (8): 526 – 528.
- Kang, U., and Wise, K.D.(2000). A high-speed capacitive humidity sensor with on-chip thermal reset. IEEE Tran. Electron Devices. 10 (2): 702-710.
- Ketthanom, Ch., Chomnawang, N., Klaitabtim, D., and Tuantranont, A. (2004). Capacitance simulation of interdigitated metallic towers for humidity sensing 173 applications.
 Proceedings of the 27th Electrical Engineering Conference. 2: (pp.297-300). Thailand, Khonkaen.
- Kupta, B.D., and Ratnanjali. (2001). A novel probe for a fiber optic humidity sensor. Sensors and Actuators B: Chemical. 80 (2): 132-135.

- Kuroiwa, T., Miyagishi, T., Ito, A., Matsuguchi, M., Sadaoka, Y., and Sakai, Y. (1995). A thin-film polysulfone-based capacitive-type relative-humidity sensor. Sensors and Actuators
 B: Chemical. 25 (1-3): 692-695.
- Laville, C.,Deletage, J.Y., and Pellet, C. (2001). Humidity sensors for a pulmonary function diagnostic microsystem. Sensors and Actuators B: Chemical. 76 (1-3) : 304-309.
- Lee, S.P., and Park, K.J. (1996). Humidity sensitive field effect transistors. Sensors and Actuators B: Chemical. 35 (1-3): 80-84.
- Qiu, Y.Y., Leme, C.A., Alcacer, L.R., and Franca, J.E. (2001). A CMOS humidity sensor with on-chip calibration. Sensors and Actuators A: Physical. 92 (1-3): 80-87.
- Ralston, A.R.K., Klein, C.F., Thoma, Paul, E., and Denton, D.D. (1996). A model for the relative environmental stability of a series of polyimide capacitance humidity sensors.
 Sensors and Actuators B: Chemical. 34 (1-3) : 343-348.
- Rittersma, Z.M. (2002). Recent achievements in miniaturized humidity sensors a review of transduction techniques. Sensors and Actuators A: Physical. 96 (2-3): 196-210.
- Rittersma, Z.M., Splinter, A., Bödecker, A., and Benecker, W. (2000). A novel surfacemicromachined capacitive porous silicon humidity sensor. Sensors and Actuators B: Chemical. 68 (1-3): 210-217.
- Ralston, A. R. K., Tobin, J. A., Bajikar, S. S. and Denton, D. D. (1994). Comparative performance of linear, cross-linked, and plasma-deposited PMMA capacitive humidity sensors. Sensors and Actuators B: Chemical. 22 (2): 139-147. 176
- Sakai, Y., Sadaoka, Y., and Ikeuchi, K. (1986). Humidity sensors composed of grafted copolymers. Sensors and Actuators. 9 (2):125-131.
- Sakai, Y., Sadaoka, Y., and Matsuguchi, M. (1996). Humidity sensors based on polymer thin films. Sensors and Actuators B: Chemical. 35 (1-3): 85-90.
- Tetelin, A., Pellet, C., Laville, C., and N'Kaoua, G. (2003). Fast response humidity sensors for a medical microsystem. Sensors and Actuators B: Chemical. 91 (1-3): 211-218.

- Traversa, E. (1995). Ceramic sensors for humidity detection: the state-of-the-art and future developments. Sensors and Actuators B: Chemical. 23 (2-3): 135-156.177
- Tsuchitani, S., Sugawara, T., Kinjo, N., and OharaT. Tsunoda, S. (1988). A humidity sensor using ionic copolymer and its application to a humidity-temperature sensor module. **Sensors and Actuators**. 15 (4): 375-386.
- Yamazoe, N. (1986). Humidity sensors: principles and applications. Sensors and Actuators. 10: 379-398.

ภาคผนวก ก

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

รายชื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 R. Phatthanakun, M. Mapato, W. Wanburee, S. Promwikorn, N. Chathirat, P. Songsiriritthigul,
 P. Klysubun and N. Chomnawang. "Copier Transparent Support for X-ray Mask Absorber." International Conference on material for Advanced Technology-ICMAT, Singapore, July 1-7, 2007 ภาคผนวก ข

การผสมน้ำยาชุบโลหะเงินปริมาตร 500 มิลลิลิตร

ขั้นตอนสำหรับการเตรียมสารละลายเงินสำหรับการชุบเงินด้วยไฟฟ้าโดยจะได้ปริมาตร ของสารละลาย 500 มิลลิลิตร

 เตรียมน้ำดี ไอ ปริมาตร 300 มิลลิลิตร ใช้ภาชนะที่ทำการกวนตอลอดเวลา เติม Potassium cyanide น้ำหนัก 83.3 กรัม โดยเติมลงไปทีละน้อย ทำการกวนทิ้งไว้ประมาณ
 นาทีจนกว่า Potassium cyanide ละลายจนหมด

2. เติม Potassium carbonate 7.5 กรัม ลงในสารละลาย และกวนจนสารละลายเป็น เนื้อเดียวกัน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

3. เติม Silver cyanide 80% น้ำหนัก 22.5 กรัม ลงไปทีละน้อยและกวนจนสารละลายเป็น เนื้อเดียวกัน และกวนสารทิ้งไว้อีก 15 นาที

4. เติมน้ำดีไอเพิ่มลงในสารละลาย จนมีปริมาตร 500 มิลลิลิตร

5. เติมผงการ์บอน (Granular carbon) น้ำหนัก 1 กรัมลงไปแล้วกวนสารต่อไปเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นจึงหยุดการกวนสาร นำสารละลายที่ได้ลงจากเครื่องกวนสารปิดฝาให้สนิท และปล่อยให้สารเคมีทำปฏิกิริยากันอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

6. นำสารละลายมากรองด้วยกระดาษกรอง 3-5 ครั้งเพื่อกรองเอาผงการ์บอนและฝุ่นผงใน สารละลายออก

7. ทำความสะอาดสารละลายขั้นสุดท้ายด้วยการกรองด้วยไฟฟ้าโดยนำสารละลายมาชุบ ด้วยไฟฟ้า โดยใช้โลหะ Platinized titanium เป็นขั้วบวก (Anode) และใช้ Stainless steel เป็นขั้ว ลบ (Cathode) โดยใช้แรงคันกงที่ 1.5 โวลต์ เป็นเวลา 15 นาที

8. เติมสาร Silver Glo make up ปริมาตร 3 มิลลิลิตร และสาร Silver Glo 3K TY ปริมาตร 0.65 มิลลิลิตร เพื่อทำให้ผิวของโลหะเงินหลังการชุบด้วยไฟฟ้าเรียบเนียน ภาคผนวก ค

กระบวนการสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์

กระบวนการสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์

นำแผ่นใสยึคติคกับวงแหวนทองแคงโคยใช้ SU-8 50 อบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส
 30 นาที และอบที่ 95 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมงปล่อยให้ชิ้นงานเย็นลงช้า ๆ

2. ฉายรังสีอัลตราไวโอเลตด้วยเครื่อง UV-PCB เป็นเวลา 30 นาที และนำไปอบที่ อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 30 นาทีและอบที่ 95 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง

3. ตัดแยกวงแหวนออกจากกัน

4. ทำความสะอาด โดยเช็ดด้วย IPA (Isopropyl alcohol) ฉิดด้วยอะซิโตน และฉิดด้วย IPA
 อีกกรั้งและนำไปทำความสะอาดด้วยคลื่นเสียง อัลตราโซนิกในน้ำดีไอ (DI water) ประมาณ
 10 นาที เป่าให้แห้งด้วยแก๊ส ในโตรเจน และอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 30 นาที

5. เคลือบโลหะไทเทนียม และเงินในสุญญากาศหนา 200 และ 600 อังสตรอม ตามลำคับ

6. เคลือบสาร ไวแสงชนิดบวก AZ4620 โดยการหมุนเคลือบด้วยเครื่องหมุนเคลือบ Laurell รุ่น WS-400B-6NPP/LIT ด้วยความเร็ว 500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 35 วินาที ซึ่งจะได้ความหนาของ สารไวแสงประมาณ 35 μm

7. อบที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงเพื่อให้สารไวแสงแข็งตัว ปล่อยให้ ชิ้นงานเย็นลงอย่างช้า ๆ

8. ฉายรังสีอัลตราไวโอเลตลงบนชิ้นงาน ผ่านหน้ากากลวดลายจุลภาคทึบแสงด้วยพลังงาน ประมาณ 3,700 mJ/cm²

9. เตรียมน้ำยาถ้างฟิล์ม โดยผสมอัตรา 1 ส่วนต่อน้ำ 2 ส่วน ใช้เวลาถ้างสารไวแสงประมาณ 25-30 นาที

10. ล้างด้วยน้ำดี ไอและเป่าให้แห้ง อบที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 20 นาที เพื่อให้ สารไวแสงยึดเกาะกับฐานได้ดียิ่งขึ้น

11. ชุบเงินด้วยไฟฟ้าด้วยสารละลายเงินที่เตรียมไว้ ใช้โลหะไทเทเนียมชุบพลาทินัม เป็น ขั้วบวก (Anode) และให้ชิ้นงานเป็นขั้วลบ (Cathode) ใช้ความหนาแน่นกระแสประมาณ 28 mA/cm² ใช้เวลาชุบประมาณ 30 นาที จะได้โลหะเงินหนาประมาณ 35 μm

12. ล้างสาร ไวแสง AZ4620 ออกด้วยอะชิโตน และล้างน้ำดีไอ เป่าให้แห้ง และอบที่ อุณหภูมิประมาณ 85 องศาเซลเซียส ประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อไล่ความชื้น

13. จะได้หน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ที่มีเงินหนา 35 μm เป็นวัสดุกั้นรังสีสามารถใช้เป็นหน้ากาก สำหรับสร้างโครงสร้างจุลภาคที่มีความหนาสูงสุด 400 μm ภาคผนวก ง

กระบวนการสร้างหน้ากากโลหะ

ขั้นตอนการสร้างหน้ากากโลหะหนา 250 µm

 1. ตัดแผ่นกราไฟต์ให้มีขนาดประมาณ 1x1 นิ้วทำกวามสะอาดโดยกลื่นอัลตราโซนิก ในน้ำดีไอประมาณ 2-3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 10 นาที ทำกวามสะอาดด้วยกลื่นอัลตราโซนิกอีกครั้ง ในเมทานอลเป็นเวลา 15 นาที และทำกวามสะอาดโดยกลื่นอัลตราโซนิกในน้ำดีไออีกครั้ง ประมาณ 10 นาที เป่าให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจน และอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส 30 นาที 2. หมุนเกลือบสารไวแสง AZ1512 ลงบนกระจกสไลด์ ด้วยความเร็ว 1,500 รอบต่อนาที

2. หมุ่นเหลือบสาว เวณสา A21312 สงบนการจักสาสสา ครอศวามเวรา 1,500 รอบคอน ก และนำแผ่นกราไฟต์ติดทับลงไป อบให้แห้งด้วยอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 30 นาที

3. หมุนเคลือบสาร ไวแสง SU-8 2150 ลงบนกราไฟต์ ด้วยความเร็ว 1,750 รอบต่อนาที เป็น เวลา 30 วินาที และอบด้วยอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 30 นาที และต่อด้วย 95 องศาเซลเซียส 4 ชั่วโมง ปล่อยให้ชิ้นงานเย็นลงอย่างช้า ๆ จะได้ความหนาของสาร ไวแสงประมาณ 350 μm

4. ฉายรังสีเอ็กซ์ผ่านหน้ากากกั้นรังสีเอ็กซ์ด้วยพลังงานประมาณ 5,500-6,000 mJ/cm³
 5. อบด้วยอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 30 นาที และต่อด้วย 95 องศาเซลเซียสเป็นเวลา

1 ชั่วโมง

6. ล้างสารไวแสงโคยใช้น้ำยา SU8 คีเวลอปเปอร์ ใช้เวลาล้างสารไวแสงประมาณ 1 ชั่วโมง

7. ฉีดล้างด้วย IPA เป่าให้แห้ง และอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 30 นาที

8. ทำความสะอาคพื้นผิวกราไฟต์ด้วยพลาสมาของ O_2 ด้วยกำลัง 200 W เป็นเวลา 5 นาที

9. ชุบโลหะนิกเกิลลงบนกราไฟต์ โดยใช้อัตรากระแสประมาณ 20 mA/cm² การชุบโลหะ นิกเกิล สามารถชุบจนล้นแม่พิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าโลหะได้ถูกเติมจนเต็มแม่พิมพ์ทุกส่วน

10. ขัคโลหะนิกเกิลส่วนเกินให้เรียบ และขัคส่วนฐานกราไฟต์ทิ้งไป

 11. กำจัดสารไวแสงในช่องว่างทิ้งได้โดยการใช้พลาสมาของ O₂ ผสมกับก๊าซ CF₄ กำลัง
 200 W เป็นเวลาประมาณ 50 ชั่วโมง จะได้หน้ากากโลหะซึ่งมีลวดลายเป็นช่องว่าง สามารถ นำไปใช้สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นต่อไป ภาคผนวก จ

กระบวนการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นโดยใช้การเคลือบโลหะผ่านหน้ากาก

ขั้นตอนการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นโดยวิธีการเคลือบโลหะผ่านหน้ากาก

ทำความสะอาคกระจกส ไลค์ โดยเช็คด้วย ไอ โซ โพพิลแอลกอฮอล์ (IPA) ฉีคล้างด้วย
 อะซิโตน และฉีคล้างอีกครั้งด้วย IPA ล้างด้วยน้ำดี ไอ เป่าให้แห้ง

2. อบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที

3. เคลือบโลหะ Ti/Cu/Ti ลงบนกระจกสไลค์ด้วยความหนาประมาณ 200 800 และ 200 อังสตรอม ตามลำดับ

4. ทำความสะอาคพื้นผิวโลหะด้วยพลาสมาของออกซิเจนกำลัง 200 W เป็นเวลา 5 นาที

5. หมุนเคลือบสารไวแสง SU-8 2002 ด้วยความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที อบให้แห้งบนแผ่น ทำความร้อนอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที

6. ติดหน้ากากโลหะทับลงบนชิ้นงานที่ได้ และฉายรังสีอัลตราไวโอเลตด้วยความหนาแน่น พลังงาน 2,000 mJ/cm²

7. อบบนแผ่นทำความร้อนด้วยอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที

8. นำชิ้นงานซึ่งยังติดหน้ากากอยู่ ไปเกลือบโลหะอลูมิเนียมโดยการระเหยในสุญญากาศ ด้วยกวามหนาประมาณ 2,000 อังสตรอม

9. อบด้วยอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้โลหะยึดติดกับชิ้นงาน ได้ดียิ่งขึ้น ปล่อยให้ชิ้นงานเย็นลงอย่างช้า ๆ

10. นำหน้ากากโลหะออก และล้างสารไวแสงส่วนที่ไมถูกฉายแสงออก จะได้โครงสร้าง ของตัวตรวจรู้ความชื้น ที่มีลวดลายอิเล็กโทรควางบนลวดลายของสารไวความชื้น เพื่อนำไปวัดผล ต่อไป ภาคผนวก ฉ

กระบวนการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นโดยใช้วิธีการ lift-off

ขั้นตอนการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นโดยวิธีการ lift-off

ทำกวามสะอาดกระจกส ไลด์ โดยเช็ดด้วย ไอ โซ โพพิลแอลกอฮอล์ (IPA) ฉีดล้างด้วย
 อะซิโตนและฉีดล้างอีกกรั้งด้วย IPA ล้างด้วยน้ำดี ไอ เป่าให้แห้ง

2. อบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที

3. เคลือบโลหะ Ti/Cu/Ti ลงบนกระจกสไลด์ด้วยความหนาประมาณ 200 800 และ 200 อังสตรอม ตามลำดับ

4. ทำความสะอาคพื้นผิวโลหะด้วยพลาสมาของออกซิเจนกำลัง 200 W เป็นเวลา 5 นาที

5. หมุนเกลือบสาร ไวแสง SU-8 2002 ด้วยความเร็ว 3000 รอบต่อนาที อบให้แห้งบน แผ่นทำความร้อนอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที

6. ติดหน้ากากโลหะทับลงบนชิ้นงานที่ได้ และฉายรังสีอัลตราไวโอเลตด้วยความหนาแน่น พลังงาน 2,000 mJ/cm²

7. นำหน้ากากโลหะออก และอบบนแผ่นทำความร้อนด้วยอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที

8. เคลือบโลหะอลูมิเนียม โดยการระเหยในสุญญากาศลงบนชิ้นงาน ด้วยความหนา ประมาณ 2,000 อังสตรอม

9. อบด้วยอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้โลหะยึดติดกับชิ้นงานได้ดี ยิ่งขึ้น ปล่อยให้ชิ้นงานเนลงอย่างช้า ๆ

10. กำจัดโลหะ และถ้างสารไวแสงส่วนที่ไมถูกฉายแสง โดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก ในน้ำยา ถ้างฟิล์ม เป็นเวลา 30 นาที จะได้โครงสร้างของตัวตรวจรู้ความชื้น ที่มีลวดลายอิเล็กโทรดวางบน ลวดลายของสารไวความชื้น ที่สร้างโดยวิธีการ lift-off เพื่อนำไปวัดผลต่อไป ภาคผนวก ช

โปรแกรม XmaskSim

//โปรแกรม XmaskSim สำหรับคำนวณพลังงานของแสงที่ผ่านวัสดุตัวกรองต่างๆในกระบวนการลิโธกราฟฟีด้วย //รังสีเอ็กซ์ //โดย นายมาโนทย์ มาปะโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลับเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2550 //File : XmaskSim.sci //หมายเลขของวัสดุ //Be=1 Kapton=2 Aluminium=3 Mylar=4 Graphite=5 //Silver=6 Gold=7 Lead=8 Tin=9 Nickel=10 Copper=11 //SU-8=12 Si3N4=13 tungsten=14 and thickness in um //ตัวอย่างการใส่วัสดุและความหนา //example // filter_light=[1 100;3 16;12 500]; // #1 is Be thickness=100um #2 is Aluminium thickness=16um #3 is SU-8photoresist filter_dark=[1 100;6 20;12 500]; // // #1 is Be thickness=100um #2 is Silver thickness=20um #3 is SU-8photoresist //เวกเตอร์กระแสของวงแหวนกักเก็บ Current=[88.19]; //อิเล็กตรอน //วัสดุตัวกรองและความหนาสำหรับด้าน filter light=[1 100;2 100;3 16;4 100;6 0;12 350]; //สว่าง filter_dark =[1 100;2 100;3 16;4 100;6 40;12 350]; //วัสดุตัวกรองและความหนาสำหรับด้านมืด clc //ชี้ตำแหน่งที่บรรจุข้อมูลสัมประสิทธิ์การ chdir('C:\BL6data DoseCalc\DATA'); //ดูดกลื่นแสงของวัสดุ format('e',15); //เวกเตอร์ที่ใช้เก็บชนิดวัสดุ sequence=filter_light(:,1); //เวกเตอร์ที่ใช้เก็บความหนาวัสดุ thickness=(1/10000).*filter light(:,2); //ตัวแปรเก็บจำนวนชั้นวัสดุ r=length(sequence); //อ่านค่าสเปกตรัมของแหล่งกำเนิดแสง source =fscanfMat('power.txt'); //ซินโครตรอน //เก็บสเปกตรัมแสงซิน โครตรอน energy=source(:,1);

[a,b]=size(source); L0=source(:,2); for k=1:r if sequence(k)==1 then beryllium =fscanfMat('beryllium.txt'); absorb(:,k)=beryllium(:,2); elseif sequence(k)== 2 then kapton =fscanfMat('kapton.txt'); absorb(:,k)=kapton(:,2);

elseif sequence(k)== 3 then
aluminum =fscanfMat('aluminum.txt');
absorb(:,k)=aluminum(:,2);

elseif sequence(k)== 4 then
graphite =fscanfMat('graphite.txt');
absorb(:,k)=graphite(:,2);

elseif sequence(k)== 5 then
mylar =fscanfMat('mylar.txt');
absorb(:,k)=mylar(:,2);

elseif sequence(k)== 6 then
silver =fscanfMat('silver.txt');
absorb(:,k)=silver(:,2);

elseif sequence(k)== 7 then
gold =fscanfMat('gold.txt');
absorb(:,k)=gold(:,2);

elseif sequence(k)== 8 then

//เก็บจำนวนจุดของสเปกตรัม //สเปกตรัมอินพุต //วนลูปเพื่อคำนวณก่าสัมประสิทธิ์การ //ดูดกลืนกลื่นแสงของวัสดุตัวกรองจนกรบ //ทุกชั้น สำหรับด้านสว่าง lead =fscanfMat('lead.txt'); absorb(:,k)=lead(:,2);

elseif sequence(k)== 9 then
tin =fscanfMat('tin.txt');
absorb(:,k)=tin(:,2);

elseif sequence(k)== 10 then
nickel =fscanfMat('nickel.txt');
absorb(:,k)=nickel(:,2);

elseif sequence(k)== 11 then
copper =fscanfMat('copper.txt');
absorb(:,k)=copper(:,2);

elseif sequence(k)== 12 then
su8 =fscanfMat('su8.txt');
absorb(:,k)=su8(:,2);

elseif sequence(k)== 13 then
si3n4 =fscanfMat('si3n4.txt');
absorb(:,k)=si3n4(:,2);

elseif sequence(k)== 14 then
tungsten =fscanfMat('tungsten.txt');
absorb(:,k)=tungsten(:,2);
end

if k==1 then
L(:,k)=L0.*exp(-absorb(:,k)*thickness(k));
else

//จบขั้นตอนการเก็บข้อมูลสัมประสิทธิ์ //การดูดกลืนคลื่นแสงของวัสดุ //เริ่มการคำนวณสเปกตรัมคลื่นแสงที่ผ่าน //ตัวกรองแต่ละชั้น L(:,k)=L(:,k-1).*exp(-absorb(:,k)*thickness(k));

end

//จบการคำนวณสเปกตรัมที่ผ่านชั้นตัวกรอง end //อ่านค่าสเปกตรัมที่ผ่านตัวกรองชั้นสดท้าย light tran =L(:,r-1); //คำนวณสเปกตรัมที่ถูกคุดกลืนโดย top L =absorb(:,r).*light tran; //สารไวแสงส่วนบน //กำนวณสเปกตรัมที่ถูกดูดกลืนโดย bot_L =absorb(:,r).*light_tran.*exp(-absorb(:,r)*thickness(r)); //สารไวแสงค้านสว่างส่วนถ่าง //อินทิเกรตพลังงานที่สารไวแสงค้านสว่าง integ top L=sum(top L) - ((top L(a))/2) - ((top L(1))/2);//ส่วนาเนได้รับ //อินทิเกรตพลังงานที่สารไวแสงค้านสว่าง integ bot L=sum(bot L) - ((bot L(a))/2) - ((bot L(1))/2); //ส่วนถ่างได้รับ //กำนวณพลังงานที่ถูกดุดกลืนโดย top dose =(1000)*integ top L;//สารไวแสงส่วนบน //คำนวณพลังงานที่ถูกดูดกลืนโดย bottom dose =(1000)*integ bot L; //สารไวแสงส่วนล่าง //กำนวณอัตราส่วนของพลังงานส่วนบน toptobot ratio=top dose/bottom dose; //และส่วนล่าง

> //วนลูปเพื่อคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การ //ดูดกลืนคลื่นแสงจนครบทุกชั้น //สำหหรับด้านมืด

elseif sequence(k)== 2 then
kapton =fscanfMat('kapton.txt');
absorb(:,k)=kapton(:,2);

sequence=filter dark(:,1);

if sequence(k)==1 then

absorb(:,k)=beryllium(:,2);

for k=1:r

thickness=(1/10000).*filter dark(:,2);

beryllium =fscanfMat('beryllium.txt');

elseif sequence(k)== 3 then
aluminum =fscanfMat('aluminum.txt');

absorb(:,k)=aluminum(:,2);

elseif sequence(k)== 4 then
graphite =fscanfMat('graphite.txt');
absorb(:,k)=graphite(:,2);

elseif sequence(k)== 5 then
mylar =fscanfMat('mylar.txt');
absorb(:,k)=mylar(:,2);

elseif sequence(k)== 6 then
silver =fscanfMat('silver.txt');
absorb(:,k)=silver(:,2);

elseif sequence(k)== 7 then
gold =fscanfMat('gold.txt');
absorb(:,k)=gold(:,2);

elseif sequence(k)== 8 then
lead =fscanfMat('lead.txt');
absorb(:,k)=lead(:,2);

elseif sequence(k)== 9 then
tin =fscanfMat('tin.txt');
absorb(:,k)=tin(:,2);

elseif sequence(k)== 10 then
nickel =fscanfMat('nickel.txt');
absorb(:,k)=nickel(:,2);

elseif sequence(k)== 11 then

copper =fscanfMat('copper.txt'); absorb(:,k)=copper(:,2);

elseif sequence(k)== 12 then
su8 =fscanfMat('su8.txt');
absorb(:,k)=su8(:,2);

elseif sequence(k)== 13 then
si3n4 =fscanfMat('si3n4.txt');
absorb(:,k)=si3n4(:,2);

elseif sequence(k)== 14 then
tungsten =fscanfMat('tungsten.txt');
absorb(:,k)=tungsten(:,2);

end

if k==1 then L(:,k)=L0.*exp(-absorb(:,k)*thickness(k)); else L(:,k)=L(:,k-1).*exp(-absorb(:,k)*thickness(k)); end end dark_tran =L(:,r-1); top_D =absorb(:,r).*dark_tran; bot_D =absorb(:,r).*dark_tran.*exp(-absorb(:,r)*thickness(r));

integ_top_D=sum(top_D) - ((top_D(a))/2) - ((top_D(1))/2);

//จบขั้นตอนการเก็บข้อมูลสัมประสิททธิ์ //การดูดกลืนกลื่นแสงของวัสดุ //เริ่มการคำนวณสเปกตรัมกลื่นแสงที่ผ่าน //ตัวกรองแต่ละชั้น

//อ่านก่าสเปกตรัมที่ผ่านตัวกรองชั้นสุดท้าย //กำนวณสเปกตรัมที่ถูกดูดกลืนโดย //สารไวแสงส่วนบน //กำนวณสเปกตรัมที่ถูกดูดกลืนโดย //สารไวแสงด้านมืดส่วนล่าง

//อินทิเกรตพลังงานที่สารไวแสงค้านมืด //ส่วนบนได้รับ integ bot D=sum(bot D) - ((bot D(a))/2) - ((bot D(1))/2); //อินทิเกรตพลังงานที่สารไวแสงค้านมืด //ส่วนล่างได้รับ //กำนวณพลังงานที่ถูกดุดกลืนโดย critical dose =(1000)*integ top D; //สารไวแสงค้านมืดส่วนบน //กำนวณพลังงานที่ถูกดุดกลืนโดย bottom dark =(1000)*integ bot D; //สารไวแสงค้านมืดส่วนถ่าง contrast =100*(bottom dose-bottom dark)/(bottom dose+bottom dark); //กำนวณเปอร์เซนต์ก่ากวามคมชัด coef=[top dose;critical dose;bottom dose;bottom dark;toptobot ratio;contrast]; //รวมค่าที่คำนวณได้เป็นเมตริกซ์ //ชี้ไดเรกทอรีที่จะเก็บข้อมูล chdir('C:\BL6data DoseCalc\coefficient data scan'); //ลบแฟ้มข้อมูลเก่า mdelete('coeff.txt'); //เขียนแฟ้มข้อมูลใหม่ write('coeff.txt',coef); format('v',10); //อ่านข้อมูลวันที่เพื่อตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล dd=getdate(); fil='coeff'+' '+string(dd(6))+string(dd(2))+string(dd(1))+' '+string(dd(7))+string(dd(8))+string(dd(9))+'.txt'; //เขียนแฟ้มข้อมูล write(fil,coef); printf('Current TopBright Acc.TopBright BottomBright ... Acc.BottomBright Top.Dark Acc.TopDark Contrast Top to Bottom\n') //แสดงผลการจำลองการฉายแสง printf('(mA/cm^3) (mJ/cm^3) (mJ/cm^3) (mJ/cm^3) (mJ/cm^3) (mJ/cm³) (mJ/cm³) (percent) ()\n\n') AccumTop =0;AccumBot =0; AccumCrit=0; //วนลูปเพื่อคำนวณผลการฉายแสงโดย for i=1:length(Current) //กระแสเวกเตอร์ //พถังงานด้านบนส่วนสว่าง top_dose1=(30/94.5)*Current(i)*top_dose; //พลังงานด้านล่างส่วนสว่าง bottom_dose1=(30/94.5)*Current(i)*bottom_dose; //พลังงานด้านบนส่วนมืด critical_dose1=(30/94.5)*Current(i)*critical_dose; //พลังงานสะสมด้ำนบนส่วนสว่าง AccumTop =top_dose1+AccumTop;

AccumBot =bottom_dose1+AccumBot;//พลังงานสะสมด้านล่างส่วนสว่างAccumCrit=critical_dose1+AccumCrit;//พลังงานสะสมด้านบนส่วนมืดprintf(%.2f%.3f%.3f%.3f%.3f\n',Current(i),top_dose1,AccumTop,bottom_dose1,AccumBot,...%.3fcritical_dose1,AccumCrit,contrast,toptobot_ratio)//แสดงตารางค่าที่ได้จากการคำนวณend//จบโปรแกรม

ภาคผนวก ซ

โปรแกรมจำลองการตอบสนองความชื้นของตัวตรวจรู้ความชื้น

//โปรแกรมจำลองผลการแพร่ใน 1 มิติ สำหรับโครงสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบซี่ยาวที่มีการแพร่ของความชื้น //สองด้าน ใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการของ Crank-Nicloson

//โดย นายมาโนทย์ มาปะโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลับเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2550

//File : CN_method.sci

a(i,i+1)=-lamda;

//ช่วงเวลาในการจำลองผล t=0:0.1:30; //ความกว้างของซึ่ x=0:1:10; //สัมปประสิทธิ์การแพร่ความชื้น D=0.835; //เงื่อนไขขอบเขตด้านซ้าย left=1; //เงื่อนไขขอบเขตด้ำนขวา right=1; $//\Delta t$ $d_t=t(2)-t(1);$ $d_x=x(2)-x(1);$ $//\Delta x$ //ตรวจสอบเงื่อนไขการลู่เข้า if d_t>=0.5*d_x^2/D x_message(['Numerical Method with Crank-Nicloson ... Unstable';'Plese decrease dt or increase dx']); else $lamda=D*d_t/(d_x^2);$ //คำนวณค่า lamda h=2*(1+lamda);//ประกาศเมตริกซ์ a a=zeros(length(x)-2,length(x)-2); //ประกาศเมตริกซ์ b b=zeros(length(x)-2,1); //ประกาศเมตริกซ์คำตอบ m=zeros(length(x)-2,1); //เมตริกซ์ที่ใช้เก็บคำตอบทุกช่วงเวลา as=zeros(length(x),length(t)); //ลูปสร้างเมตริกซ์ a และ b for j=1:length(t) for i=1:length(b) if i==1 a(i,i)=h;

```
b(i) = lamda*left + 2*(1-lamda)*m(i) + lamda*m(i+1) + lamda*left;
   elseif i==length(b)
      a(length(b),length(b)-1)=-lamda;
      a(length(b),length(b))=h;
      b(length(b))=lamda*right + 2*(1-lamda)*m(length(b)) + lamda*m(length(b)-1) + lamda*right;
   else
      a(i,i-1)=-lamda;
      a(i,i)=h;
      a(i,i+1)=-lamda;
      b(i)=lamda*m(i-1) + m(i)*2*(1-lamda) + lamda*m(i+1);
   end
end
                                                      //แก้สมการหาคำตอบ
m=inv(a)*b;
                                                      //รวมคำตอบเข้ากับเงื่อนไขขอบเขต
as(:,j)=[left ;m ;right];
                                                      //วาดผลตอบสนองในหนึ่งช่วงเวลา
plot(x,as(:,j));
end
                                                      //จบการคำนวณ
end
//โปรแกรมจำลองผลการแพร่ใน 1 มิติ สำหรับโครงสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบทรงกระบอกที่มีการแพร่ของ
```

//กวามชื้นโดยรอบ เทียบกับโรงสร้างขั้วไฟฟ้ามีรูพรุนหรือแบบที่มีการแพร่ใน 1 มิติโดยตรง ใช้การแก้ปัญหาด้วย //วิธีการ analytical //โดย นายมาโนทย์ มาปะโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลับเทกโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2550

```
//File : Cylidrical_body.sci
```

```
clear ;close ;clc
```

x=linspace(0,1000,500000);	//ช่วงที่ใช้หาค่ารากสมการเบสเซล
t=0:0.1:2000;	//ช่วงเวลาในการจำลองผล
a = 51e-6; //(m) Diameter of Circle	//เส้นผ่านศูนย์กลางทรงกระบอก
L = 51e-6; $//(m)$ thickness of film	//กวามหนาฟิล์ม

D=5e-12; //(m^2/s) Diffusion Coefficient sumpw=0;sumq=0;

function [sumpw,sumq]=equ(n,D,L)

w=(2*n-1)^2;

p=1-exp((-w*%pi*%pi*D*t) / ((L^2)));

q=(1/w);

sumpw=sumpw+(p/w);

sumq=sumq+q;

endfunction

sumupper=0;sumbelow=0;

//สัมประสิทธิ์การแพร่ //ค่าเริ่มต้นของผลรวม

//ฟังก์ชันหาก่าผลรวมถึงอนันต์ //ของโครงสร้างขั้วไฟฟ้ารูพรุน

//จบฟังก์ชัน

//ค่าเริ่มต้นของผลรวม

//ฟังก์ชันหาค่าผลรวมถึงอนันต์ function [sumupper,sumbelow]=equ2(k3,D,a) //ของโครงสร้างทรงกระบอก f=(1-exp ($-D^*(((k3(j))^2)^*t)/(a^2)))/((k3(j))^2);$ h=(1 / (k3(j)^2)); sumupper=sumupper+f; sumbelow=sumbelow+h; //จบฟังก์ชัน endfunction //คำนวณรากของฟังก์ชันเบสเซล //Roots of besselj(x)=0 Calc y=besselj(0,x); k=[]; s=0; for r=1:2:(length(x)-2)y0=besselj(0, x(r));y1=besselj(0, x(r+1)); y2=besselj(0, x(r+2));

if y0*y2<0 then

y=y1; s=s+1;

k(s,1)=s-1;k(s,2)=y;k(s,3) = x(r+1);else end //จบการคำนวณรากสมการเบสเซล end //ขนาดของรากคำตอบสมการเบสเซล uu=size(k); //ตัวแปรวนลูปเท่ากับจำนวนราก n=uu(1,1);m=n; //ตัวแปรที่ใช้เก็บคำตอบ k1=k(:,1)';k2=k(:,2)';k3=k(:,3)'; k4=[]; sumkn=0; //กำนวณผลตอบสนองของตัวตรวจรู้ for j=1:n //ความชื้นทั้งสองโครงสร้าง $sumkn=sumkn+(1/((k3(j))^2));$ k4(j)=sumkn; [sumpw,sumq]=equ(j,D,L); //Conventional Structure// [sumupper,sumbelow]=equ2(k3,D,a); //Circular Structure// End //จบการคำนวณ //ผลตอบสนองของโครงสร้างขั้วไฟฟ้า Cnorm=sumpw/sumq; //รูพรุน //ผลตอบสนองของโครงสร้างแบบทรง CnormCir=sumupper/sumbelow; //กระบอก scf(2); //วาดกราฟผลตอบสนองเทียบกัน plot(t,Cnorm,'-.r',t,CnormCir,'--b');xgrid; //ทั้งสองแบบ //ใส่กริด xgrid; //คำอธิบายเส้นกราฟ legends(['Long electrode';'Cylindrical body'],[[5;4],[2;2]]);

ประวัติผู้เขียน

นายมาโนทย์ มาปะโท เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2526 ที่อำเภอขามทะเลสอ จังหวัด นครราชสีมา เริ่มการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา และสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เมื่อ พ.ศ. 2549 และได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ในสาขาวิชาเดียวกัน โดยได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิด แสงซินโครตรอนแห่งชาติ ขณะศึกษาได้ทำงานวิจัยด้านระบบกลไฟฟ้าจุลภาค (MEMS) โดยได้ พัฒนาตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างโดยใช้กระบวนการลิโธกราฟฟิด้วยรังสีเอ็กซ์ ผู้วิจัยมีความสนใจ ในการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนสำหรับการผลิตโครงสร้างจุลภาคสัดส่วนสูง และมีผลงานทาง วิชาการที่ได้รับการติพิมพ์เผยแพร่ในขณะศึกษาดังภาคผนวก ก.